## (12)特許公報(B2)

## (11)特許番号 **特許第7460314号**

(P7460314)

## (45)発行日 **令和6年4月2日(2024.4.2)**

(51)国際特許分類		FΙ	
G 0 2 F	1/1368(2006.01)	G 0 2 F	1/1368
G 0 2 F	1/1333(2006.01)	G 0 2 F	1/1333
G 0 2 F	1/1343(2006.01)	G 0 2 F	1/1343

(21)出願番号	特願2023-4315(P2023-4315)	(73)特許権者	000153878
(22)出願日	令和5年1月16日(2023.1.16)		株式会社半導体エネルギー研究所
(62)分割の表示	特願2017-214384(P2017-214384		神奈川県厚木市長谷398番地
	)の分割	(72)発明者	山崎 舜平
原出願日	平成29年11月7日(2017.11.7)		神奈川県厚木市長谷398番地 株式会
(65)公開番号	特開2023-29646(P2023-29646A)		社半導体エネルギー研究所内
(43)公開日	令和5年3月3日(2023.3.3)	審査官	井亀 諭
審査請求日	令和5年2月15日(2023.2.15)		
(31)優先権主張番号	特願2016-219157(P2016-219157)		
(32)優先日	平成28年11月9日(2016.11.9)		
(33)優先権主張国・均	也域又は機関		
	日本国(JP)		
(31)優先権主張番号	特願2016-219160(P2016-219160)		
(32)優先日	平成28年11月9日(2016.11.9)		
(33)優先権主張国・均	也域又は機関		
	最終頁に続く		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 表示装置の作製方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に、液晶素子、第1の絶縁層、トランジスタ、走査線、信号線<u></u>タッチセンサ<u>及</u> び接続部を有し、

前記液晶素子は、画素電極、液晶層及び共通電極を有し、

前記第1の絶縁層は、前記画素電極と前記トランジスタの間に位置し、

前記第1の絶縁層は、<u>第1の</u>開口<u>及び第2の開口</u>を有し、

前記走査線及び前記信号線は、それぞれ、前記トランジスタと電気的に接続され、

前記走査線及び前記信号線は、それぞれ、金属層を有し、

前記トランジスタは、前記画素電極と接続される第1の領域を有し、

<u>前</u>記タッチセンサは、可視光を透過する機能を有する第2の領域を有し、

前記画素電極、前記共通電極及び前記第1の領域は、それぞれ、前記可視光を透過する 機能を有し、

前記可視光は、前記液晶素子、前記第1の領域、前記<u>第2の領域</u>、前記基板の順に透過 して<u>、表</u>示装置の外部に射出される機能を有<u>し、</u>

<u>前記接続部は、第1乃至第3の導電層を有し、且つFPCと電気的に接続される、</u>表示装 置<u>の作製方法であって、</u>

<u>前記基板上に、前記タッチセンサと、前記タッチセンサと電気的に接続する前記第1の導</u> <u>電層を形成する工程と、</u>

<u>前記タッチセンサ上に、前記トランジスタ、前記走査線及び前記信号線を形成し、且つ前</u>

請求項の数 2 (全91頁)

(24)登録日 令和6年3月25日(2024.3.25)

10

20

## (19)日本国特許庁(JP)

<u>記第1の導電層上に、前記第2の導電層を形成する工程と、</u>

<u>前記トランジスタ上、前記走査線上、前記信号線上及び前記第2の導電層上に、前記第1</u> の絶縁層を形成する工程と、

前記第1の絶縁層に、前記第1の開口及び前記第2の開口を形成する工程と、

<u>前記第1の開口を介して前記トランジスタと電気的に接続される前記画素電極を形成し、</u>

<u>日つ前記第2の開口を介して前記第2の導電層と電気的に接続される前記第3の導電層を</u> 形成する工程と、を有する、表示装置の作製方法。

【請求項2】

<u> 基板上に、液晶素子、第1の絶縁層、トランジスタ、走査線、信号線、タッチセンサ、接</u> <u>続部及び第5の導電層を有し、</u>

前記液晶素子は、画素電極、液晶層及び共通電極を有し、

前記第1の絶縁層は、前記画素電極と前記トランジスタの間に位置し、

<u>前記第1の絶縁層は、第1の開口及び第2の開口を有し、</u>

<u>前記走査線及び前記信号線は、それぞれ、前記トランジスタと電気的に接続され、</u>

前記走査線及び前記信号線は、それぞれ、金属層を有し、

<u>前記トランジスタは、前記画素電極と接続される第1の領域を有し、</u>

<u>前記タッチセンサは、可視光を透過する機能を有する第2の領域を有し、</u>

<u>前記画素電極、前記共通電極及び前記第1の領域は、それぞれ、前記可視光を透過する機</u> <u>能を有し、</u>

<u>前記第5の導電層は、前記タッチセンサと前記トランジスタの間に位置し、且つ前記液晶</u> <u>素子を有する表示領域全体と重なっており、</u>

<u>前記可視光は、前記液晶素子、前記第1の領域、前記第5の導電層、前記第2の領域、前</u> 記基板の順に透過して、表示装置の外部に射出される機能を有し、

<u>前記接続部は、第1乃至第4の導電層を有し、且つFPCと電気的に接続される、表示装</u> 置の作製方法であって、

<u>前記基板上に、前記タッチセンサと、前記タッチセンサと電気的に接続する前記第1の導</u> 電層を形成する工程と、

<u>前記タッチセンサ上に、前記第5の導電層を形成し、且つ前記第1の導電層上に、前記第</u> <u>4の導電層を形成する工程と、</u>

<u>前記タッチセンサ上に、前記第5の導電層を介して前記トランジスタ、前記走査線及び前</u> 記信号線を形成し、且つ前記第4の導電層上に、前記第2の導電層を形成する工程と、 前記トランジスタ上、前記走査線上、前記信号線上及び前記第2の導電層上に、前記第1

の絶縁層を形成する工程と、

前記第1の絶縁層に、前記第1の開口及び前記第2の開口を形成する工程と、

<u>前記第1の開口を介して前記トランジスタと電気的に接続される前記画素電極を形成し、</u> <u>且つ前記第2の開口を介して前記第2の導電層と電気的に接続される前記第3の導電層を</u> 形成する工程と、を有する、表示装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明の一態様は、液晶表示装置、表示モジュール、及び電子機器に関する。本発明の一 態様は、液晶表示装置の作製方法に関する。

[0002]

なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本発明の一態様の技術分野と しては、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、電子機器、照明装置、 入力装置(例えば、タッチセンサなど)、入出力装置(例えば、タッチパネルなど)、そ れらの駆動方法、又はそれらの製造方法を一例として挙げることができる。 【背景技術】

[0003]

液晶表示装置及び発光表示装置等のフラットパネルディスプレイの多くに用いられている

10

20

40

トランジスタは、ガラス基板上に形成されたアモルファスシリコン、単結晶シリコン、ま たは多結晶シリコンなどのシリコン半導体によって構成されている。また、該シリコン半 導体を用いたトランジスタは、集積回路(IC)などにも利用されている。 [0004]近年、シリコン半導体に代わって、半導体特性を示す金属酸化物をトランジスタに用いる 技術が注目されている。なお、本明細書中では、半導体特性を示す金属酸化物を酸化物半 導体と記すこととする。例えば、特許文献1及び特許文献2には、酸化物半導体として、 酸化亜鉛、またはIn-Ga-Zn系酸化物を用いたトランジスタを作製し、該トランジ スタを表示装置の画素のスイッチング素子などに用いる技術が開示されている。 【先行技術文献】 【特許文献】 [0005]【文献】特開2007-123861号公報 【文献】特開2007-96055号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 [0006]本発明の一態様は、開口率が高い液晶表示装置を提供することを目的の一とする。または 、本発明の一態様は、消費電力の低い液晶表示装置を提供することを目的の一とする。ま たは、本発明の一態様は、高精細な液晶表示装置を提供することを目的の一とする。また は、本発明の一態様は、信頼性の高い液晶表示装置を提供することを目的の一とする。 [0007]なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。本発明の一態様は 、必ずしも、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。明細書、図面、請求 項の記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。 【課題を解決するための手段】 [0008]「1]本発明の一態様は、液晶素子、トランジスタ、走査線、及び信号線を有する表示装 置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。走査線及び信号線は 、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号線は、それぞれ、金属 層を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に接続される。トランジスタは、画素電 極と接続される第1の領域を有する。画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を 透過する機能を有する。可視光は、第1の領域及び液晶素子を透過して、表示装置の外部 に射出される。  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ [2]本発明の一態様は、液晶素子、トランジスタ、走査線、信号線、及びタッチセンサ を有する表示装置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。走査 線及び信号線は、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号線は、 それぞれ、金属層を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に接続される。トランジ スタは、画素電極と接続される第1の領域を有する。タッチセンサは、液晶素子及びトラ ンジスタよりも表示面側に位置する。画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を 透過する機能を有する。可視光は、第1の領域及び液晶素子を透過して、表示装置の外部 に射出される。タッチセンサは、一対の電極を有する。一対の電極の一方または双方は、 可視光を透過する第2の領域を有することが好ましい。このとき、第1の領域及び液晶素 子を透過した可視光は、第2の領域を透過して、表示装置の外部に射出される。

[0010]

[3]本発明の一態様は、液晶素子、トランジスタ、走査線、信号線、及びタッチセンサ を有する表示装置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。走査 線及び信号線は、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号線は、 それぞれ、金属層を有する。トランジスタは、画素電極と接続される第1の領域を有する 20

10

30

。タッチセンサは、可視光を透過する第2の領域を有する。画素電極、共通電極、及び第 1の領域は、可視光を透過する機能を有する。可視光は、液晶素子、第1の領域、第2の 領域の順に透過して、表示装置の外部に射出される。表示装置は、さらに、着色層を有す ることが好ましい。このとき、可視光は、着色層、液晶素子、第1の領域、第2の領域の 順に透過して、表示装置の外部に射出されることが好ましい。トランジスタのチャネル領 域と、第1の領域と、は、それぞれ、金属酸化物を有することが好ましい。このとき、第 1の領域が有する金属酸化物は、チャネル領域が有する金属酸化物に含まれる金属元素を 1種類以上有することが好ましい。

[0011]

[4]本発明の一態様は、液晶素子、第1の絶縁層、トランジスタ、走査線、及び信号線 を有する表示装置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。第1 の絶縁層は、画素電極とトランジスタの間に位置する。第1の絶縁層は、開口部を有する 。走査線及び信号線は、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号 線は、それぞれ、金属層を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に接続される。ト ランジスタは、画素電極と接続される第1の領域を有する。第1の領域は、画素電極と接 する第1の部分と、第1の絶縁層が有する開口部の側面と接する第2の部分と、を有する 。画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を透過する機能を有する。可視光は、 第1の領域及び液晶素子を透過して、表示装置の外部に射出される。

【0012】

[5]本発明の一態様は、液晶素子、第1の絶縁層、トランジスタ、走査線、及び信号線 を有する表示装置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。第1 の絶縁層は、画素電極とトランジスタの間に位置する。第1の絶縁層は、開口部を有する 。走査線及び信号線は、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号 線は、それぞれ、金属層を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に接続される。ト ランジスタは、金属酸化物層、ゲート、及びゲート絶縁層を有する。金属酸化物層は、第 1の領域と第2の領域を有する。第1の領域は、画素電極と接する第1の部分と、第1の 絶縁層が有する開口部の側面と接する第2の部分と、を有する。第2の領域は、ゲート絶 縁層を介してゲートと重なる。第1の領域の抵抗率は、第2の領域の抵抗率よりも低い。 画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を透過する機能を有する。可視光は、第

【0013】

[4]または[5]において、表示装置は、さらに、着色層を有してもよい。着色層は、 トランジスタを挟んで、第1の絶縁層とは反対側に位置することが好ましい。 【0014】

[6]本発明の一態様は、液晶素子、第1の絶縁層、トランジスタ、走査線、信号線、及びタッチセンサを有する表示装置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。第1の絶縁層は、画素電極とトランジスタの間に位置する。第1の絶縁層は、開口部を有する。走査線及び信号線は、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。 走査線及び信号線は、それぞれ、金属層を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に接続される。トランジスタは、画素電極と接続される第1の領域を有する。第1の領域は、画素電極と接する第1の部分と、第1の絶縁層が有する開口部の側面と接する第2の部分と、を有する。タッチセンサは、液晶素子及びトランジスタよりも表示面側に位置する。画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を透過する機能を有する。可視光は、第1の領域及び液晶素子を透過して、表示装置の外部に射出される。

【0015】

[7]本発明の一態様は、液晶素子、第1の絶縁層、トランジスタ、走査線、信号線、及 びタッチセンサを有する表示装置である。液晶素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極 を有する。第1の絶縁層は、画素電極とトランジスタの間に位置する。第1の絶縁層は、 開口部を有する。走査線及び信号線は、それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。 走査線及び信号線は、それぞれ、金属層を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に 30

10

接続される。トランジスタは、金属酸化物層、ゲート、及びゲート絶縁層を有する。金属 酸化物層は、第1の領域と第2の領域を有する。第1の領域は、画素電極と接する第1の 部分と、第1の絶縁層が有する開口部の側面と接する第2の部分と、を有する。第2の領 域は、ゲート絶縁層を介してゲートと重なる。第1の領域の抵抗率は、第2の領域の抵抗 率よりも低い。タッチセンサは、液晶素子及びトランジスタよりも表示面側に位置する。 画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を透過する機能を有する。可視光は、第 1の領域及び液晶素子を透過して、表示装置の外部に射出される。

[0016]

[6]または[7]において、表示装置は、さらに、着色層を有してもよい。着色層は、 トランジスタを挟んで、第1の絶縁層とは反対側に位置することが好ましい。タッチセン サは、着色層よりも表示面側に位置することが好ましい。

[0017]

[6]または[7]において、表示装置が有するタッチセンサは、一対の電極を有する。 一対の電極の一方または双方は、可視光を透過する第3の領域を有することが好ましい。 第1の領域及び液晶素子を透過した可視光は、第3の領域を透過して、表示装置の外部に 射出されることが好ましい。

[0018]

[4]乃至[7]の各構成において、画素電極の液晶層側の面は、第1の絶縁層の液晶層 側の面と同一面を形成することができると好ましい。

【0019】

- [4]乃至[7]の各構成において、画素電極は、液晶層と第1の絶縁層の間に位置する ことが好ましい。
- [0020]

[4]乃至[7]の各構成において、画素電極と共通電極の間に位置する第2の絶縁層を 有することが好ましい。そして、共通電極の液晶側の面は、第2の絶縁層の液晶側の面と 同一面を形成することができると好ましい。

[0021]

走査線は、トランジスタのチャネル領域と重なる部分を有することが好ましい。

[0022]

可視光は、第1の領域、液晶素子の順に透過して、表示装置の外部に射出されてもよい。 または、可視光は、液晶素子、第1の領域の順に透過して、表示装置の外部に射出されて もよい。

[0023]

走査線が伸長する方向は、信号線が伸長する方向と交差することが好ましい。同一の色を 呈する複数の画素(副画素)が配設される方向は、信号線が伸長する方向と交差すること が好ましい。

【0024】

共通電極は、トランジスタと液晶層との間に位置することが好ましい。

【0025】

画素電極、共通電極、及び金属酸化物層は、それぞれ、インジウムと、亜鉛と、アルミニ ウム、ガリウム、イットリウム、及びスズのうち少なくとも一つと、を有することが好ま しい。

[0026]

トランジスタはバックゲートを有することが好ましい。バックゲートは、金属酸化物層を 介して、ゲートと重なる部分を有する。ゲート及びバックゲートは電気的に接続される。 ゲートまたはバックゲートは、インジウムと、亜鉛と、アルミニウム、ガリウム、イット リウム、及びスズのうち少なくとも一つと、を有することが好ましい。 【0027】 本発明の一態様は、上記いずれかの構成の表示装置を有し、フレキシブルプリント回路基

板 (Flexible printed circuit、以下、FPCと記す)もしく

10

はTCP(Tape Carrier Package)等のコネクタが取り付けられた 表示モジュール、またはCOG(Chip On G1ass)方式もしくはCOF(C hip On Film)方式等によりICが実装された表示モジュール等の表示モジュ ールである。 [0028]本発明の一態様は、上記の表示モジュールと、アンテナ、バッテリ、筐体、カメラ、スピ ーカ、マイク、または操作ボタンの少なくともいずれかーと、を有する電子機器である。 【発明の効果】 [0029]本発明の一態様により、開口率が高い液晶表示装置を提供することができる。または、本 発明の一態様により、消費電力の低い液晶表示装置を提供することができる。または、本 発明の一態様により、高精細な液晶表示装置を提供することができる。または、本発明の 一態様により、信頼性の高い液晶表示装置を提供することができる。 なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。本発明の一態様は 、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。明細書、図面、請求項の記載から 、これら以外の効果を抽出することが可能である。 【図面の簡単な説明】 [0031]【図1】表示装置の一例を示す断面図。 【図2】表示装置の一例を示す断面図。 【図3】表示装置の一例を示す上面図及び断面図。 【図4】表示装置の一例を示す斜視図。 【図5】副画素の一例を示す上面図。 【図6】表示装置の一例を示す断面図。 【図7】表示装置の一例を示す断面図。 【図8】表示装置の一例を示す断面図。 【図9】表示装置の一例を示す断面図。 【図10】副画素の一例を示す上面図。 【図11】表示装置の一例を示す断面図。 【図12】表示装置の一例を示す断面図。 【図13】副画素の一例を示す上面図。 【図14】副画素の一例を示す上面図。 【図15】副画素の一例を示す上面図。 【図16】副画素の一例を示す上面図。 【図17】副画素の一例を示す上面図。 【図18】副画素の一例を示す上面図。 【図19】画素の配置例及び構成例を示す図。 【図20】表示装置の一例を示す斜視図。 【図21】表示装置の一例を示す断面図。 【図22】表示装置の一例を示す斜視図。 【図23】表示装置の一例を示す断面図。 【図24】表示装置の一例を示す断面図。 【図25】表示装置の一例を示す断面図。 【図26】入力装置の一例を示す上面図。 【図27】入力装置の一例を示す上面図。 【図28】表示装置の一例を示す断面図。 【図29】検知素子と画素の一例を示す図。 【図30】検知素子と画素の動作の一例を示す図。 【図31】検知素子と画素の一例を示す上面図。

(6)

20

10

【図32】表示装置の一例を示す断面図。 【図33】表示装置の一例を示す断面図。 【図34】表示装置の一例を示す断面図。 【図35】表示装置の一例を示す上面図及び断面図。 【図36】表示装置の一例を示す断面図。 【図37】表示装置の一例を示す断面図。 【図38】表示装置の一例を示す断面図。 【図39】副画素の一例を示す上面図。 【図40】表示装置の一例を示す断面図。 【図41】表示装置の一例を示す断面図。 10 【図42】表示装置の作製方法の一例を示す断面図。 【図43】表示装置の作製方法の一例を示す断面図。 【図44】表示装置の作製方法の一例を示す断面図。 【図45】表示装置の作製方法の一例を示す断面図。 【図46】表示装置の作製方法の一例を示す断面図。 【図47】表示装置の作製方法の一例を示す断面図。 【図48】表示装置の一例を示す断面図。 【図49】表示装置の一例を示す断面図。 【図50】表示装置の一例を示す断面図。 20 【図51】画素回路の一例を示す回路図、及び動作モードの一例を示す図。 【図52】タッチセンサのブロック図及びタイミングチャート図。 【図53】表示装置のブロック図及びタイミングチャート図。 【図54】表示装置及びタッチセンサの動作を説明する図。 【図55】表示装置及びタッチセンサの動作を説明する図。 【図56】電子機器の一例を示す図。 【図57】電子機器の一例を示す図。 【発明を実施するための形態】 [0032]実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ れず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し 30 得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態の 記載内容に限定して解釈されるものではない。 [0033]なお、以下に説明する発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同 ーの符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、同様の 機能を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符号を付さない場合がある。 [0034]また、図面において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実際 の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必ず しも、図面に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。 なお、「膜」という言葉と、「層」という言葉とは、場合によっては、又は、状況に応じ て、互いに入れ替えることが可能である。例えば、「導電層」という用語を、「導電膜」 という用語に変更することが可能である。または、例えば、「絶縁膜」という用語を、「 絶縁層」という用語に変更することが可能である。 [0036]本明細書等において、金属酸化物(metal oxide)とは、広い表現での金属の 酸化物である。金属酸化物は、酸化物絶縁体、酸化物導電体(透明酸化物導電体を含む) 、酸化物半導体(Oxide Semiconductorまたは単にOSともいう)な

どに分類される。例えば、トランジスタの半導体層に金属酸化物を用いた場合、当該金属

酸化物を酸化物半導体と呼称する場合がある。つまり、OS FETと記載する場合にお いては、金属酸化物または酸化物半導体を有するトランジスタと換言することができる。 [0037]また、本明細書等において、窒素を有する金属酸化物も金属酸化物(metal oxi de)と総称する場合がある。また、窒素を有する金属酸化物を、金属酸窒化物(met al oxynitride)と呼称してもよい。 [0038](実施の形態1) 本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置について図1~図31を用いて説明する。 [0039]<1.表示装置の構成例1> まず、図1~図3を用いて、本実施の形態の表示装置について説明する。 [0040]本実施の形態の表示装置は、液晶素子及びトランジスタを有する。液晶素子は、画素電極 、液晶層、及び共通電極を有する。トランジスタは、画素電極と電気的に接続される。ト ランジスタは、第1の領域を有する。画素電極、共通電極、及び第1の領域は、可視光を 透過する機能を有する。可視光は、第1の領域及び液晶素子を透過して、表示装置の外部 に射出される。トランジスタが有する第1の領域は、例えば、画素電極と接続される領域 であってもよい。 [0041]本実施の形態の表示装置は、トランジスタが可視光を透過する領域を有する。例えば、ト ランジスタと画素電極のコンタクト部が、可視光を透過するため、当該コンタクト部を表 示領域に設けることができる。これにより、画素の開口率を高め、表示装置の消費電力を 低減させることができる。また、表示装置の高精細化を実現できる。 [0042]本実施の形態の表示装置は、さらに、走査線及び信号線を有する。走査線及び信号線は、 それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号線は、それぞれ、金属層 を有する。走査線及び信号線に金属層を用いることで、走査線及び信号線の抵抗値を下げ ることができる。 [0043]また、走査線は、トランジスタのチャネル領域と重なる部分を有することが好ましい。ト ランジスタのチャネル領域に用いる材料によっては、光が照射されることでトランジスタ の特性が変動することがある。走査線が、トランジスタのチャネル領域と重なる部分を有 することで、外光またはバックライトの光などが、チャネル領域に照射されることを抑制 できる。これにより、トランジスタの信頼性を高めることができる。 [0044]図1(A)に示す表示装置10Aは、基板11、基板12、トランジスタ14、及び液晶 素子15等を有する。表示装置10Aの基板12側に、バックライトユニット13が配置 されている。 [0045]液晶素子15は、画素電極21、液晶層22、及び共通電極23を有する。画素電極21 は、絶縁層26に設けられた開口を介して、トランジスタ14と電気的に接続されている 。絶縁層26上には、画素電極21と同一の工程及び同一の材料を用いて形成された導電 層25が設けられている。導電層25は、接続体29を介して、共通電極23と電気的に 接続されている。 [0046]バックライトユニット13からの光45aは、基板12、絶縁層26、画素電極21、液 晶層22、共通電極23、及び基板11を介して、表示装置10Aの外部に射出される。

光45aが透過するこれらの層の材料には、可視光を透過する材料を用いる。

【0047】

20

10

30

バックライトユニット13からの光45 bは、基板12、トランジスタ14、絶縁層26 、画素電極21、液晶層22、共通電極23、及び基板11を介して、表示装置10Aの 外部に射出される。本実施の形態において、液晶素子15と電気的に接続されるトランジ スタ14は、可視光を透過する領域を有する構成である。したがって、トランジスタ14 が設けられている領域も、表示領域として使用することができる。これにより、画素の開 口率を高めることができる。開口率が高いほど光取り出し効率を高めることができる。し たがって、表示装置の消費電力を低減することができる。また、高精細な表示装置を実現 できる。

【0048】

図1(B)に示す表示装置10Bは、基板11側に、バックライトユニット13が配置されている点で、表示装置10Aと異なる。その他の構成は、表示装置10Aと同様であるため、説明を省略する。

【0049】

表示装置10Aでは、光45bは、まず、トランジスタ14が有する可視光を透過する領 域に入射する。そして、当該領域を透過した光45bは、液晶素子15に入射する。一方 、表示装置10Bでは、光45bは、まず、液晶素子15に入射する。そして、液晶素子 15を透過した光45bは、トランジスタ14が有する可視光を透過する領域に入射する 。このように、バックライトユニット13からの光は、トランジスタ14と液晶素子15 のどちらに先に入射してもよい。

[0050]

また、表示装置10Bでは、トランジスタ14における画素電極21と接続される部分が 、可視光を透過する例を示す。光45bは、トランジスタ14と画素電極21とのコンタ クト部を透過する。つまり、トランジスタ14と画素電極21とのコンタクト部を、表示 領域として使用することができる。これにより、画素の開口率を高めることができる。ま た、表示装置の消費電力を低減することができる。

【0051】

本発明の一態様の表示装置は、タッチセンサが搭載された表示装置(入出力装置またはタ ッチパネルともいう)に適用することができる。タッチセンサは、液晶素子及びトランジ スタよりも表示面側に位置する。

【 0 0 5 2 】

図 2 ( A ) に示す表示装置 1 5 A は、表示装置 1 0 A の基板 1 1 側に、タッチセンサユニ ット 3 1 が配置された構成である。

【 0 0 5 3 】

図2(B)に示す表示装置15Bは、表示装置10Aの基板11と共通電極23との間に 、タッチセンサユニット31及び絶縁層32が設けられた構成である。さらに、表示装置 15Bは、導電層27及び導電層28を有する。

【0054】

絶縁層26上に、画素電極21と同一の工程及び同一の材料を用いて形成された導電層2 7が設けられている。絶縁層32に接して、共通電極23と同一の工程及び同一の材料を 用いて形成された導電層28が設けられている。導電層28は、タッチセンサユニット3 1と電気的に接続されている。導電層28は、接続体29を介して、導電層27と電気的 に接続されている。これにより、基板12側に接続された1つまたは複数のFPCによっ て、液晶素子15を駆動する信号とタッチセンサユニット31を駆動する信号の双方を表 示装置15Bに供給することができる。基板11側にFPC等を接続する必要がなく、表 示装置の構成をより簡略化できる。基板11側と基板12側の双方にFPCを接続する場 合に比べて、電子機器に組み込みやすく、また、部品点数を削減できる。

表示装置15Bでは、一対の基板間に、タッチセンサユニット31を設けることができる ため、基板枚数を削減し、表示装置の軽量化及び薄型化を実現できる。

[0056]

20



図2(C)に示す表示装置15Cは、表示装置10Bの基板12と絶縁層26との間に、 タッチセンサユニット31及び絶縁層32が設けられた構成である。さらに、表示装置1 5Cは、導電層33を有する。

【 0 0 5 7 】

絶縁層32に接して、トランジスタ14が有する導電層の一つまたは複数と同一の工程、 及び同一の材料で形成された導電層33が設けられている。導電層33は、タッチセンサ ユニット31と電気的に接続されている。表示装置15Cでは、基板11側に接続された 1つまたは複数のFPCによって、液晶素子15を駆動する信号とタッチセンサユニット 31を駆動する信号の双方を表示装置15Cに供給することができる。そのため、電子機 器に組み込みやすく、また、部品点数を削減できる。

【0058】

表示装置15Cでは、一対の基板間に、タッチセンサユニット31を設けることができる ため、基板枚数を削減し、表示装置の軽量化及び薄型化を実現できる。

【 0 0 5 9 】

[画素について]

次に、本実施の形態の表示装置が有する画素について、図3を用いて説明する。

【0060】

図3(A1)に、画素900の上面概略図を示す。図3(A1)に示す画素900は、4 つの副画素を有する。図3(A1)では、画素900において、副画素が縦に2つ、横に 2つ配列している例を示している。各副画素には、透過型の液晶素子930LC(図3( A1)(A2)には図示しない)及びトランジスタ914等が設けられている。図3(A 1)では、画素900に、配線902及び配線904が、それぞれ2本ずつ設けられてい る。図3(A1)に示す各副画素では、液晶素子の表示領域(表示領域918R、表示領 域918G、表示領域918B、及び表示領域918W)を示している。

【0061】

画素900は、配線902及び配線904等を有する。配線902は、例えば走査線とし て機能する。配線904は、例えば信号線として機能する。配線902と配線904とは 、互いに交差する部分を有する。

[0062]

トランジスタ914は、選択トランジスタとして機能する。トランジスタ914のゲート は、配線902と電気的に接続されている。トランジスタ914のソースまたはドレイン の一方は、配線904と電気的に接続されており、他方は、液晶素子930LCと電気的 に接続されている。

【0063】

ここで、配線902及び配線904は遮光性を有する。またこれ以外の層、すなわち、ト ランジスタ914、トランジスタ914に接続する配線、コンタクト部、容量等を構成す る各層には、透光性を有する膜を用いると好適である。図3(A2)は、図3(A1)に 示す画素900を、可視光を透過する透過領域900tと、可視光を遮る遮光領域900 sと、に分けて明示した例である。このように、透光性を有する膜を用いてトランジスタ を作製することで、配線902及び配線904が設けられる部分以外を透過領域900t とすることができる。液晶素子の透過領域をトランジスタ、トランジスタに接続する配線 、コンタクト部、容量等と重ねることができるため、画素の開口率を高めることができる

0

【0064】

なお、画素の面積に対する透過領域の面積の割合が高いほど、透過光の光量を増大させる ことができる。例えば、画素の面積に対する、透過領域の面積の割合は、1%以上95% 以下、好ましくは10%以上90%以下、より好ましくは20%以上80%以下とするこ とができる。特に40%以上または50%以上とすることが好ましく、60%以上80% 以下であるとより好ましい。

【0065】

10

また、図3(A2)に示す一点鎖線A - Bの切断面に相当する断面図を図3(B)、(C)に示す。なお、図3(B)、(C)では、上面図において図示していない、液晶素子930LC、着色膜932CF、遮光膜932BM、容量素子915、駆動回路部901等の断面も合わせて図示している。駆動回路部901は、走査線駆動回路部または信号線駆動回路部として用いることができる。また、駆動回路部901は、トランジスタ911を有する。

[0066]

図3(B)、(C)に示すように、バックライトユニット13からの光は、破線の矢印に 示す方向に射出される。バックライトユニット13の光は、トランジスタ914と液晶素 子930LCとのコンタクト部、トランジスタ914、及び容量素子915等を介して外 部に取り出される。したがって、トランジスタ914、及び容量素子915を構成する膜 などについても、透光性を有すると好ましい。トランジスタ914、容量素子915等が 有する透光性の領域の面積が広いほど、バックライトユニット13の光を効率良く使用す ることができる。

【 0 0 6 7 】

なお、図3(B)、(C)に示すように、バックライトユニット13からの光は、着色膜 932CFを介して外部に取り出してもよい。着色膜932CFを介して取り出すことで 、所望の色に着色することができる。着色膜932CFとしては、赤(R)、緑(G)、 青(B)、シアン(C)、マゼンタ(M)、黄色(Y)等から選択することができる。

【0068】

図3(B)では、バックライトユニット13からの光は、まず、トランジスタ914、及び容量素子915等に入射する。そして、トランジスタ914、及び容量素子915等を 透過した光は、液晶素子930LCに入射する。そして、液晶素子930LCを透過した 光は、着色膜932CFを介して外部に取り出される。

【0069】

図3(C)では、バックライトユニット13からの光は、まず、着色膜932CFに入射 する。そして、着色膜932CFを透過した光は、液晶素子930LCに入射する。そし て、液晶素子930LCを透過した光は、トランジスタ914、及び容量素子915等を 介して外部に取り出される。

【 0 0 7 0 】

図3に示すトランジスタ、配線、容量素子等には、以下に示す材料を用いることができる。 。なお、これらの材料は、本実施の形態で示す各構成例における可視光を透過する半導体 層及び導電層にも適用することができる。

【0071】

トランジスタが有する半導体膜は、透光性を有する半導体材料を用いて形成することがで きる。透光性を有する半導体材料としては、金属酸化物、または酸化物半導体(O × i d e S e m i c o n d u c t o r)等が挙げられる。酸化物半導体は、少なくともインジ ウムを含むことが好ましい。特にインジウム及び亜鉛を含むことが好ましい。また、それ らに加えて、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、銅、バナジウム、ベリリウム、ホ ウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ラ ンタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネシウ ムなどから選ばれた一種、または複数種が含まれていてもよい。

[0072]

トランジスタが有する導電膜は、透光性を有する導電性材料を用いて形成することができ る。透光性を有する導電性材料は、インジウム、亜鉛、錫の中から選ばれた一種、または 複数種を含むことが好ましい。具体的には、In酸化物、In-Sn酸化物(ITO:I ndium Tin Oxideともいう)、In-Zn酸化物、In-W酸化物、In -W-Zn酸化物、In-Ti酸化物、In-Sn-Ti酸化物、In-Sn-Si酸化 物、Zn酸化物、Ga-Zn酸化物などが挙げられる。 【0073】 10

20



また、トランジスタが有する導電膜に、不純物元素を含有させる等して低抵抗化させた酸 化物半導体を用いてもよい。当該低抵抗化させた酸化物半導体は、酸化物導電体(OC: Oxide Conductor)ということができる。 [0074]例えば、酸化物導電体は、酸化物半導体に酸素欠損を形成し、当該酸素欠損に水素を添加 することで、伝導帯近傍にドナー準位が形成される。酸化物半導体にドナー準位が形成さ れることで、酸化物半導体は、導電性が高くなり導電体化する。 [0075]なお、酸化物半導体は、エネルギーギャップが大きい(例えば、エネルギーギャップが2 .5 e V 以上である)ため、可視光に対して透光性を有する。また、上述したように酸化 物導電体は、伝導帯近傍にドナー準位を有する酸化物半導体である。したがって、酸化物 導電体は、ドナー準位による吸収の影響は小さく、可視光に対して酸化物半導体と同程度 の透光性を有する。 [0076] また、酸化物導電体は、トランジスタが有する半導体膜に含まれる金属元素を一種類以上 有することが好ましい。同一の金属元素を有する酸化物半導体を、トランジスタを構成す る層のうち2層以上に用いることで、製造装置(例えば、成膜装置、加工装置等)を2以 上の工程で共通で用いることが可能となるため、製造コストを抑制することができる。 本実施の形態に示す表示装置が有する画素の構成とすることで、バックライトユニットか ら射出される光を効率よく使用することができる。したがって、消費電力が抑制された、 優れた表示装置を提供することができる。 [0078] < 2 . 表示装置の構成例 2 > 次に、図4~図7を用いて、本実施の形態の表示装置について説明する。図4は、表示装 置100Aの斜視図である。図5は、表示装置100Aが有する副画素の上面図である。 図6は、表示装置100Aの断面図である。図7は、表示装置100Bの断面図である。 図4では、明瞭化のため、偏光板130などの構成要素を省略して図示している。図4で は、基板61を破線で示す。 [0079]表示装置100Aは、表示部62及び駆動回路部64を有する。表示装置100Aには、 F P C 7 2 及び I C 7 3 が実装されている。  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ 表示部62は、複数の画素を有し、画像を表示する機能を有する。 [0081]画素は、複数の副画素を有する。例えば、赤色を呈する副画素、緑色を呈する副画素、及 び青色を呈する副画素によって1つの画素が構成されることで、表示部62ではフルカラ ーの表示を行うことができる。なお、副画素が呈する色は、赤、緑、及び青に限られない 。画素には、例えば、白、黄、マゼンタ、またはシアン等の色を呈する副画素を用いても よい。なお、本明細書等において、副画素を単に画素と記す場合がある。 【0082】 表示装置100Aは、走査線駆動回路及び信号線駆動回路のうち、一方または双方を有し ていてもよい。または、走査線駆動回路及び信号線駆動回路の双方を有していなくてもよ い。表示装置100Aが、タッチセンサ等のセンサを有する場合、表示装置100Aは、 センサ駆動回路を有していてもよい。本実施の形態では、駆動回路部64として、走査線 駆動回路を有する例を示す。走査線駆動回路は、表示部62が有する走査線に、走査信号 を出力する機能を有する。

【 0 0 8 3 】

表示装置100Aでは、IC73が、COG方式などの実装方式により、基板51に実装 されている。IC73は、例えば、信号線駆動回路、走査線駆動回路、及びセンサ駆動回

(12)

30

20

10

10

20

路のうち、一つ又は複数を有する。 [0084]表示装置100Aには、FPC72が電気的に接続されている。FPC72を介して、I C73及び駆動回路部64には外部から信号及び電力が供給される。また、FPC72を 介して、IC73から外部に信号を出力することができる。 [0085]FPC72には、ICが実装されていてもよい。例えば、FPC72には、信号線駆動回 路、走査線駆動回路、及びセンサ駆動回路のうち、一つ又は複数を有するICが実装され ていてもよい。 [0086]表示部62及び駆動回路部64には、配線65から、信号及び電力が供給される。当該信 号及び電力は、IC73から、またはFPC72を介して外部から、配線65に入力され る。 [0087]図6は、表示部62、駆動回路部64、及び配線65を含む断面図である。図6は、図5 (A)における一点鎖線X1-X2間の断面図を含む。図6以降に示す表示装置の断面図 では、表示部62として、1つの副画素の表示領域68とその周囲に位置する非表示領域 66を示す。 [0088]図5(A)は、副画素のうち、ゲート223から共通電極112までの積層構造(図6参 照)を、共通電極112側から見た上面図である。図5(A)には、副画素の表示領域6 8 を太い点線の枠で示す。図5(B)は、図5(A)の積層構造から共通電極112 を除 いた上面図である。 [0089]表示装置100Aは、横電界方式の液晶素子を用いた透過型の液晶表示装置の一例である [0090]図6に示すように、表示装置100Aは、基板51、トランジスタ201、トランジスタ 206、液晶素子40、補助配線139、配向膜133a、配向膜133b、接続部20 4、接着層141、着色層131、遮光層132、オーバーコート121、基板61、及 30 び偏光板130等を有する。 [0091]表示領域68には、液晶素子40が設けられている。液晶素子40は、FFS(Frin ge Field Switching)モードが適用された液晶素子である。 [0092] 液晶素子40は、画素電極111、共通電極112、及び液晶層113を有する。画素電 極111と共通電極112との間に生じる電界により、液晶層113の配向を制御するこ とができる。液晶層113は、配向膜133aと配向膜133bの間に位置する。 [0093]図6において、画素電極111は、導電層222cを介して、低抵抗領域231bと電気 的に接続されている。 [0094] 導電層222c及び低抵抗領域231bは、可視光を透過する材料を用いて形成される。 これにより、画素電極111とトランジスタとの接続部を表示領域68に設けることがで きる。したがって、副画素の開口率を高めることができる。また、表示装置の消費電力を 低減することができる。 [0095] 共通電極112は、 歯状の上面形状(平面形状ともいう)、またはスリットが設けられ た上面形状を有していてもよい。図5(A)、(B)及び図6では、1つの副画素の表示 領域68に、共通電極112の開口が1つ設けられている例を示す。共通電極112には

50

、1つまたは複数の開口を設けることができる。表示装置の高精細化に伴い、1つの副画 素の表示領域68の面積は小さくなる。そのため、共通電極112に設ける開口は複数に 限られず、1つとすることができる。すなわち、高精細な表示装置においては、画素(副 画素)の面積が小さいため、共通電極112の開口が1つであっても、副画素の表示領域 全体に亘って、液晶を配向させるために十分な電界を生成することができる。 【0096】

画素電極111と共通電極112の間には、絶縁層220が設けられている。画素電極1 11は、絶縁層220を介して共通電極112と重なる部分を有する。また、画素電極1 11と着色層131とが重なる領域において、画素電極111上に共通電極112が配置 されていない部分を有する。共通電極112上には補助配線139が設けられている。補 助配線139の抵抗率は、共通電極112の抵抗率よりも低いことが好ましい。共通電極 と電気的に接続する補助配線を設けることで、共通電極の抵抗に起因する電圧降下を抑制 することができる。また、このとき、金属酸化物を含む導電層と、金属を含む導電層の積 層構造とする場合には、ハーフトーンマスクを用いたパターニング技術により形成すると、 、工程を簡略化できるため好ましい。

[0097]

補助配線139は、共通電極112よりも抵抗値の低い膜とすればよい。補助配線139 は、例えば、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅 、銀、ネオジム、スカンジウム等の金属材料またはこれらの元素を含む合金材料を用いて 、単層または積層で形成することができる。

【 0 0 9 8 】

表示装置の使用者から視認されないよう、補助配線139は、遮光層132等と重なる位 置に設けられることが好ましい。

【0099】

液晶層113と接する配向膜を設けることが好ましい。配向膜は、液晶層113の配向を 制御することができる。表示装置100Aでは、共通電極112及び絶縁層220と液晶 層113との間に配向膜133aが位置し、オーバーコート121と液晶層113との間 に配向膜133bが位置している。

[0100]

液晶材料には、誘電率の異方性( )が正であるポジ型の液晶材料と、負であるネガ型の液晶材料がある。本発明の一態様では、どちらの材料を用いることもでき、適用するモード及び設計に応じて最適な液晶材料を用いることができる。

【0101】

本発明の一態様では、ネガ型の液晶材料を用いることが好ましい。ネガ型液晶では、液晶 分子の分極に由来するフレクソエレクトリック効果の影響を抑制でき、液晶層に印加され る電圧の極性による透過率の差がほとんどない。したがって、表示装置の使用者からフリ ッカーが視認されることを抑制できる。フレクソエレクトリック効果とは、主に分子形状 に起因し、配向歪みにより分極が発生する現象である。ネガ型の液晶材料は、広がり変形 や曲げ変形の配向歪みが生じにくい。

【0102】

なお、ここでは液晶素子40としてFFSモードが適用された素子を用いたが、これに限 られず様々なモードが適用された液晶素子を用いることができる。例えば、VA(Ver tical Alignment)モード、TN(Twisted Nematic)モ ード、IPS(In-Plane-Switching)モード、ASM(Axiall y Symmetric aligned Micro-cell)モード、OCB(O ptically Compensated Birefringence)モード、F LC(Ferroelectric Liquid Crystal)モード、AFLC (AntiFerroelectric Liquid Crystal)モード、EC B(Electrically Controlled Birefringence) モード、VA-IPSモード、ゲストホストモード等が適用された液晶素子を用いること ができる。

【0103】

また、表示装置100Aにノーマリーブラック型の液晶表示装置、例えば垂直配向(VA )モードを採用した透過型の液晶表示装置を適用してもよい。垂直配向モードとしては、 MVA(Multi‐Domain Vertical Alignment)モード、 PVA(Patterned Vertical Alignment)モード、 Advanced Super View)モードなどを用いることができる。 【0104】

なお、液晶素子は、液晶の光学変調作用によって光の透過または非透過を制御する素子で ある。液晶の光学的変調作用は、液晶にかかる電界(横方向の電界、縦方向の電界または 斜め方向の電界を含む)によって制御される。液晶素子に用いる液晶としては、サーモト ロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶(PDLC:Polymer Dispersed Liquid Crystal)、強誘電性液晶、反強誘電性液 晶等を用いることができる。これらの液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメ

クチック相、キュービック相、カイラルネマチック相、等方相等を示す。 【 0 1 0 5 】 また、横電界方式を採用する場合、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい

。ブルー相は液晶相の一つであり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善するために5重量%以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を液晶層113に用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が短く、光学的等方性を示す。また、ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向膜を設けなくてもよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こされる静電破壊を防止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良または破損を軽減することができる。

[0106]

表示装置100Aは、透過型の液晶表示装置であるため、画素電極111及び共通電極1 12の双方に、可視光を透過する導電性材料を用いる。また、トランジスタ206が有す る導電層の一つまたは複数に、可視光を透過する導電性材料を用いる。これにより、表示 領域68に、トランジスタ206の少なくとも一部を設けることができる。図6では、導 電層222cに、可視光を透過する導電性材料を用いる場合を例に挙げて説明する。 【0107】

可視光を透過する導電性材料としては、例えば、インジウム(In)、亜鉛(Zn)、錫 (Sn)の中から選ばれた一種以上を含む材料を用いるとよい。具体的には、酸化インジ ウム、インジウム錫酸化物(ITO)、インジウム亜鉛酸化物、酸化タングステンを含む インジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むイ ンジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、酸化シリコンを含むインジウム 錫酸化物(ITSO)、酸化亜鉛、ガリウムを含む酸化亜鉛などが挙げられる。なお、グ ラフェンを含む膜を用いることもできる。グラフェンを含む膜は、例えば酸化グラフェン を含む膜を還元して形成することができる。

【0108】

導電層222c、画素電極111、及び共通電極112のうち、一つまたは複数に酸化物 導電層を用いることが好ましい。酸化物導電層は、トランジスタ206の半導体層に含ま れる金属元素を一種類以上有することが好ましい。例えば、導電層222cは、インジウ ムを含むことが好ましく、In-M-Zn酸化物(MはA1、Ti、Ga、Ge、Y、Z r、La、Ce、Nd、SnまたはHf)膜であることがさらに好ましい。同様に、画素 電極111及び共通電極112は、それぞれ、インジウムを含むことが好ましく、In-M-Zn酸化物膜であることがさらに好ましい。 【0109】 10

導電層222c、画素電極111、及び共通電極112のうち、一つまたは複数を、酸化物半導体を用いて形成してもよい。同一の金属元素を有する酸化物半導体を、表示装置を構成する層のうち2層以上に用いることで、製造装置(例えば、成膜装置、加工装置等)を2以上の工程で共通で用いることが可能となるため、製造コストを抑制することができる。

(16)

【 0 1 1 0 】

酸化物半導体は、膜中の酸素欠損、及び膜中の水素、水等の不純物濃度のうち少なくとも 一方によって、抵抗を制御することができる半導体材料である。そのため、酸化物半導体 層へ酸素欠損及び不純物濃度の少なくとも一方が増加する処理、または酸素欠損及び不純 物濃度の少なくとも一方が低減する処理を選択することによって、酸化物導電層の有する 抵抗率を制御することができる。

**[**0 1 1 1 **]** 

なお、このように、酸化物半導体層を用いて形成された酸化物導電層は、キャリア密度が 高く低抵抗な酸化物半導体層、導電性を有する酸化物半導体層、または導電性の高い酸化 物半導体層ということもできる。

[0112]

また、酸化物半導体層と、酸化物導電層を同一の金属元素で形成することで、製造コスト を低減させることができる。例えば、同一の金属組成の金属酸化物ターゲットを用いるこ とで製造コストを低減させることができる。また、同一の金属組成の金属酸化物ターゲッ トを用いることによって、酸化物半導体層を加工する際のエッチングガスまたはエッチン グ液を共通して用いることができる。ただし、酸化物半導体層と、酸化物導電層は、同一 の金属元素を有していても、組成が異なる場合がある。例えば、表示装置の作製工程中に 、膜中の金属元素が脱離し、異なる金属組成となる場合がある。

【0113】

例えば、絶縁層216に水素を含む窒化シリコン膜を用い、導電層222cに酸化物半導体を用いると、絶縁層216から供給される水素によって、酸化物半導体の導電率を高めることができる。同様に、例えば、絶縁層220に水素を含む窒化シリコン膜を用い、画素電極111に酸化物半導体を用いると、絶縁層220から供給される水素によって、酸化物半導体の導電率を高めることができる。

【0114】

非表示領域66には、トランジスタ206が設けられている。

【0115】

トランジスタ206は、ゲート221、ゲート223、絶縁層211、絶縁層213、及 び半導体層(チャネル領域231a及び一対の低抵抗領域231b)を有する。低抵抗領 域231bの抵抗率は、チャネル領域231aの抵抗率よりも低い。本実施の形態では、 半導体層として酸化物半導体層を用いる場合を例に説明する。酸化物半導体層は、インジ ウムを含むことが好ましく、In-M-Zn酸化物(MはA1、Ti、Ga、Ge、Y、 Zr、La、Ce、Nd、SnまたはHf)膜であることがさらに好ましい。酸化物半導 体層の詳細は、後述する。

【0116】

ゲート221は、絶縁層213を介してチャネル領域231aと重なる。ゲート223は、絶縁層211を介してチャネル領域231aと重なる。絶縁層211及び絶縁層213 は、それぞれゲート絶縁層として機能する。導電層222aは低抵抗領域231bの一方 と、導電層222cは低抵抗領域231bの他方と、絶縁層212及び絶縁層214に設 けられた開口を通じて接続している。

【0117】

図 6 に示すトランジスタ 2 0 6 は、チャネルの上下にゲートが設けられているトランジス タである。

【0118】

図5(B)に示すコンタクト部Q1において、ゲート221及びゲート223は、電気的

20

30

に接続されている。このように2つのゲートが電気的に接続されている構成のトランジス タは、他のトランジスタと比較して電界効果移動度を高めることが可能であり、オン電流 を増大させることができる。その結果、高速動作が可能な回路を作製することができる。 さらには回路部の占有面積を縮小することが可能となる。オン電流の大きなトランジスタ を適用することで、表示装置を大型化、または高精細化して配線数が増大したとしても、 各配線における信号遅延を低減することが可能であり、表示ムラを抑制することが可能で ある。また、このような構成を適用することで、信頼性の高いトランジスタを実現するこ とができる。

【0119】

図5(B)に示すコンタクト部Q2において、導電層222cが、画素電極111と接続 している。上述の通り、導電層222cは、可視光を透過する材料を用いて形成される。 そのため、コンタクト部Q2を表示領域68に設けることができる。これにより、副画素 の開口率を高めることができる。また、表示装置の消費電力を低減することができる。 【0120】

図5(A)、(B)において、1つの導電層が、走査線228及びゲート223として機 能するともいえる。ゲート221及びゲート223のうち、抵抗の低い方が、走査線とし ても機能する導電層であることが好ましい。走査線228として機能する導電層の抵抗は 十分に低いことが好ましい。そのため、走査線228として機能する導電層は、金属、合 金等を用いて形成されることが好ましい。走査線228として機能する導電層には、可視 光を遮る機能を有する材料を用いてもよい。

【0121】

図5(A)、(B)において、1つの導電層が、信号線229及び導電層222aとして 機能するともいえる。信号線229として機能する導電層の抵抗は十分に低いことが好ま しい。そのため、信号線229として機能する導電層は、金属、合金等を用いて形成され ることが好ましい。信号線229として機能する導電層には、可視光を遮る機能を有する 材料を用いてもよい。つまり、本発明の一態様において、トランジスタ206は、導電層 222aと導電層222cとに異なる材料を用いて形成されるという特徴を有する。 【0122】

具体的には、導電層222cに用いることができる可視光を透過する導電性材料は、銅や アルミニウムなどの可視光を遮る導電性材料と比較して抵抗率が大きいことがある。よっ て、走査線及び信号線などのバスラインは、信号遅延を防ぐため、抵抗率が小さい可視光 を遮る導電性材料(金属材料)を用いて形成することが好ましい。ただし、画素の大きさ や、バスラインの幅、バスラインの厚さなどによっては、バスラインに可視光を透過する 導電性材料を用いることができる。

【0123】

ゲート221、223には、それぞれ、金属材料及び酸化物導電体の一方を単層で、また は双方を積層して用いることができる。例えば、ゲート221及びゲート223のうち、 一方に酸化物導電体を用い、他方に金属材料を用いてもよい。

[0124]

トランジスタ206は、半導体層として酸化物半導体層を用い、ゲート221及びゲート 223のうち、少なくとも一方に酸化物導電層を用いる構成とすることができる。このと き、酸化物半導体層と酸化物導電層を、酸化物半導体を用いて形成することが好ましい。 【0125】

ゲート223に可視光を遮る導電層を用いることで、バックライトの光がチャネル領域2 31 a に照射されることを抑制できる。このように、チャネル領域231 a を、可視光を 遮る導電層と重ねると、光によるトランジスタの特性変動を抑制できる。これにより、ト ランジスタの信頼性を高めることができる。

【0126】

チャネル領域231aの基板61側に、遮光層132が設けられ、チャネル領域231aの基板51側に、可視光を遮るゲート223が設けられていることで、外光及びバックラ

20

イトの光がチャネル領域231aに照射されることを抑制できる。

【 0 1 2 7 】

本発明の一態様において、可視光を遮る導電層は、半導体層の一部と重なり、半導体層の 他の一部とは重ならなくてもよい。例えば、可視光を遮る導電層は、少なくともチャネル 領域231aと障接する低抵抗領域231bは、ゲート223と重ならない領域を有する。なお 、低抵抗領域231bを、先の説明の酸化物導電体(OC)と読み替えてもよい。酸化物 導電体(OC)は、先の説明のように、可視光に対して透光性を有するため、低抵抗領域 231bを透過させて光を取り出すことができる。

[0128]

また、トランジスタの半導体層にシリコン、代表的にはアモルファスシリコン、または低 温ポリシリコン(LTPS)などを用いる場合、上述した低抵抗領域に相当する領域は、 シリコン中にリン、ボロンなどの不純物が含まれた領域ともいえる。なお、シリコンのバ ンドギャップは、概ね1.1 e Vである。また、シリコン中にリン、ボロンなどの不純物 が含まれると、バンドギャップはさらに低くなる場合がある。したがって、トランジスタ の半導体層にシリコンを用いる場合、シリコン中に形成される低抵抗領域は、可視光に対 して透光性が低いため、当該低抵抗領域を透過させて光を取り出すことが難しい場合があ る。しかしながら、本発明の一態様では、酸化物半導体(OS)、及び酸化物導電体(O C)ともに、可視光に対して透光性を有するため、画素または副画素の開口率を向上させ ることができる。

【0129】

トランジスタ206は、絶縁層212、絶縁層214、絶縁層215、及び絶縁層216 に覆われている。なお、絶縁層212、絶縁層214、さらには絶縁層216を、トラン ジスタ206の構成要素とみなすこともできる。トランジスタは、トランジスタを構成す る半導体への不純物の拡散を抑制する効果を奏する絶縁層で覆われていることが好ましい 。絶縁層215は、平坦化層として機能することができる。

[0130]

絶縁層211及び絶縁層213は、それぞれ、過剰酸素領域を有することが好ましい。ゲート絶縁層が過剰酸素領域を有することで、チャネル領域231a中に過剰酸素を供給することができる。チャネル領域231aに形成されうる酸素欠損を過剰酸素により補填することができるため、信頼性の高いトランジスタを提供することができる。

【0131】

絶縁層212は、窒素または水素を有することが好ましい。絶縁層212と、低抵抗領域231bと、が接することで、絶縁層212中の窒素または水素が低抵抗領域231b中に添加される。低抵抗領域231bは、窒素または水素が添加されることで、キャリア密度が高くなる。または、絶縁層214が窒素または水素を有し、絶縁層212が窒素または水素を透過することで、窒素または水素が低抵抗領域231b中に添加されてもよい。 【0132】

表示装置100Aの、液晶層113よりも基板61側には、着色層131及び遮光層13 2が設けられている。着色層131は、少なくとも、副画素の表示領域68と重なる部分 に位置する。画素(副画素)が有する非表示領域66には、遮光層132が設けられてい る。遮光層132は、トランジスタ206の少なくとも一部と重なる。

[0133]

着色層131及び遮光層132と、液晶層113と、の間には、オーバーコート121を 設けることが好ましい。オーバーコート121は、着色層131及び遮光層132等に含 まれる不純物が液晶層113に拡散することを抑制できる。 【0134】

基板 5 1 及び基板 6 1 は、接着層 1 4 1 によって貼り合わされている。基板 5 1 、基板 6 1 、及び接着層 1 4 1 に囲まれた領域に、液晶層 1 1 3 が封止されている。 【 0 1 3 5 】 10



表示装置100Aを、透過型の液晶表示装置として機能させる場合、偏光板を、表示部6 2を挟むように2つ配置する。図6では、基板61側の偏光板130を図示している。基 板51側に設けられた偏光板よりも外側に配置されたバックライトからの光45は偏光板 を介して入射する。このとき、画素電極111と共通電極112の間に与える電圧によっ て液晶層113の配向を制御し、光の光学変調を制御することができる。すなわち、偏光 板130を介して射出される光の強度を制御することができる。また、入射光は着色層1 31によって特定の波長領域以外の光が吸収されるため、射出される光は例えば赤色、青 色、または緑色を呈する光となる。

【0136】

また、 偏光板に加えて、 例えば円偏光板を用いることができる。 円偏光板としては、 例え ば直線偏光板と1/4波長位相差板を積層したものを用いることができる。 円偏光板によ り、表示装置の表示の視野角依存を低減することができる。

【0137】

また、液晶素子40は、ゲスト・ホスト液晶モードを用いて駆動されることが好ましい。 ゲスト・ホスト液晶モードを用いる場合、偏光板を用いなくてよい。偏光板による光の吸 収を低減できるため、光取り出し効率を高め、表示装置の表示を明るくすることができる

【0138】

駆動回路部64は、トランジスタ201を有する。

【0139】

トランジスタ201は、ゲート221、ゲート223、絶縁層211、絶縁層213、半 導体層(チャネル領域231a及び一対の低抵抗領域231b)、導電層222a、及び 導電層222bを有する。導電層222a及び導電層222bのうち、一方はソースとし て機能し、他方はドレインとして機能する。導電層222aは低抵抗領域231bの一方 と、導電層222bは低抵抗領域231bの他方と、それぞれ電気的に接続される。

【0140】

駆動回路部64に設けられるトランジスタは、可視光を透過する機能を有していなくてよい。そのため、導電層222aと導電層222bとを、同一の工程で、同一の材料を用いて形成することができる。

【0141】

接続部204では、配線65と導電層251が互いに接続し、導電層251と接続体24 2は互いに接続している。つまり、接続部204では、配線65が、導電層251と接続 体242を介して、FPC72と電気的に接続している。このような構成とすることで、 FPC72から、配線65に、信号及び電力を供給することができる。

【0142】

配線65は、トランジスタ201が有する導電層222a、222b、及びトランジスタ 206が有する導電層222aと同一の材料、同一の工程で形成することができる。導電 層251は、液晶素子40が有する画素電極111と同一の材料、同一の工程で形成する ことができる。このように、接続部204を構成する導電層を、表示部62や駆動回路部 64に用いる導電層と同一の材料、同一の工程で作製すると、工程数の増加を防ぐことが でき好ましい。

【0143】

トランジスタ201、206は、同じ構造であっても、異なる構造であってもよい。つま り、駆動回路部64が有するトランジスタと、表示部62が有するトランジスタが、同じ 構造であっても、異なる構造であってもよい。また、駆動回路部64が、複数の構造のト ランジスタを有していてもよいし、表示部62が、複数の構造のトランジスタを有してい てもよい。例えば、走査線駆動回路が有するシフトレジスタ回路、バッファ回路、及び保 護回路のうち、一以上の回路に、2つのゲートが電気的に接続されている構成のトランジ スタを用いることが好ましい。

**(**0 1 4 4 **)** 

20

10

30

また、図7に、表示装置100日の断面図を示す。なお、表示装置100日の斜視図は、 図4に示す表示装置100Aと同様であるため、ここでの説明は省略する。 [0145]表示装置100Aでは、トランジスタが2つのゲートを有する例を示したが、表示装置1 00Bでは、トランジスタ201及びトランジスタ206が、ゲート221のみを有する 。また、表示装置100Bは、スペーサ117を有する。表示装置100Bにおいて、表 示装置100Aと同様の部分については、詳細な説明を省略する。 [0146]トランジスタ201及びトランジスタ206は、絶縁層211上に設けられる。絶縁層2 11は下地膜として機能する。トランジスタ206は、ゲート221、絶縁層213、及 10 び半導体層(チャネル領域231 a及び一対の低抵抗領域231 b)を有する。導電層2 22aは低抵抗領域231bの一方と、導電層222bまたは導電層222cは低抵抗領 □ 域 2 3 1 b の他方と、絶縁層 2 1 2 及び絶縁層 2 1 4 に設けられた開口を通じて接続して いる。絶縁層215は、平坦化層として機能することができる。 [0147]トランジスタ201が有する導電層222bは、導電層222aと同一の材料、同一の工 程で形成することができる。トランジスタ201が有する導電層222cは、可視光を透 過する材料を用いて形成する。 [0148]スペーサ117は、基板51と基板61との距離が一定以上近づくことを防ぐ機能を有す 20 る。 [0149]図7では、スペーサ117の底面が、オーバーコート121と接している例を示すが、本 発明の一態様はこれに限られない。スペーサ117は、基板51側に設けられていてもよ いし、基板61側に設けられていてもよい。 [0150] 図 7 では、スペーサ 1 1 7 と重なる部分で、配向膜 1 3 3 a と配向膜 1 3 3 b が接してい ない例を示すが、配向膜どうしは接していてもよい。また、一方の基板上に設けられたス ペーサ117は、他方の基板上に設けられた構造物と接していてもよいし、接していなく てもよい。例えば、スペーサ117と当該構造物の間に液晶層113が位置していてもよ 30 ί١. [0151]スペーサ117として粒状のスペーサを用いてもよい。粒状のスペーサとしては、シリカ などの材料を用いることができる。スペーサに、樹脂またはゴムなどの弾性を有する材料 を用いることが好ましい。このとき、粒状のスペーサは上下方向に潰れた形状となる場合 がある。 [0152]次に、本実施の形態の表示装置の各構成要素に用いることができる材料等の詳細について 、説明を行う。なお、既に説明した構成要素については説明を省略する場合がある。また 、以降に示す表示装置及びタッチパネル、並びにそれらの構成要素にも、以下の材料を適 宜用いることができる。 **[**0153**]** 基板 5 1 、 6 1 本発明の一態様の表示装置が有する基板の材質などに大きな制限はなく、様々な基板を用 いることができる。例えば、ガラス基板、石英基板、サファイア基板、半導体基板、セラ ミック基板、金属基板、またはプラスチック基板等を用いることができる。 【0154】

厚さの薄い基板を用いることで、表示装置の軽量化及び薄型化を図ることができる。さら に、可撓性を有する程度の厚さの基板を用いることで、可撓性を有する表示装置を実現で きる。

(20)

[0155]

本発明の一態様の表示装置は、作製基板上にトランジスタ等を形成し、その後、別の基板 にトランジスタ等を転置することで、作製される。作製基板を用いることにより、特性の よいトランジスタの形成、消費電力の小さいトランジスタの形成、壊れにくい表示装置の 製造、表示装置への耐熱性の付与、表示装置の軽量化、または表示装置の薄型化を図るこ とができる。トランジスタが転置される基板には、トランジスタを形成することが可能な 基板に限られず、紙基板、セロファン基板、石材基板、木材基板、布基板(天然繊維(絹 、綿、麻)、合成繊維(ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル)もしくは再生繊維(ア セテート、キュプラ、レーヨン、再生ポリエステル)などを含む)、皮革基板、またはゴ ム基板などを用いることができる。

【0156】

トランジスタ201、206

本発明の一態様の表示装置が有するトランジスタは、トップゲート型またはボトムゲート 型のいずれの構造としてもよい。または、チャネルの上下にゲート電極が設けられていて もよい。トランジスタに用いる半導体材料は特に限定されず、例えば、酸化物半導体、シ リコン、ゲルマニウム等が挙げられる。

**[**0157**]** 

トランジスタに用いる半導体材料の結晶性についても特に限定されず、非晶質半導体、結 晶性を有する半導体(微結晶半導体、多結晶半導体、単結晶半導体、または一部に結晶領 域を有する半導体)のいずれを用いてもよい。結晶性を有する半導体を用いると、トラン ジスタ特性の劣化を抑制できるため好ましい。

【0158】

例えば、第14族の元素、化合物半導体または酸化物半導体を半導体層に用いることがで きる。代表的には、シリコンを含む半導体、ガリウムヒ素を含む半導体またはインジウム を含む酸化物半導体などを半導体層に適用できる。

【0159】

トランジスタのチャネルが形成される半導体に、酸化物半導体を適用することが好ましい。 特にシリコンよりもバンドギャップの大きな酸化物半導体を適用することが好ましい。 シリコンよりもバンドギャップが広く、且つキャリア密度の小さい半導体材料を用いると 、トランジスタのオフ状態における電流(オフ電流)を低減できるため好ましい。

**[**0160**]** 

酸化物半導体については、上述の説明及び実施の形態5などを参照できる。

[0161]

酸化物半導体を用いることで、電気特性の変動が抑制され、信頼性の高いトランジスタを 実現できる。

【0162】

また、その低いオフ電流により、トランジスタを介して容量に蓄積した電荷を長期間に亘 って保持することが可能である。このようなトランジスタを画素に適用することで、表示 した画像の階調を維持しつつ、駆動回路を停止することも可能となる。その結果、極めて 消費電力の低減された表示装置を実現できる。

【0163】

トランジスタ201、206は、高純度化し、酸素欠損の形成を抑制した酸化物半導体層 を有することが好ましい。これにより、トランジスタのオフ電流を低くすることができる 。よって、画像信号等の電気信号の保持時間を長くすることができ、電源オン状態では書 き込み間隔も長く設定できる。よって、リフレッシュ動作の頻度を少なくすることができ るため、消費電力を抑制する効果を奏する。

【0164】

また、トランジスタ201、206は、比較的高い電界効果移動度が得られるため、高速 駆動が可能である。このような高速駆動が可能なトランジスタを表示装置に用いることで 、表示部のトランジスタと、駆動回路部のトランジスタを同一基板上に形成することがで 10

きる。すなわち、駆動回路として、別途、シリコンウェハ等により形成された半導体装置 を用いる必要がないため、表示装置の部品点数を削減することができる。また、表示部に おいても、高速駆動が可能なトランジスタを用いることで、高画質な画像を提供すること ができる。

(22)

【0165】

絶縁層

表示装置が有する各絶縁層、オーバーコート、スペーサ等に用いることのできる絶縁材料 としては、有機絶縁材料または無機絶縁材料を用いることができる。有機絶縁材料として は、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミ ドイミド樹脂、シロキサン樹脂、ベンゾシクロプテン系樹脂、及びフェノール樹脂等が挙 げられる。無機絶縁層としては、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコ ン膜、窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化ハフニウム膜、酸化イットリウム膜、 酸化ジルコニウム膜、酸化ガリウム膜、酸化タンタル膜、酸化マグネシウム膜、酸化ラン タン膜、酸化セリウム膜、及び酸化ネオジム膜等が挙げられる。

【0166】

導電層

トランジスタのゲート、ソース、ドレインのほか、表示装置が有する各種配線及び電極等 の導電層には、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニ ウム、モリブデン、銀、タンタル、またはタングステンなどの金属、またはこれを主成分 とする合金を単層構造または積層構造として用いることができる。例えば、アルミニウム 膜上にチタン膜を積層する二層構造、タングステン膜上にチタン膜を積層する二層構造、 モリブデン膜上に銅膜を積層した二層構造、モリブデンとタングステンを含む合金膜上に 銅膜を積層した二層構造、銅-マグネシウム-アルミニウム合金膜上に銅膜を積層する二 層構造、チタン膜または窒化チタン膜と、そのチタン膜または窒化チタン膜上に重ねてア ルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にチタン膜または窒化チタン膜を形成す る三層構造、モリブデン膜または窒化モリブデン膜と、そのモリブデン膜または窒化モリ ブデン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜ま たは窒化モリブデン膜を形成する三層構造等がある。例えば、導電層を三層構造とする場 合、一層目及び三層目には、チタン、窒化チタン、モリブデン、タングステン、モリブデ ンとタングステンを含む合金、モリブデンとジルコニウムを含む合金、または窒化モリブ デンでなる膜を形成し、二層目には、銅、アルミニウム、金または銀、或いは銅とマンガ ンの合金等の低抵抗材料でなる膜を形成することが好ましい。なお、ITO、酸化タング ステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チ タンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸 化物、ITSO等の透光性を有する導電性材料を用いてもよい。

【0167】

なお、酸化物半導体の抵抗率を制御することで、酸化物導電層を形成してもよい。

【0168】

接着層141

接着層141としては、熱硬化樹脂、光硬化樹脂、または2液混合型の硬化性樹脂などの 硬化性樹脂を用いることができる。例えば、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂 、またはシロキサン樹脂などを用いることができる。

【0169】

接続体242

接続体242としては、例えば、異方性導電フィルム(ACF:Anisotropic Conductive Film)、または異方性導電ペースト(ACP:Aniso tropic Conductive Paste)などを用いることができる。

着色層131

着色層131は特定の波長域の光を透過する有色層である。着色層131に用いることの

30

50

できる材料としては、金属材料、樹脂材料、及び顔料または染料が含まれた樹脂材料などが挙げられる。

**[**0171**]** 

遮光層132

遮光層132は、例えば、隣接する異なる色の着色層131の間に設けられる。例えば、 金属材料、または、顔料もしくは染料を含む樹脂材料を用いて形成されたブラックマトリ クスを遮光層132として用いることができる。なお、遮光層132は、駆動回路部64 など、表示部62以外の領域にも設けると、導波光などによる光漏れを抑制できるため好 ましい。

【0172】

表示装置を構成する薄膜(絶縁膜、半導体膜、導電膜等)は、それぞれ、スパッタリング 法、化学気相堆積(CVD:Chemical Vapor Deposition)法 、真空蒸着法、パルスレーザー堆積(PLD:Pulsed Laser Deposi tion)法、原子層成膜(ALD:Atomic Layer Deposition )法等を用いて形成することができる。CVD法の例として、プラズマ化学気相堆積(P ECVD)法及び熱CVD法等が挙げられる。熱CVD法の例として、有機金属化学気相 堆積(MOCVD:Metal Organic CVD)法が挙げられる。

【0173】

表示装置を構成する薄膜(絶縁膜、半導体膜、導電膜等)は、それぞれ、スピンコート、 ディップ、スプレー塗布、インクジェット印刷、ディスペンス、スクリーン印刷、オフセ ット印刷、ドクターナイフ、スリットコート、ロールコート、カーテンコート、ナイフコ ート等の方法により形成することができる。

【0174】

表示装置を構成する薄膜は、フォトリソグラフィ法等を用いて加工することができる。ま たは、遮蔽マスクを用いた成膜方法により、島状の薄膜を形成してもよい。または、ナノ インプリント法、サンドブラスト法、もしくはリフトオフ法などにより薄膜を加工しても よい。フォトリソグラフィ法としては、加工したい薄膜上にレジストマスクを形成して、 エッチング等により当該薄膜を加工し、レジストマスクを除去する方法と、感光性を有す る薄膜を成膜した後に、露光、現像を行って、当該薄膜を所望の形状に加工する方法と、 がある。

【0175】

フォトリソグラフィ法において、露光に用いる光としては、例えばi線(波長365nm)、g線(波長436nm)、h線(波長405nm)、及びこれらを混合させた光が挙 げられる。そのほか、紫外線、KrFレーザ光、またはArFレーザ光等を用いることも できる。また、液浸露光技術により露光を行ってもよい。露光に用いる光としては、極端 紫外光(EUV:Extreme Ultra-violet)及びX線等が挙げられる 。また、露光に用いる光に換えて、電子ビームを用いることもできる。極端紫外光、X線 または電子ビームを用いると、極めて微細な加工が可能となるため好ましい。なお、電子 ビームなどのビームを走査することにより露光を行う場合には、フォトマスクは不要であ る。

[0176]

薄膜のエッチングには、ドライエッチング法、ウエットエッチング法、サンドブラスト法 などを用いることができる。

**[**0177**]** 

< 3 . 表示装置の構成例 3 >

図8~図12に、表示装置の一例をそれぞれ示す。図8は、表示装置100Cの断面図で ある。図9(A)は、表示装置100Dの断面図である。図10は、表示装置が有する副 画素の上面図である。図11は、表示装置100Eの断面図である。図12は、表示装置 100Fの断面図である。なお、表示装置100C、表示装置100D、表示装置100 E、及び表示装置100Fの斜視図は、図4に示す表示装置100Aと同様であるため、 10

ここでの説明は省略する。

【0178】

図 8 に示す表示装置 1 0 0 C は、先に示した表示装置 1 0 0 A と、画素電極 1 1 1 と共通 電極 1 1 2 の位置関係が異なる。

【0179】

図6に示す表示装置100Aは、配向膜133aと共通電極112とが接する構成である。 一方、図8に示す表示装置100Cは、配向膜133aと画素電極111とが接する構 成である。

**[**0 1 8 0 **]** 

図 9 に示す表示装置 1 0 0 D は、先に示した表示装置 1 0 0 A と、画素電極 1 1 1 と共通 10 電極 1 1 2 の形状が異なる。

**[**0 1 8 1 **]** 

画素電極111及び共通電極112の双方が、 歯状の上面形状(平面形状ともいう)、 またはスリットが設けられた上面形状を有していてもよい。

[0182]

図9に示す表示装置100Dでは、画素電極111及び共通電極112が、同一平面上に 設けられている。

【0183】

または、上面から見て、一方の電極のスリットの端部と、他方の電極のスリットの端部が 揃っている形状であってもよい。この場合の断面図を図9(B)に示す。

[0184]

または、上面から見て、画素電極111及び共通電極112が互いに重なる部分を有して いてもよい。この場合の断面図を図9(C)に示す。

【0185】

または、表示部62は、上面から見て、画素電極111及び共通電極112の双方が設け られていない部分を有していてもよい。この場合の断面図を図9(D)に示す。

【0186】

図10(A)、(B)は、液晶素子と電気的に接続されるトランジスタに、ボトムゲート トップコンタクト(Bottom Gate Top Contact、BGTC)構造 のトランジスタを適用した場合の、副画素の上面図である。図10(A)では、トランジ スタと、画素電極111と、共通電極112と、を示す。BGTC構造のトランジスタは 、ゲート221、半導体層231、並びに、ソース電極及びドレイン電極である導電層2 22a、222cを有する。図10(B)は、図10(A)の積層構造から共通電極11 2を除いた上面図である。

【0187】

図10(A)、(B)において、1つの導電層が、走査線228及びゲート221として 機能するともいえる。また、図10(A)、(B)において、1つの導電層が、信号線2 29及び導電層222aとして機能するともいえる。

【0188】

- 導電層222cは、可視光を透過する材料を用いて形成される。これにより、画素電極1 11とトランジスタとの接続部を表示領域68に設けることができる。したがって、副画 素の開口率を高めることができる。また、表示装置の消費電力を低減することができる。 【0189】
- 図11に示す表示装置100E及び図12に示す表示装置100Fは、それぞれ、先に示 す表示装置100Aと、トランジスタの形状が異なる。

【0190】

図11に示すトランジスタ201及びトランジスタ206は、それぞれ、ゲート221、 絶縁層213、導電層222a、及び半導体層231を有する。トランジスタ201は、 さらに導電層222bを有する。トランジスタ206は、さらに導電層222cを有する

٥

30

(25)

【0191】

ゲート221は、絶縁層213を介して半導体層231と重なる。絶縁層213はゲート 絶縁層として機能する。導電層222a、導電層222b、及び導電層222cは、それ ぞれ、半導体層231と接続する部分を有する。導電層222aと、導電層222bまた は導電層222cと、は、一方がソース電極として機能し、他方がドレイン電極として機 能する。トランジスタ201及びトランジスタ206は、絶縁層212及び絶縁層214 に覆われている。

【0192】

図12に示すトランジスタ201及びトランジスタ206は、それぞれ、ゲート221、 ゲート223、絶縁層212、絶縁層213、絶縁層214、導電層222a、及び半導 体層231を有する。トランジスタ201は、さらに導電層222bを有する。トランジ スタ206は、さらに導電層222cを有する。

【0193】

ゲート221は、絶縁層213を介して半導体層231と重なる。ゲート223は、絶縁 層212及び絶縁層214を介して半導体層231と重なる。絶縁層212、絶縁層21 3、及び絶縁層214はそれぞれゲート絶縁層として機能する。導電層222a、導電層 222b、及び導電層222cは、それぞれ、半導体層231と接続する部分を有する。 導電層222aと、導電層222bまたは導電層222cと、は、一方がソース電極とし て機能し、他方がドレイン電極として機能する。トランジスタ201及びトランジスタ2 06は、絶縁層215に覆われている。

[0194]

図11及び図12において、画素電極111は、導電層222cと電気的に接続されている。

[0195]

導電層222cは、可視光を透過する材料を用いて形成される。これにより、画素電極1 11とトランジスタとの接続部を表示領域68に設けることができる。したがって、副画 素の開口率を高めることができる。また、表示装置の消費電力を低減することができる。 【0196】

以上のように、本発明の一態様の表示装置には、様々な形状のトランジスタ及び液晶素子 を適用することができる。

[0197]

< 4 . 表示装置の構成例 4 >

図13~図18は、それぞれ、図5とは異なる副画素の上面図である。

[0198]

図5は、FFSモードの液晶素子を有する副画素の上面図である。図5は、トランジスタ 側から画素電極111、共通電極112の順で設けられている例である。

【0199】

図13及び図14に、図5と同様、FFSモードの液晶素子を有する副画素の上面図を示 す。図13及び図14も、トランジスタ側から画素電極111、共通電極112の順で設 けられている例である。

【 0 2 0 0 】

図13(A)、図14(A)は、副画素のうち、ゲート223から共通電極112までの 積層構造を、共通電極112側から見た上面図である。図13(A)、図14(A)には 、副画素の表示領域68を太い点線の枠で示す。図13(B)、図14(B)は、それぞ れ、図13(A)または図14(A)の積層構造から共通電極112を除いた上面図であ る。

[0201]

図13(A)、図14(A)に示すように、1つの副画素の表示領域68に、共通電極1 12の開口を2つ以上設けることができる。 【0202】 20

図13(B)及び図14(B)に示すコンタクト部Q1において、ゲート221及びゲー ト223は、電気的に接続されている。 [0203]図13(B)に示すコンタクト部Q2において、導電層222bが、画素電極111と接 続している。図14(B)に示すコンタクト部Q2において、導電層222cが、画素電 極111と接続している。 [0204]図14に示す構成は、導電層222cが可視光を透過する。このため、コンタクト部Q2 を表示領域68に設けることができる。一方、図13に示す導電層222bは可視光を遮 る。したがって、図13に示す構成に比べて、図14に示す構成は、副画素の開口率を高 めることができる。また、表示装置の消費電力を低減することができる。 [0205]本発明の一態様において、画素電極とトランジスタとのコンタクト部を、表示領域68に 設けることで、開口率を、10%以上、さらには20%以上高めることができる。これに より、バックライトの消費電力を、10%以上、さらには20%以上削減することができ る。 [0206] 図13に示す構成は、導電層222a及び導電層222bを同一の材料、同一の工程で形 成することができるため、作製工程が簡略化され、コストを低減することができる。 図15及び図16に、TNモードまたはVAモードなどの縦電界モードの液晶素子を有す る副画素の上面図を示す。 [0208] 図15(A)、図16(A)は、副画素のうち、ゲート223から画素電極111までの 積層構造を、画素電極111側から見た上面図である。図15(A)、図16(A)には 、副画素の表示領域68を太い点線の枠で示す。図15(B)、図16(B)は、それぞ れ、図15(A)または図16(A)の積層構造から画素電極111を除いた上面図であ る。 [0209] 横電界モードの液晶素子を用いる場合、画素電極111と共通電極112との間で容量を 形成することができる。一方、縦電界モードの液晶素子を用いる場合、容量素子を別途形 成する。 [0210]図15及び図16では、副画素に、容量線244が設けられている例を示す。容量線24 4 は、トランジスタが有する導電層(例えばゲート221)と同一の材料、同一の工程で 形成される導電層と電気的に接続される。図15では、容量線244と重ねて可視光を遮 る導電層222bが設けられている。図16では、容量線244と重ねて可視光を透過す る導電層222cが設けられている。図15では、導電層222bが、画素電極111と 接続している。図16では、導電層222cが、画素電極111と接続している。 [0211]図16に示す構成は、導電層222cが可視光を透過する。このため、容量素子の少なく とも一部と、導電層222とと画素電極111のコンタクト部を表示領域68に設けるこ とができる。一方、図15に示す導電層222bは可視光を遮る。したがって、図15に 示す構成に比べて、図16に示す構成は、副画素の開口率を高めることができる。また、 表示装置の消費電力を低減することができる。 [0212]図15に示す構成は、導電層222a及び導電層222bを同一の材料、同一の工程で形 成することができるため、作製工程が簡略化され、コストを低減することができる。 [0213]図17及び図18に、縦電界モードの液晶素子を有する副画素の上面図を示す。

20

10

30

[0214]

図17(A)、図18(A)は、副画素のうち、ゲート223から画素電極111までの 積層構造を、画素電極111側から見た上面図である。図17(A)、図18(A)には 、副画素の表示領域68を太い点線の枠で示す。図17(B)、図18(B)は、それぞ れ、図17(A)または図18(A)の積層構造から画素電極111を除いた上面図であ る。

[0215]

図17及び図18では、副画素に、容量線244が設けられている例を示す。容量線24 4は、トランジスタが有する導電層(例えばゲート221)と同一の材料、同一の工程で 形成される導電層と電気的に接続される。図17では、容量線244と重ねて可視光を遮 る導電層222bが設けられている。図18では、容量線244と重ねて可視光を透過す る導電層222cが設けられている。図17では、導電層222bが、画素電極111と 接続している。図18では、導電層222cが、画素電極111と接続している。 【0216】

図18に示す構成は、容量素子の少なくとも一部と、導電層222cと画素電極111の コンタクト部を表示領域68に設けることができる。したがって、図17に示す構成に比 べて、図18に示す構成は、副画素の開口率を高めることができる。また、表示装置の消 費電力を低減することができる。

[0217]

図17に示す構成は、導電層222 a 及び導電層222 b を同一の材料、同一の工程で形 成することができるため、作製工程が簡略化され、コストを低減することができる。

【0218】

< 5. 画素の配置例 >

図19(A)、(B)に画素の配置例を示す。図19(A)、(B)では、赤色の副画素 R、緑色の副画素G、及び青色の副画素Bによって1つの画素が構成される例を示す。図 19(A)、(B)では、複数の走査線81が×方向に伸長しており、複数の信号線82 がy方向に伸長しており、走査線81と信号線82は交差している。

【0219】

図19(A)の二点鎖線の枠内に示すように、副画素は、トランジスタ206、容量素子 34、及び液晶素子40を有する。トランジスタ206のゲートは、走査線81と電気的 に接続される。トランジスタ206のソース及びドレインのうち、一方は、信号線82と 電気的に接続され、他方は、容量素子34の一方の電極及び液晶素子40の一方の電極と 電気的に接続される。容量素子34の他方の電極及び液晶素子40の他方の電極には、そ れぞれ、定電位が与えられる。

【0220】

図19(A)、(B)では、ソースライン反転駆動を適用する例を示す。信号A1と信号 A2は極性が同じ信号である。信号B1と信号B2は極性が同じ信号である。信号A1と 信号B1は互いに極性の異なる信号である。信号A2と信号B2は互いに極性の異なる信 号である。

【0221】

表示装置の高精細化に伴い、副画素間の距離は狭くなる。そのため、例えば図19(A) の一点鎖線の枠内に示すように、信号A1が入力される副画素における、信号B1が入力 される信号線82近傍では、液晶が、信号A1と信号B1の双方の電位の影響を受けやす くなる。これにより、液晶の配向不良が生じやすくなる。

[0222]

図19(A)では、同一の色を呈する複数の副画素が配設される方向は、 y 方向であり、 信号線82が伸長する方向と概略平行である。図19(A)の一点鎖線の枠内に示すよう に、副画素の長辺側に、異なる色を呈する副画素が隣接する。

【 0 2 2 3 】

図19(B)では、同一の色を呈する複数の副画素が配設される方向は、×方向であり、

10

20

信号線82が伸長する方向と交差する。図19(B)の一点鎖線の枠内に示すように、副 画素の短辺側に、同じ色を呈する副画素が隣接する。 [0224]図19(B)に示すように、副画素における、信号線82が伸長する方向に概略平行な辺 が、短辺であると、長辺である場合(図19(A))に比べて、液晶の配向不良が生じや すい領域を狭くすることができる。図19(B)に示すように、液晶の配向不良が生じや すい領域が同一の色を呈する副画素間に位置すると、異なる色を呈する副画素間に位置す る場合(図19(A))に比べて、表示装置の使用者に、表示不良を視認されにくくなる 。本発明の一態様において、同一の色を呈する複数の副画素が配設される方向は、信号線 82が伸長する方向と交差することが好ましい。 [0225]< 6 . 表示装置の構成例 5 > 本発明の一態様は、タッチセンサが搭載された表示装置(入出力装置またはタッチパネル ともいう)に適用することができる。上述の各表示装置の構成を、タッチパネルに適用す ることができる。本実施の形態では、表示装置100Aにタッチセンサを搭載する例を主 に説明する。 [0226] 本発明の一態様のタッチパネルが有する検知素子(センサ素子ともいう)に限定は無い。 指やスタイラスなどの被検知体の近接または接触を検知することのできる様々なセンサを 、検知素子として適用することができる。 [0227]センサの方式としては、例えば、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方 式、光学方式、感圧方式など様々な方式を用いることができる。 [0228]本実施の形態では、静電容量方式の検知素子を有するタッチパネルを例に挙げて説明する [0229]静電容量方式としては、表面型静電容量方式、投影型静電容量方式等がある。また、投影 型静電容量方式としては、自己容量方式、相互容量方式等がある。相互容量方式を用いる と、同時多点検知が可能となるため好ましい。 本発明の一態様のタッチパネルは、別々に作製された表示装置と検知素子とを貼り合わせ る構成、表示素子を支持する基板及び対向基板の一方または双方に検知素子を構成する電 極等を設ける構成等、様々な構成を適用することができる。  $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 図20及び図21に、タッチパネルの一例を示す。図20(A)は、タッチパネル350 Aの斜視図である。図20(B)は、図20(A)を展開した斜視概略図である。なお、 明瞭化のため、代表的な構成要素のみを示している。図20(B)では、基板61及び基 板162を破線で輪郭のみ明示している。図21は、タッチパネル350Aの断面図であ る。 タッチパネル350Aは、別々に作製された表示装置と検知素子とを貼り合わせた構成で ある。  $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ 

タッチパネル350Aは、入力装置375と、表示装置370とを有し、これらが重ねて 設けられている。

【0234】

入力装置375は、基板162、電極127、電極128、複数の配線137、及び複数 の配線138を有する。FPC72bは、複数の配線137及び複数の配線138の各々 と電気的に接続する。FPC72bにはIC73bが設けられている。 10

20

(29)

[0235]

表示装置370は、対向して設けられた基板51と基板61とを有する。表示装置370 は、表示部62及び駆動回路部64を有する。基板51上には、配線65等が設けられて いる。FPC72aは、配線65と電気的に接続される。FPC72aにはIC73aが 設けられている。

【 0 2 3 6 】

表示部62及び駆動回路部64には、配線65から、信号及び電力が供給される。当該信 号及び電力は、外部またはIC73aから、FPC72aを介して配線65に入力される

0

10

【 0 2 3 7 】

図 2 1 は、表示部 6 2、駆動回路部 6 4、 F P C 7 2 a を含む領域、及び F P C 7 2 b を 含む領域等の断面図である。

【 0 2 3 8 】

基板51と基板61とは、接着層141によって貼り合わされている。基板61と基板1 62とは、接着層169によって貼り合わされている。ここで、基板51から基板61ま での各層が、表示装置370に相当する。また、基板162から電極124までの各層が 入力装置375に相当する。つまり、接着層169は、表示装置370と入力装置375 を貼り合わせているといえる。

[0239]

図21に示す表示装置370の構成は、図6に示す表示装置100Aと同様の構成である ため、詳細な説明は省略する。

【0240】

基板51には、接着層167によって、偏光板165が貼り合わされている。偏光板16 5には、接着層163によって、バックライト161が貼り合わされている。

【0241】

バックライト161としては、直下型のバックライト、またはエッジライト型のバックラ イト等が挙げられる。LEDを備える直下型のバックライトを用いると、複雑なローカル ディミングが可能となり、コントラストを高めることができるため好ましい。また、エッ ジライト型のバックライトを用いると、バックライトを含めたモジュールの厚さを低減で きるため好ましい。

[0242]

基板162には、接着層168によって、偏光板166が貼り合わされている。偏光板1 66には、接着層164によって、保護基板160が貼り合わされている。電子機器にタ ッチパネル350Aを組み込む際、保護基板160を、指またはスタイラスなどの被検知 体が直接触れる基板として用いてもよい。保護基板160には、基板51及び基板61等 に用いることができる基板を適用することができる。保護基板160には、基板51及び 基板61等に用いることができる基板の表面に保護層を形成した構成、または強化ガラス 等を用いることが好ましい。当該保護層は、セラミックコートにより形成することができ る。または、当該保護層は、酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化イットリウム、イッ トリア安定化ジルコニア(YSZ)などの無機絶縁材料を用いて形成することができる。 【0243】

入力装置375と表示装置370の間に偏光板166を配置してもよい。その場合、図2 1に示す保護基板160、接着層164、及び接着層168を設けなくてよい。つまり、 タッチパネル350Aの最表面に基板162が位置する構成とすることができる。基板1 62には、上記の保護基板160に用いることができる材料を適用することが好ましい。 【0244】

基板162の基板61側には、電極127及び電極128が設けられている。電極127 及び電極128は同一平面上に形成されている。絶縁層125は、電極127及び電極1 28を覆うように設けられている。電極124は、絶縁層125に設けられた開口を介し て、電極127を挟むように設けられる2つの電極128と電気的に接続している。 30

【0245】

入力装置375が有する導電層のうち、表示領域68と重なる導電層(電極127、12 8等)には、可視光を透過する材料を用いる。

[0246]

電極127、128と同一の導電層を加工して得られた配線137が、電極124と同一 の導電層を加工して得られた導電層126と接続している。導電層126は、接続体24 2bを介してFPC72bと電気的に接続される。

【0247】

< 7.表示装置の構成例 6 >

図22及び図23に、タッチパネルの一例を示す。図22(A)は、タッチパネル350 Bの斜視図である。図22(B)は、図22(A)を展開した斜視概略図である。なお、 明瞭化のため、代表的な構成要素のみを示している。図22(B)では、基板61を破線 で輪郭のみ明示している。図23は、タッチパネル350Bの断面図である。

【0248】

タッチパネル350Bは、画像を表示する機能と、タッチセンサとしての機能と、を有する、インセル型のタッチパネルである。

【0249】

タッチパネル350Bは、対向基板のみに、検知素子を構成する電極等を設けた構成である。このような構成は、別々に作製された表示装置と検知素子とを貼り合わせる構成に比べて、タッチパネルを薄型化もしくは軽量化することができる、または、タッチパネルの 部品点数を少なくすることができる。

20

10

図 2 2 (A)、(B)において、入力装置 3 7 6 は、基板 6 1 に設けられている。また、 入力装置 3 7 6 の配線 1 3 7 及び配線 1 3 8 等は、表示装置 3 7 9 に設けられた F P C 7 2 と電気的に接続する。

[0251]

[0250]

このような構成とすることで、タッチパネル350Bに接続するFPCを1つの基板側( ここでは基板51側)にのみ配置することができる。また、タッチパネル350Bに2以 上のFPCを取り付ける構成としてもよいが、図22(A)、(B)に示すように、タッ チパネル350Bには1つのFPC72を設け、FPC72から、表示装置379と入力 装置376の両方に信号を供給する構成とすると、構成をより簡略化できるため好ましい

30

【0252】

IC73は入力装置376を駆動する機能を有していてもよい。入力装置376を駆動するICをさらにFPC72上に設けてもよい。または、入力装置376を駆動するICを 基板51上に実装してもよい。

【0253】

図 2 3 は、図 2 2 (A)における F P C 7 2 を含む領域、接続部 6 3、駆動回路部 6 4、 及び表示部 6 2 を含む断面図である。

【0254】

接続部63では、配線137(または配線138)の1つと、基板51側に設けられた導 電層とが、接続体243を介して電気的に接続している。

【0255】

接続体243としては、例えば導電性の粒子を用いることができる。導電性の粒子として は、有機樹脂またはシリカなどの粒子の表面を金属材料で被覆したものを用いることがで きる。金属材料としてニッケルや金を用いると接触抵抗を低減できるため好ましい。また ニッケルをさらに金で被覆するなど、2種類以上の金属材料を層状に被覆させた粒子を用 いることが好ましい。また接続体243として弾性変形もしくは塑性変形する材料を用い ることが好ましい。このとき導電性の粒子は図23等に示すように上下方向に潰れた形状 となる場合がある。こうすることで、接続体243と、これと電気的に接続する導電層と

の接触面積が増大し、接触抵抗が低減できるほか、接続不良などの不具合を抑制できる。 [0256]接続体243は接着層141に覆われるように配置することが好ましい。例えば硬化前の 接着層141に、接続体243を分散させておけばよい。 [0257] 基板61に接して遮光層132が設けられている。そのため、タッチセンサに用いる導電 層が使用者から視認されることを抑制できる。遮光層132は絶縁層122によって覆わ れている。絶縁層122と絶縁層125の間には、電極127が設けられている。絶縁層 125と絶縁層123の間には電極128が設けられている。電極127及び電極128 には、金属や合金を用いることができる。絶縁層123に接して着色層131が設けられ ている。なお、図24に示すタッチパネル350Cのように、基板61に接して設けられ る遮光層132bとは別に、絶縁層123に接して遮光層132aを配置してもよい。 [0258]電極127と同一の導電層を加工して得られた配線137が、電極128と同一の導電層 を加工して得られた導電層285と接続している。導電層285は、導電層286と接続 している。導電層286は、接続体243を介して導電層284と電気的に接続される。 なお、導電層286を設けず、導電層285と接続体243とを接続させてもよい。 [0259]タッチパネル350Bは、一つのFPCにより、画素を駆動する信号と検知素子を駆動す る信号が供給される。そのため、電子機器に組み込みやすく、また、部品点数を削減する ことが可能となる。 [0260]< 8 . 表示装置の構成例 7 > 図25にタッチパネル350Dの断面図を示す。タッチパネル350Dは、基板51上に 入力装置が設けられている構成である。  $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ タッチパネル350Dは、トランジスタ等を形成する基板のみに、検知素子を構成する電 極等を設けた構成である。このような構成は、別々に作製された表示装置と検知素子とを 貼り合わせる構成に比べて、タッチパネルを薄型化もしくは軽量化することができる、ま たは、タッチパネルの部品点数を少なくすることができる。また、基板61側の構成要素 の数を減らすことができる。 [0262] また、基板51側に接続された1つまたは複数のFPCによって、液晶素子40を駆動す る信号と、検知素子を駆動する信号の双方を供給することができる。 まず、基板51上に形成する各構成要素について説明する。 [0264]基板51上には、電極127、電極128、及び配線137が設けられている。電極12 7、電極128、及び配線137上に、絶縁層125が設けられている。絶縁層125上 に、電極124及び導電層126が設けられている。電極124は、絶縁層125に設け られた開口を介して、電極127を挟むように設けられる2つの電極128と電気的に接 続している。導電層126は、絶縁層125に設けられた開口を介して、配線137と電 気的に接続されている。電極124及び導電層126上に、絶縁層170が設けられてい る。絶縁層170上には、導電層227が設けられている。導電層227は、表示部62 全体に設けられることが好ましい。導電層227には、定電位が供給される。導電層22 7は、ノイズを遮蔽するためのシールドとして機能することができる。これによりトラン ジスタや検知素子を安定に動作させることができる。導電層227上には絶縁層171が

入力装置が有する導電層のうち、表示領域68と重なる導電層(電極127、128等)

設けられている。 【0265】 (31)

40

10

20

30

には、可視光を透過する材料を用いる。なお、図23及び図24等のように、入力装置が 有する導電層を非表示領域66にのみ配置してもよい。入力装置が有する導電層を表示領 域68と重ねない構成とすることで、入力装置が有する導電層の材料の可視光の透過性が 限定されない。入力装置が有する導電層に、金属等の抵抗率の低い材料を用いることがで きる。例えば、タッチセンサの配線及び電極として、メタルメッシュを用いることが好ま しい。これにより、タッチセンサの配線及び電極の抵抗を下げることができる。また、大 型の表示装置のタッチセンサとして好適である。なお、一般的に金属は反射率が大きい材 料であるが、酸化処理などを施すことにより暗色にすることができる。したがって、表示 面側から視認した場合においても、外光の反射による視認性の低下を抑えることができる

[0266]

また、当該配線及び当該電極を、金属層と反射率の小さい層(「暗色層」ともいう。)の 積層で形成してもよい。暗色層の一例としては、酸化銅を含む層、塩化銅または塩化テル ルを含む層などがある。また、暗色層を、Ag粒子、Agファイバー、Cu粒子等の金属 微粒子、カーボンナノチューブ(CNT)、グラフェン等のナノ炭素粒子、並びに、PE DOT、ポリアニリン、ポリピロールなどの導電性高分子などを用いて形成してもよい。 【0267】

導電層126は、複数の導電層と接続体242bを介してFPC72bと電気的に接続される。当該複数の導電層は、導電層227と同一の材料、同一の工程で形成された導電層、トランジスタが有する導電層と同一の材料、同一の工程で形成された導電層、及び、導電層251等が挙げられる。

20

30

10

[0268]

絶縁層171上に設けられる構成要素は、図6に示す表示装置100Aにおける基板51 上に設けられる構成要素と同様である。

【0269】

タッチパネル350Dの作製方法例を説明する。タッチパネル350Dの作製方法は、基板51上に、タッチセンサを形成する工程と、タッチセンサ上に、トランジスタ206、第1の導電層、及び第2の導電層などを形成する工程と、トランジスタ206と電気的に 接続される液晶素子40を形成する工程と、を有する。

【0270】

タッチセンサは、まず、基板51上に電極127、電極128、及び配線137を形成し 、電極127、電極128、及び配線137上に絶縁層125を形成し、絶縁層125に 、電極128に達する開口及び配線137に達する開口を形成し、絶縁層125に設けら れた開口を介して電極128と接する電極124と、絶縁層125に設けられた開口を介 して配線137と接する導電層126と、を形成することで形成される。第1の導電層は 、タッチセンサと電気的に接続するように形成される。具体的には、第1の導電層は、配 線137及び導電層126を介して、電極127または電極128と電気的に接続される 。第2の導電層は、トランジスタ206と電気的に接続するように形成される。第1の導 電層及び第2の導電層は、それぞれ、トランジスタ206が有する導電層の一つまたは複 数と同一の工程、及び同一の材料で形成される。

【0271】

基板61には、接着層167によって、偏光板165が貼り合わされている。偏光板16 5には、接着層163によって、バックライト161が貼り合わされている。

[0272]

基板 5 1 には、接着層 1 6 8 によって、偏光板 1 6 6 が貼り合わされている。偏光板 1 6 6 には、接着層 1 6 4 によって、保護基板 1 6 0 が貼り合わされている。 【 0 2 7 3】

バックライト161からの光は、基板61、着色層131、液晶素子40を透過した後、 トランジスタと画素電極のコンタクト部に入射する。本発明の一態様では、トランジスタ と画素電極のコンタクト部が可視光を透過する構成であるため、当該コンタクト部を表示

50

【0274】

< 9. タッチセンサの構成例 >

以下では、入力装置(タッチセンサ)の構成例について説明する。当該入力装置は、本実施の形態で例示する各タッチパネルに適用することができる。

(33)

【0275】

図26(A)に、入力装置415の上面図を示す。入力装置415は、基板416上に複数の電極471、複数の電極472、複数の配線476、及び複数の配線477を有する。基板416には、複数の配線476及び複数の配線477の各々と電気的に接続するFPC450が設けられている。また、図26(A)では、FPC450にIC449が設けられている。

【0276】

図26(B)に、図26(A)中の一点鎖線で囲った領域の拡大図を示す。電極471は 、複数の菱形の電極パターンが、横方向に連なった形状を有している。一列に並んだ菱形 の電極パターンは、それぞれ電気的に接続されている。電極472も同様に、複数の菱形 の電極パターンが、縦方向に連なった形状を有し、一列に並んだ菱形の電極パターンはそ れぞれ電気的に接続されている。電極471と電極472とは、これらの一部が重畳し、 互いに交差している。この交差部分では電極471と電極472とが電気的に短絡(ショ ート)しないように、絶縁体が挟持されている。

[0277]

図26(C)に示すように、電極472は、菱形の形状を有する複数の電極473と、ブ リッジ電極474によって構成されていてもよい。島状の電極473は、縦方向に並べて 配置され、ブリッジ電極474により隣接する2つの電極473が電気的に接続されてい る。このような構成とすることで、電極473と、電極471を同一の導電膜を加工する ことで同時に形成することができる。そのためこれらの膜厚のばらつきを抑制することが でき、それぞれの電極の抵抗値や光透過率が場所によってばらつくことを抑制できる。な お、ここでは電極472がブリッジ電極474を有する構成としたが、電極471がこの ような構成であってもよい。

【0278】

図26(D)に示すように、図26(B)で示した電極471及び電極472の菱形の電 極パターンの内側をくりぬいて、輪郭部のみを残したような形状としてもよい。このとき 、電極471及び電極472の幅が、使用者から視認されない程度に細い場合には、後述 するように電極471及び電極472に金属や合金などの遮光性の材料を用いてもよい。 また、図26(D)に示す電極471または電極472が、上記ブリッジ電極474を有 する構成としてもよい。

[0279]

1つの電極471は、1つの配線476と電気的に接続している。1つの電極472は、 1つの配線477と電気的に接続している。ここで、電極471と電極472のいずれか 一方が、行配線に相当し、いずれか他方が列配線に相当する。

【 0 2 8 0 】

IC449は、タッチセンサを駆動する機能を有する。IC449から出力された信号は 配線476または配線477を介して、電極471または電極472のいずれかに供給さ れる。電極471または電極472のいずれかに流れる電流(または電位)が、配線47 6または配線477を介してIC449に入力される。ここではIC449をFPC45 0上に実装した例を示したが、IC449を基板416上に実装してもよい。

【0281】

入力装置415を表示パネルの表示面に重ねる場合には、電極471及び電極472に透 光性を有する導電性材料を用いることが好ましい。また、電極471及び電極472に透 光性の導電性材料を用い、表示パネルからの光を電極471または電極472を介して取

り出す場合には、隣り合う電極471と電極472との間に、同一の導電性材料を含む導 電膜をダミーパターンとして配置することが好ましい。このように、電極471と電極4 72との間の隙間の一部をダミーパターンにより埋めることにより、光透過率のばらつき を低減できる。その結果、入力装置415を透過する光の輝度ムラを低減することができ る。

[0282]

透光性を有する導電性材料としては、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、インジウム 亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウム亜鉛酸化物などの導電性酸化物を用いることができる。 なお、グラフェンを含む膜を用いることもできる。

【0283】

または、透光性を有する程度に薄い金属または合金を用いることができる。例えば、金、 銀、白金、マグネシウム、ニッケル、タングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト 、銅、パラジウム、またはチタンなどの金属や、該金属を含む合金を用いることができる 。または、該金属または合金の窒化物(例えば、窒化チタン)などを用いてもよい。また 、上述した材料を含む導電膜のうち、2以上を積層した積層膜を用いてもよい。

【0284】

また、電極471及び電極472には、使用者から視認されない程度に細く加工された導 電膜を用いてもよい。例えば、このような導電膜を格子状(メッシュ状)に加工すること で、高い導電性と表示装置の高い視認性の両方を得ることができる。このとき、導電膜は 30nm以上100µm以下、好ましくは50nm以上50µm以下、より好ましくは5 0nm以上20µm以下の幅である部分を有することが好ましい。特に、10µm以下の パターン幅を有する導電膜は、使用者が視認することが極めて困難となるため好ましい。 【0285】

20

30

10

一例として、図27(A)~(D)に、図26(B)に示す領域460を拡大した概略図
を示す。

[0286]

図27(A)は、格子状の導電膜461を用いた場合の例を示している。このとき、表示 装置が有する表示素子と重ならないように、導電膜461を配置することで、当該表示素 子からの光を遮ることがないため好ましい。その場合、格子の向きを表示素子の配列と同 じ向きとし、また格子の周期を表示素子の配列の周期の整数倍とすることが好ましい。 【0287】

図27(B)には、三角形の開口が形成されるように加工された格子状の導電膜462の 例を示している。このような構成とすることで、図27(A)に示した場合に比べて抵抗 をより低くすることが可能となる。

【0288】

また、図27(C)に示すように、周期性を有さないパターン形状を有する導電膜463 としてもよい。このような構成とすることで、表示装置の表示部と重ねたときにモアレが 生じることを抑制できる。

[0289]

また、電極471及び電極472に、導電性のナノワイヤを用いてもよい。図27(D) には、ナノワイヤ464を用いた場合の例を示している。隣接するナノワイヤ464同士 が接触するように、適当な密度で分散することにより、2次元的なネットワークが形成さ れ、極めて透光性の高い導電膜として機能させることができる。例えば直径の平均値が1 nm以上100nm以下、好ましくは5nm以上50nm以下、より好ましくは5nm以 上25nm以下のナノワイヤを用いることができる。ナノワイヤ464としては、Agナ ノワイヤ、Cuナノワイヤ、Alナノワイヤ等の金属ナノワイヤ、または、カーボンナノ チューブなどを用いることができる。例えばAgナノワイヤの場合、光透過率は89%以 上、シート抵抗値は40 / 以上100 / 以下を実現することができる。 【0290】

また、図 2 6 ( B )における電極 4 7 1 及び電極 4 7 2 のより詳細な構成例を図 2 7 ( E

(34)

)に示す。図27(E)は、電極471及び電極472のそれぞれに、格子状に加工され た導電膜を用いた場合の一例である。 [0291]図26(A)等では、電極471及び電極472の上面形状として、複数の菱形が一方向 に連なった形状とした例を示したが、電極471及び電極472の形状としてはこれに限 られず、帯状(長方形状)、曲線を有する帯状、ジグザグ形状など、様々な上面形状とす ることができる。また、上記では電極471と電極472とが直交するように配置されて いるように示しているが、これらは必ずしも直交して配置される必要はなく、2つの電極 の成す角が90度未満であってもよい。 [0292]< 10.表示装置の構成例8> 図28に、タッチパネルの一例を示す。図28は、タッチパネル350Eの断面図である [0293] タッチパネル350Eは、画像を表示する機能と、タッチセンサとしての機能と、を有す る、インセル型のタッチパネルである。 [0294]タッチパネル350Eは、表示素子を支持する基板のみに、検知素子を構成する電極等を 設けた構成である。このような構成は、別々に作製された表示装置と検知素子とを貼り合 わせる構成や、対向基板側に検知素子を作製する構成に比べて、タッチパネルを薄型化も しくは軽量化することができる、または、タッチパネルの部品点数を少なくすることがで きる。 [0295] 図 2 8 に示すタッチパネル 3 5 0 E は、先に示す表示装置 1 0 0 A とは、共通電極及び補 助配線139のレイアウトが異なる。 [0296] 複数の補助配線139は、それぞれ、共通電極112aまたは共通電極112bと電気的 に接続される。 [0297] 図28に示すタッチパネル350Eでは、共通電極112aと、共通電極112bとの間 に形成される容量を利用して、被検知体の近接または接触等を検知することができる。す なわちタッチパネル350Eにおいて、共通電極112a、112bは、液晶素子の共通 電極と、検知素子の電極と、の両方を兼ねる。 [0298]このように、本発明の一態様のタッチパネルでは、液晶素子を構成する電極が、検知素子 を構成する電極を兼ねるため、作製工程を簡略化でき、かつ作製コストを低減できる。ま た、タッチパネルの薄型化、軽量化を図ることができる。 [0299] 共通電極は、補助配線139と電気的に接続される。補助配線139を設けることで、検 知素子の電極の抵抗を低減させることができる。検知素子の電極の抵抗が低下することで 、検知素子の電極の時定数を小さくすることができる。検知素子の電極の時定数が小さい ほど、検出感度を高めることができ、さらには、検出の精度を高めることができる。 検知素子の電極の時定数は、例えば、0秒より大きく1×10<sup>-4</sup>秒以下、好ましくは0 秒より大きく5×10<sup>-5</sup>秒以下、より好ましくは0秒より大きく5×10<sup>-6</sup>秒以下、 より好ましくは0秒より大きく5×10<sup>-7</sup>秒以下、より好ましくは0秒より大きく2× 10<sup>-7</sup>秒以下であるとよい。特に、時定数を1×10<sup>-6</sup>秒以下とすることで、ノイズ の影響を抑制しつつ高い検出感度を実現することができる。  $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 

タッチパネル350Eは、一つのFPCにより、画素を駆動する信号と検知素子を駆動す

(35)

20

10

30

40

る信号が供給される。そのため、電子機器に組み込みやすく、また、部品点数を削減する ことが可能となる。 [0302]以下では、タッチパネル350Eの動作方法の例などを示す。 [0303]図29(A)は、タッチパネル350Eの表示部62に設けられる画素回路の一部におけ る等価回路図である。 [0304]一つの画素(副画素)は少なくともトランジスタ206と液晶素子40を有する。トラン ジスタ206のゲートには、配線3501が電気的に接続されている。また、トランジス タ206のソースまたはドレインの一方には、配線3502が電気的に接続されている。 [0305]画素回路は、X方向に延在する複数の配線(例えば、配線3510\_1、配線3510\_ 2)と、Y方向に延在する複数の配線(例えば、配線3511\_1)を有し、これらは互 いに交差して設けられ、その間に容量が形成される。 [0306]また、画素回路に設けられる画素のうち、一部の隣接する複数の画素は、それぞれに設け られる液晶素子の一方の電極が電気的に接続され、一つのブロックを形成する。当該ブロ ックは、島状のブロック(例えば、ブロック3515\_1、ブロック3515\_2)と、 X 方向または Y 方向に延在するライン状のブロック(例えば、 Y 方向に延在するブロック 3516)の、2種類に分類される。なお、図29(A)では、画素回路の一部のみを示 しているが、実際にはこれら2種類のブロックがX方向及びY方向に繰り返し配置される 。ここで、液晶素子の一方の電極としては、例えば共通電極などが挙げられる。一方、液 晶素子の他方の電極としては、例えば画素電極などが挙げられる。 [0307]X 方向に延在する配線3510\_1(または3510\_2)は、島状のブロック3515 \_ 1 (またはブロック3515 \_\_ 2 )と電気的に接続される。なお、図示しないが、 X 方 向に延在する配線3510\_1は、ライン状のブロックを介してX方向に沿って不連続に 配置される複数の島状のブロック3515 \_\_ 1 を電気的に接続する。また、 Y 方向に延在 する配線3511\_1は、ライン状のブロック3516と電気的に接続される。 図 2 9 ( B ) は、 X 方向に延在する複数の配線(配線 3 5 1 0 \_ 1 乃至配線 3 5 1 0 \_ 6 、まとめて配線3510とも記す)と、Y方向に延在する複数の配線(配線3511\_1 乃至配線3511\_6、まとめて配線3511とも記す)の接続構成を示した等価回路図 である。X方向に延在する配線3510の各々、及びY方向に延在する配線3511の各 々には、共通電位を入力することができる。また、X方向に延在する配線3510の各々 には、パルス電圧出力回路からパルス電圧を入力することができる。また、Y方向に延在 する配線3511の各々は、検出回路と電気的に接続することができる。なお、配線35 10と配線3511とは入れ替えることができる。 [0309] 図30(A)、(B)を用いて、タッチパネル350Eの動作方法の一例について説明す る。 [0310]ここでは1フレーム期間を、書き込み期間と検知期間とに分ける。書き込み期間は画素へ の画像データの書き込みを行う期間であり、配線3501(ゲート線、または走査線とも いう)が順次選択される。一方、検知期間は、検知素子によるセンシングを行う期間であ る。 [0311]図30(A)は、書き込み期間における等価回路図である。書き込み期間では、X方向に 延在する配線3510と、Y方向に延在する配線3511の両方に、共通電位が入力され

10

20

30

40
る。

【 0 3 1 2 】

図30(B)は、検知期間における等価回路図である。検知期間では、Y方向に延在する 配線3511の各々は、検出回路と電気的に接続する。また、X方向に延在する配線35 10には、パルス電圧出力回路からパルス電圧が入力される。

【0313】

図30(C)は、相互容量方式の検知素子における入出力波形のタイミングチャートの一例である。

【0314】

図30(C)では、1フレーム期間で各行列での被検知体の検知を行うものとする。また、図30(C)では、検知期間における、被検知体を検知しない場合(非タッチ)と被検 知体を検知する場合(タッチ)との2つの場合について示している。

【0315】

配線3510\_1乃至配線3510\_6は、パルス電圧出力回路からパルス電圧が与えら れる配線である。配線3510\_1乃至配線3510\_6にパルス電圧が印加されること で、容量を形成する一対の電極間には電界が生じ、容量に電流が流れる。この電極間に生 じる電界が、指やペンなどのタッチによる遮蔽等により変化する。つまり、タッチなどに より、容量の容量値に変化が生じる。このことを利用して、被検知体の近接または接触を 検知することができる。

[0316]

配線3511\_\_1乃至配線3511\_\_6は、容量の容量値の変化による、配線3511\_\_ 1乃至配線3511\_\_6での電流の変化を検出するための検出回路と接続されている。配 線3511\_\_1乃至配線3511\_\_6では、被検知体の近接または接触がないと検出され る電流値に変化はないが、検出する被検知体の近接または接触により容量値が減少する場 合には電流値が減少する。なお、電流の検出は、電流量の総和を検出してもよい。その場 合には、積分回路等を用いて検出を行えばよい。または、電流のピーク値を検出してもよ い。その場合には、電流を電圧に変換して、電圧値のピーク値を検出してもよい。

【0317】

なお、図30(C)において、配線3511\_1万至配線3511\_6については、検出 される電流値に対応する電圧値とした波形を示している。なお、図30(C)のように、 表示動作のタイミングと、検知動作のタイミングとは、同期させて動作することが望ましい。

【0318】

配線3510\_1乃至配線3510\_6に与えられたパルス電圧にしたがって、配線35 11\_1万至配線3511\_6での波形が変化する。被検知体の近接または接触がない場合には、配線3510\_1乃至配線3510\_6の電圧の変化に応じて配線3511\_1 乃至配線3511\_6の波形が一様に変化する。一方、被検知体が近接または接触する箇所では、電流値が減少するため、これに対応する電圧値の波形も変化する。

【0319】

このように、容量値の変化を検出することにより、被検知体の近接または接触を検知する ことができる。なお、指やペンなどの被検知体は、タッチパネルに接触せず、近接した場 合でも、信号が検出される場合がある。

なお、図30(C)では、配線3510において、書き込み期間に与えられる共通電位と、検知期間に与えられる低電位が等しい例を示すが、本発明の一態様はこれに限られず、 共通電位と低電位は異なる電位であってよい。

【0321】

またパルス電圧出力回路及び検出回路は、例えば1個のICの中に形成されていることが 好ましい。当該ICは、例えばタッチパネルに実装されること、もしくは電子機器の筐体 内の基板に実装されることが好ましい。また可撓性を有するタッチパネルとする場合には 20

、曲げた部分では寄生容量が増大し、ノイズの影響が大きくなってしまう恐れがあるため 、ノイズの影響を受けにくい駆動方法が適用されたICを用いることが好ましい。例えば シグナル - ノイズ比(S/N比)を高める駆動方法が適用されたICを用いることが好ま しい。

【0322】

このように、画像の書き込み期間と検知素子によるセンシングを行う期間とを、独立して 設けることが好ましい。これにより、画素の書き込み時のノイズに起因する検知素子の感 度の低下を抑制することができる。

【 0 3 2 3 】

本発明の一態様では、図30(D)に示すように、1フレーム期間に書き込み期間と検知 期間をそれぞれ1つ有する。または、図30(E)に示すように、1フレーム期間に検知 期間を2つ有していてもよい。1フレーム期間に検知期間を複数設けることで、検出感度 をより高めることができる。例えば、1フレーム期間に検知期間を2つ以上4つ以下有し ていてもよい。

[0324]

次に、タッチパネル350Eが有する検知素子の上面構成例について、図31を用いて説 明する。

【0325】

図31(A)に、検知素子の上面図を示す。検知素子は、導電層56a及び導電層56b を有する。導電層56aは、検知素子の一方の電極として機能し、導電層56bは、検知 素子の他方の電極として機能する。検知素子は、導電層56aと、導電層56bとの間に 形成される容量を利用して、被検知体の近接または接触等を検知することができる。なお 、導電層56a及び導電層56bは、 歯状の上面形状、またはスリットが設けられた上 面形状を有している場合があるが、ここでは省略する。

[0326]

本発明の一態様において、導電層 5 6 a 及び導電層 5 6 b は、液晶素子の共通電極としての機能も有する。

【 0 3 2 7 】

Y方向に複数配設された導電層56aは、それぞれX方向に延在して設けられている。また、Y方向に複数配設された導電層56bは、Y方向に延在して設けられた導電層58によって、電気的に接続されている。図31(A)では、m本の導電層56aと、n本の導電層58を有する例を示す。

【0328】

なお、導電層56aは、X方向に複数配設されていてもよく、その場合、Y方向に延在して設けられていてもよい。また、X方向に延在して設けられた導電層58によって、X方向に複数配設された導電層56bが電気的に接続されていてもよい。

【0329】

図31(B)に示すように、検知素子の電極として機能する導電層56は、複数の画素60にわたって設けられる。導電層56は、図31(A)の導電層56a、56bのそれぞれに相当する。画素60は、それぞれ異なる色を呈する複数の副画素からなる。図31(B)では、3つの副画素60a、60b、60cにより、画素60が構成されている例を示す。

[0330]

また、検知素子が有する一対の電極は、それぞれ、補助配線と電気的に接続されていることが好ましい。図31(C)に示すように、導電層56が補助配線57と電気的に接続されていてもよい。なお、図31(C)では、導電層上に補助配線が重ねて設けられている例を示すが、補助配線上に導電層が重ねて設けられていてもよい。X方向に複数配設された導電層56は、補助配線57を介して、導電層58と電気的に接続されていてもよい。 【0331】

可視光を透過する導電層の抵抗値は比較的高い場合がある。そのため、補助配線と電気的

10

30

に接続させることで、検知素子が有する一対の電極の抵抗をそれぞれ低減することが好ま しい。 【0332】 検知素子が有する一対の電極の抵抗を低減することで、一対の電極の時定数をそれぞれ小 さくすることができる。これにより、検知素子の検出感度を向上させ、さらには、検知素 子の検出精度を向上させることができる。 【0333】

<11.表示装置の構成例9>

図32に、本実施の形態の表示装置が有する画素の一例である断面図を示す。

【0334】

図32は、透過型の液晶表示装置の一例である。図32に示すように、バックライトユニット13からの光は、破線の矢印に示す方向に射出される。

【 0 3 3 5 】

図32において、バックライトユニット13の光は、トランジスタ914と液晶素子93 0LCとのコンタクト部、トランジスタ914、及び容量部916等を介して外部に取り 出される。

[0336]

図32では、トランジスタ914の半導体層と、ソース電極またはドレイン電極の一方と、が可視光に対する透過性を有する例を示す。ソース電極またはドレイン電極の一方は、 液晶素子930LCと電気的に接続されている。

【0337】

図32において、配線904は、トランジスタ914のソース電極またはドレイン電極の 他方として機能する。また、配線902は、トランジスタ914のゲートとして機能する 。これら配線は抵抗率の低い導電性材料を用いて形成されることが好ましい。配線902 及び配線904は遮光性を有していてもよい。図32に示すトランジスタ914はバック ゲートを有する。バックゲートの透光性は特に限定されない。

【0338】

図32では、容量部916において、それぞれ可視光に対する透過性を有する2つの導電 層の間に絶縁層が挟持されている。2つの導電層の一方である第1の導電層は、配線90 2と接続されている。2つの導電層の他方である第2の導電層は、半導体層と同一の工程 、同一の材料で形成されており、かつ、可視光に対する透過性を有する第3の導電層と接 続されている。第3の導電層は、ソース電極またはドレイン電極の一方と同一の工程、同 一の材料で形成されている。

[0339]

トランジスタ914、容量部916等が有する透光性の領域の面積が広いほど、バックラ イトユニット13の光を効率良く使用することができる。

[0340]

本実施の形態の表示装置は、トランジスタが可視光を透過する領域を有するため、画素の 開口率を高めることができる。これにより、表示装置の消費電力を低減させることができ る。また、表示装置の高精細化を実現できる。

【0341】

本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。また、本明細書にお いて、1つの実施の形態の中に、複数の構成例が示される場合は、構成例を適宜組み合わ せることが可能である。

[0342]

(実施の形態2)

本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置について図33~図50を用いて説明する

【0343】

<1.表示装置の構成例1>

20

まず、図33~図35を用いて、本実施の形態の表示装置について説明する。

【0344】

本実施の形態の表示装置は、液晶素子、第1の絶縁層、及びトランジスタを有する。液晶 素子は、画素電極、液晶層、及び共通電極を有する。第1の絶縁層は、画素電極とトラン ジスタの間に位置する。第1の絶縁層は、開口部を有する。トランジスタは、画素電極と 電気的に接続される。

(40)

【0345】

トランジスタは、第1の領域を有する。トランジスタは、画素電極と接する第1の部分と 、第1の絶縁層が有する開口部の側面と接する第2の部分と、を有する。画素電極、共通 電極、及び第1の領域は、可視光を透過する機能を有する。可視光は、第1の領域及び液 晶素子を透過して、表示装置の外部に射出される。トランジスタが有する第1の領域は、 画素電極と接続される領域であってもよい。

【 0 3 4 6 】

本実施の形態の表示装置は、トランジスタが可視光を透過する領域を有する。例えば、ト ランジスタと画素電極のコンタクト部が、可視光を透過するため、当該コンタクト部を表 示領域に設けることができる。これにより、画素の開口率を高め、表示装置の消費電力を 低減させることができる。また、表示装置の高精細化を実現できる。

【0347】

また、本実施の形態の表示装置では、液晶素子の電極が平坦に設けられる。具体的には、 画素電極ではなく、トランジスタの構成要素が、トランジスタと画素電極との間の絶縁層 に設けられた開口部を埋めるように設けられる。そのため、トランジスタと画素電極のコ ンタクト部において、画素電極に凹凸が形成されることを抑制できる。液晶素子の電極を 平坦に形成することで、液晶素子のセルギャップのばらつきを低減することができる。ま た、液晶の初期配向のばらつきを低減することができる。これにより、表示装置における 、表示不良の抑制が可能となる。また、液晶の配向不良に起因する開口率の縮小を抑制で きる。

[0348]

本実施の形態の表示装置は、さらに、走査線及び信号線を有する。走査線及び信号線は、 それぞれ、トランジスタと電気的に接続される。走査線及び信号線は、それぞれ、金属層 を有する。走査線及び信号線に金属層を用いることで、走査線及び信号線の抵抗値を下げ ることができる。

【0349】

また、走査線は、トランジスタのチャネル領域と重なる部分を有することが好ましい。ト ランジスタのチャネル領域に用いる材料によっては、光が照射されることでトランジスタ の特性が変動することがある。走査線が、トランジスタのチャネル領域と重なる部分を有 することで、外光またはバックライトの光などが、チャネル領域に照射されることを抑制 できる。これにより、トランジスタの信頼性を高めることができる。

【0350】

図33(A)に示す表示装置20Aは、基板11、基板12、接着層16、トランジスタ 14、及び液晶素子15等を有する。表示装置20Aの基板12側に、バックライトユニ ット13が配置されている。

【0351】

液晶素子15は、画素電極21、液晶層22、及び共通電極23を有する。トランジスタ 14は、画素電極21と接する部分と、絶縁層26が有する開口部の側面と接する部分と 、を有する。このように、画素電極21とトランジスタ14とは、絶縁層26に設けられ た開口を介して、互いに電気的に接続されている。導電層25は、接続体29を介して、 共通電極23と電気的に接続されている。導電層25は、画素電極21と同一の工程及び 同一の材料を用いて形成することができる。

【 0 3 5 2 】

バックライトユニット13からの光45aは、基板12、接着層16、絶縁層26、画素

20

電極 2 1、液晶層 2 2、共通電極 2 3、及び基板 1 1 を介して、表示装置 2 0 A の外部に 射出される。光 4 5 a が透過するこれらの層の材料には、可視光を透過する材料を用いる

(41)

【0353】

バックライトユニット13からの光45 bは、基板12、接着層16、トランジスタ14 、絶縁層26、画素電極21、液晶層22、共通電極23、及び基板11を介して、表示 装置20Aの外部に射出される。本実施の形態において、液晶素子15と電気的に接続さ れるトランジスタ14は、可視光を透過する領域を有する構成である。したがって、トラ ンジスタ14が設けられている領域も、表示領域として使用することができる。これによ り、画素の開口率を高めることができる。開口率が高いほど光取り出し効率を高めること ができる。したがって、表示装置の消費電力を低減することができる。また、高精細な表 示装置を実現できる。

【 0 3 5 4 】

本発明の一態様の表示装置の作製方法では、第1の基板上に、液晶素子の電極を形成した 後に、トランジスタを形成する。次に、第1の基板と第2の基板を貼り合わせる。そして 、第1の基板と第2の基板を分離することで、液晶素子の電極及びトランジスタを第1の 基板から第2の基板に転置する。液晶素子の電極をトランジスタよりも先に形成すること で、画素電極とトランジスタのコンタクト部、及びトランジスタ自体に起因する凹凸の影 響を受けず、液晶素子の電極を平坦に形成することができる。液晶素子の電極を平坦に形 成することで、液晶素子のセルギャップのばらつきを低減することができる。また、液晶 の初期配向のばらつきを低減することができる。これにより、表示装置における、表示不 良の抑制が可能となる。また、液晶の配向不良に起因する開口率の縮小を抑制できる。

【 0 3 5 5 】

さらに、本発明の一態様の表示装置の作製方法では、トランジスタを形成する際に用いる 第1の基板が作製工程中で分離される。つまり、表示装置の構成要素に含まれる基板の材 質によって、トランジスタの作製条件が限定されない。例えば、第1の基板上で高い温度 をかけてトランジスタを作製することで、トランジスタの信頼性を高めることができる。 そして、トランジスタ等を転置する第2の基板、及び、第2の基板と共に液晶層を封止す る対向基板に、第1の基板よりも、軽量、薄型、または可撓性の高い基板を用いることで 、表示装置の軽量化、薄型化、またはフレキシブル化が可能となる。

【0356】

図33(B)に示す表示装置20Bは、基板11側に、バックライトユニット13が配置 されている点で、表示装置20Aと異なる。その他の構成は、表示装置20Aと同様であ るため、説明を省略する。

【 0 3 5 7 】

表示装置20Aでは、光45bは、まず、トランジスタ14が有する可視光を透過する領 域に入射する。そして、当該領域を透過した光45bは、液晶素子15に入射する。一方 、表示装置20Bでは、光45bは、まず、液晶素子15に入射する。そして、液晶素子 15を透過した光45bは、トランジスタ14が有する可視光を透過する領域に入射する 。このように、バックライトユニット13からの光は、トランジスタ14と液晶素子15 のどちらに先に入射してもよい。

【 0 3 5 8 】

また、表示装置20Bでは、トランジスタ14における画素電極21と接続される部分が 、可視光を透過する例を示す。光45bは、トランジスタ14と画素電極21とのコンタ クト部を透過する。つまり、トランジスタ14と画素電極21とのコンタクト部を、表示 領域として使用することができる。これにより、画素の開口率を高めることができる。ま た、表示装置の消費電力を低減することができる。

【0359】

本発明の一態様の表示装置は、タッチセンサが搭載された表示装置(入出力装置またはタ ッチパネルともいう)に適用することができる。タッチセンサは、液晶素子及びトランジ 10



スタよりも表示面側に位置する。

【 0 3 6 0 】

図 3 4 (A) に示す表示装置 3 5 A は、表示装置 2 0 A の基板 1 1 側に、タッチセンサユ ニット 3 1 が配置された構成である。

【0361】

図34(B)に示す表示装置35Bは、表示装置20Aの基板11と共通電極23との間 に、タッチセンサユニット31及び絶縁層32が設けられた構成である。さらに、表示装 置35Bは、導電層27及び導電層28を有する。

【 0 3 6 2 】

導電層28は、タッチセンサユニット31と電気的に接続されている。導電層28は、接 続体29を介して、導電層27と電気的に接続されている。これにより、一つの基板側に のみFPCを配置しても、液晶素子15を駆動する信号とタッチセンサユニット31を駆 動する信号の双方を表示装置35Bに供給することができる。または、液晶素子15を駆 動する信号を供給するFPCとタッチセンサユニット31を駆動する信号を供給するFP Cとを同一面上に接続させることができる。一対の基板のそれぞれにFPC等を接続する 必要がなく、表示装置の構成をより簡略化できる。基板11側と基板12側の双方にFP Cを接続する場合に比べて、電子機器に組み込みやすく、また、部品点数を削減できる。 なお、本発明の一態様の表示装置には、1つまたは複数のFPCを接続させることができ る。導電層27は、画素電極21と同一の工程及び同一の材料を用いて形成することがで きる。導電層28は、共通電極23と同一の工程及び同一の材料を用いて形成することが

[0363]

表示装置 3 5 B では、一対の基板間に、タッチセンサユニット 3 1 を設けることができる ため、基板枚数を削減し、表示装置の軽量化及び薄型化を実現できる。

【 0 3 6 4 】

図34(C)に示す表示装置35Cは、表示装置20Bの基板12とトランジスタ14と の間に、タッチセンサユニット31及び絶縁層32が設けられた構成である。さらに、表 示装置35Cは、導電層33を有する。

【0365】

絶縁層26に接して、トランジスタ14が有する導電層の一つまたは複数と同一の工程、 及び同一の材料で形成された導電層33が設けられている。導電層33は、タッチセンサ ユニット31と電気的に接続されている。表示装置35Cでは、一つの基板側にのみFP Cを配置しても、液晶素子15を駆動する信号とタッチセンサユニット31を駆動する信 号の双方を表示装置35Cに供給することができる。または、液晶素子15を駆動する信 号を供給するFPCとタッチセンサユニット31を駆動する信号を供給するFPCとを同 一面上に接続させることができる。そのため、電子機器に組み込みやすく、また、部品点 数を削減できる。

[0366]

表示装置35Cでは、一対の基板間に、タッチセンサユニット31を設けることができる ため、基板枚数を削減し、表示装置の軽量化及び薄型化を実現できる。

【 0 3 6 7 】

「画素について」

次に、本実施の形態の表示装置が有する画素について、図35を用いて説明する。なお、 実施の形態1で図3を用いて説明した内容も参酌することができる。

[0368]

図35(A1)に、画素900の上面概略図を示す。図35(A1)に示す画素900は 、4つの副画素を有する。図35(A1)では、画素900において、副画素が縦に2つ 、横に2つ配列している例を示している。各副画素には、透過型の液晶素子930LC( 図35(A1)(A2)には図示しない)及びトランジスタ914等が設けられている。 図35(A1)では、画素900に、配線902及び配線904が、それぞれ2本ずつ設

10

けられている。図35(A1)に示す各副画素では、液晶素子の表示領域(表示領域91 8R、表示領域918G、表示領域918B、及び表示領域918W)を示している。 【0369】

画素900は、配線902及び配線904等を有する。配線902は、例えば走査線とし て機能する。配線904は、例えば信号線として機能する。配線902と配線904とは 、互いに交差する部分を有する。

【0370】

トランジスタ914は、選択トランジスタとして機能する。トランジスタ914のゲートは、配線902と電気的に接続されている。トランジスタ914のソースまたはドレインの一方は、配線904と電気的に接続されており、他方は、液晶素子930LCと電気的に接続されている。

【0371】

ここで、配線902及び配線904は遮光性を有する。またこれ以外の層、すなわち、ト ランジスタ914、トランジスタ914に接続する配線、コンタクト部、容量等を構成す る各層には、透光性を有する膜を用いると好適である。図35(A2)は、図35(A1) に示す画素900を、可視光を透過する透過領域900tと、可視光を遮る遮光領域9 00sと、に分けて明示した例である。このように、透光性を有する膜を用いてトランジ スタを作製することで、配線902及び配線904が設けられる部分以外を透過領域90 0tとすることができる。液晶素子の透過領域をトランジスタ、トランジスタに接続する 配線、コンタクト部、容量等と重ねることができるため、画素の開口率を高めることがで きる。

【0372】

また、図35(A2)に示す一点鎖線A - Bの切断面に相当する断面図を図35(B)、 (C)に示す。なお、図35(B)、(C)では、上面図において図示していない、液晶 素子930LC、着色膜932CF、遮光膜932BM、容量素子915、駆動回路部9 01等の断面も合わせて図示している。駆動回路部901は、走査線駆動回路部または信 号線駆動回路部として用いることができる。また、駆動回路部901は、トランジスタ9 11を有する。

【0373】

図35(B)、(C)に示すように、バックライトユニット13からの光は、破線の矢印 に示す方向に射出される。バックライトユニット13の光は、トランジスタ914と液晶 素子930LCとのコンタクト部、トランジスタ914、及び容量素子915等を介して 外部に取り出される。したがって、トランジスタ914、及び容量素子915を構成する 膜などについても、透光性を有すると好ましい。トランジスタ914、容量素子915等 が有する透光性の領域の面積が広いほど、バックライトユニット13の光を効率良く使用 することができる。

[0374]

なお、図35(B)、(C)に示すように、バックライトユニット13からの光は、着色膜932CFを介して外部に取り出してもよい。着色膜932CFを介して取り出すことで、所望の色に着色することができる。

【0375】

図35(B)では、バックライトユニット13からの光は、まず、着色膜932CFに入 射する。そして、着色膜932CFを透過した光は、液晶素子930LCに入射する。そ して、液晶素子930LCを透過した光は、トランジスタ914、及び容量素子915等 を介して外部に取り出される。

【 0 3 7 6 】

図35(C)では、バックライトユニット13からの光は、まず、トランジスタ914、 及び容量素子915等に入射する。そして、トランジスタ914、及び容量素子915等 を透過した光は、液晶素子930LCに入射する。そして、液晶素子930LCを透過し た光は、着色膜932CFを介して外部に取り出される。 10

[0377]

図35に示すトランジスタ、配線、容量素子等は、実施の形態1で例示した材料を用いて 形成することができる。

【 0 3 7 8 】

本実施の形態に示す表示装置が有する画素の構成とすることで、バックライトユニットから射出される光を効率よく使用することができる。したがって、消費電力が抑制された、 優れた表示装置を提供することができる。

【0379】

< 2.表示装置の構成例 2 >

次に、図36~図37を用いて、本実施の形態の表示装置について説明する。図36(A)は、表示装置110の断面図である。表示装置110の斜視図は、表示装置100Aと 同様であるため、図4及び実施の形態1の記載を参照できる。図37は、タッチパネル3 55の断面図である。

【0380】

表示装置110は、横電界方式の液晶素子を用いた透過型の液晶表示装置の一例である。 【0381】

図36(A)に示すように、表示装置110は、基板51、接着層142、トランジスタ201、トランジスタ206、液晶素子40、配向膜133a、配向膜133b、接続部204、接着層141、スペーサ117、着色層131、遮光層132、基板61、及び 偏光板130等を有する。

【0382】

表示部62は、トランジスタ206及び液晶素子40を有する。

【0383】

トランジスタ206は、ゲート221、絶縁層213、及び半導体層(チャネル領域23 1 a 及び低抵抗領域231b)を有する。絶縁層213はゲート絶縁層として機能する。 低抵抗領域231bの抵抗率は、チャネル領域231aの抵抗率よりも低い。半導体層は 、可視光を透過することができる。本実施の形態では、半導体層として酸化物半導体層を 用いる場合を例に説明する。酸化物半導体層は、インジウムを含むことが好ましく、In - M - Zn酸化物(MはA1、Ti、Ga、Ge、Y、Zr、La、Ce、Nd、Snま たはHf)膜であることがさらに好ましい。酸化物半導体層の詳細は、後述する。

【 0 3 8 4 】

導電層 2 2 2 は、絶縁層 2 1 2 及び絶縁層 2 1 4 に設けられた開口を通じて、低抵抗領域 2 3 1 b と接続している。

【0385】

トランジスタ206は、絶縁層212及び絶縁層214に覆われている。なお、絶縁層2 12、さらには絶縁層214を、トランジスタ206の構成要素とみなすこともできる。 トランジスタは、トランジスタを構成する半導体への不純物の拡散を抑制する効果を奏す る絶縁層で覆われていることが好ましい。

[0386]

絶縁層213は、過剰酸素領域を有することが好ましい。絶縁層213が過剰酸素領域を 有することで、チャネル領域231a中に過剰酸素を供給することができる。チャネル領 域231aに形成されうる酸素欠損を過剰酸素により補填することができるため、信頼性 の高いトランジスタを提供することができる。

[0387]

絶縁層212は、窒素または水素を有することが好ましい。絶縁層212と、低抵抗領域 231 bと、が接することで、絶縁層212中の窒素または水素が低抵抗領域231 b中 に添加される。低抵抗領域231 bは、窒素または水素が添加されることで、キャリア密 度が高くなる。

【 0 3 8 8 】

液晶素子40は、FFSモードが適用された液晶素子である。液晶素子40は、画素電極

20

10

111、共通電極112、及び液晶層113を有する。画素電極111と共通電極112 との間に生じる電界により、液晶層113の配向を制御することができる。液晶層113 は、配向膜133aと配向膜133bの間に位置する。 [0389]画素電極111は、トランジスタ206が有する半導体層の低抵抗領域231bと電気的 に接続される。 [0390]接続部207では、半導体層の低抵抗領域231bが、画素電極111と接続している。 半導体層の低抵抗領域231bは、絶縁層211の開口部の側面と接する部分を有する。 半導体層の低抵抗領域231bは、絶縁層211の開口部の側面と接し、かつ、画素電極 111と接続する。これにより、画素電極111を平坦に設けることができる。 [0391]半導体層に、可視光を透過する材料を用いることで、接続部207を、画素の開口部69 (副画素の開口部、表示領域ともいえる)に設けることができる。 [0392]接続部207は基板61側に凹凸を有さない。そのため、接続部207と重なり、かつ接 続部207よりも基板61側に位置する、画素電極111、絶縁層220、共通電極11 2 及び配向膜133 aの基板61 側の表面は、それぞれ、平坦である。したがって、液晶 層113の接続部207と重なる部分を、他の部分と同様に表示に用いることができる。 すなわち、接続部207が設けられている領域を画素の開口部として用いることができる 。これにより、副画素の開口率を高めることができる。また、表示装置の消費電力を低減 することができる。 【0393】 なお、絶縁層212よりも基板51側に設けられた導電層を用いて、低抵抗領域231b と画素電極111を電気的に接続してもよい。その場合には当該導電層と低抵抗領域23 1 b との接続部と、当該導電層と画素電極111の接続部の2つの接続部を設ける必要が 生じる。一方、図36(A)等に示す構成では、接続部を減らすことが可能となる。その ため、デザインルールを変更することなく、画素を縮小することが可能で、高精細な表示 装置を実現できる。このように、半導体層の低抵抗領域231bが直接、画素電極111 と接続することにより、画素のレイアウトの自由度を高めることができる。 [0394]歯状の上面形状、またはスリットが設けられた 図 3 6 ( A ) に示す共通電極 1 1 2 は、 上面形状を有する。画素電極111と共通電極112の間には、絶縁層220が設けられ ている。画素電極111は、絶縁層220を介して共通電極112と重なる部分を有する 。また、画素電極111と着色層131とが重なる領域において、画素電極111上に共 通電極112が配置されていない部分を有する。 [0395] 液晶層113と接する配向膜を設けることが好ましい。配向膜は、液晶層113の配向を 制御することができる。表示装置110では、共通電極112及び絶縁層220と液晶層 113との間に配向膜133aが位置し、オーバーコート121と液晶層113との間に 配向膜133bが位置している。 [0396] 画素電極111は、絶縁層211に埋め込まれている。画素電極111の液晶層113側 の面は、絶縁層211の液晶層113側の面と同一面(または同一平面)を形成すること ができる。つまり、画素電極111の液晶層113側の面と、絶縁層211の液晶層11 3側の面とは、同一面上に位置する、同一面に接する、境界に段差が(実質的に)ない、 または高さが一致する等ということができる。 [0397] 表示装置110において、絶縁層211、絶縁層212、及び絶縁層214の厚さは、ト ランジスタ201及びトランジスタ206の特性に直接的な影響を与えない。そのため、

(45)

20

10

30

絶縁層211、絶縁層212、及び絶縁層214を、それぞれ、厚く設けることができる 。これにより、画素電極111とゲート221との間の寄生容量、画素電極111と導電 層222との間の寄生容量、または画素電極111と半導体層との間の寄生容量等を低減 することができる。

【 0 3 9 8 】

図36(B)に、表示装置110が有する画素の開口部69における、液晶層113とその周囲の断面図を示す。図36(B)に示すように、共通電極112は絶縁層220に埋め込まれている。共通電極112の液晶層113側の面と、絶縁層220の液晶層113側の面とは、同一面(または同一平面)を形成することができる。つまり、共通電極112の液晶層113側の面と、絶縁層220の液晶層113側の面とは、同一面上に位置する、同一面に接する、境界に段差が(実質的に)ない、または高さが一致する等ということができる。そして、配向膜133aは平坦に設けられる。 【0399】

ー方、図36(C)では、絶縁層220の液晶層113側の面上に共通電極112が設け られている。そして、配向膜133aは、共通電極112の厚みに起因した凹凸を有する (一点鎖線の枠内参照)。そのため、画素の開口部69内で、液晶層113の厚さ(セル ギャップともいえる)がばらつき、良好な表示が得られにくくなる場合がある。 【0400】

また、共通電極112の端部付近では、配向膜133aの表面の凹凸に起因して、液晶層 113の初期配向がばらつきやすくなる場合がある。液晶層113の初期配向が揃いにく い領域を表示に用いると、コントラストが低下することがある。また、隣接する2つの副 画素間に、液晶層113の初期配向が揃いにくい領域が生じた場合は、当該領域を遮光層 132等で覆うことでコントラストの低下を抑制できるが、開口率が低下することがある

【0401】

図36(A)、(B)に示すように、共通電極112の液晶層113側の面と、絶縁層2 20の液晶層113側の面とが、同一面を形成することができると、画素の開口部69内 で、配向膜133aと配向膜133bの間隔を均一にすることができる。つまり、共通電 極112の厚さが、液晶層113の厚さに影響を与えない。液晶層113の厚さは、画素 の開口部69内で均一となる。これにより、表示装置110は、色再現性を高め、良好な 表示を行うことができる。

[0402]

また、配向膜133 a が平坦に設けられることで、共通電極112の端部においても、初 期配向を揃えやすくなる。隣接する2つの副画素間に、液晶層113の初期配向が揃いに くい領域が生じることを抑制できる。したがって、開口率を高めることができ、表示装置 の高精細化が容易となる。また、表示装置の消費電力を低減させることができる。

【0403】

以上のように、本発明の一態様の表示装置では、共通電極112の端部に生じる段差を低 減し、段差に基づく配向欠陥を生じにくくすることができる。

[0404]

表示装置110は、透過型の液晶表示装置であるため、画素電極111及び共通電極11 2の双方に、可視光を透過する導電性材料を用いる。画素電極111及び共通電極112 のうち、少なくとも一方に酸化物導電層を用いることが好ましい。なお、画素電極111 及び共通電極112のうち、少なくとも一方を、酸化物半導体を用いて形成してもよい。 同一の金属元素を有する酸化物半導体を、表示装置を構成する層のうち2層以上に用いる ことで、製造装置(例えば、成膜装置、加工装置等)を2以上の工程で共通で用いること が可能となるため、製造コストを抑制することができる。

【0405】

画素電極111と半導体層の双方に酸化物を用いることが好ましい。例えば、一方に酸化物以外の材料(金属など)を用い、他方に酸化物を用いると、当該酸化物以外の材料が酸

10

化して画素電極111と半導体層の間に生じる接触抵抗が増大するなどの不具合が生じる 場合がある。画素電極111と半導体層の双方に酸化物を用いることで、接触抵抗が低減 され、表示装置110の信頼性を高めることができる。 [0406]画素電極111と半導体層の双方に、同一の金属元素を有する酸化物半導体を用いること で、画素電極111と半導体層の低抵抗領域231bとの密着性を高められる場合がある [0407] 例えば、絶縁層211に水素を含む窒化シリコン膜を用い、画素電極111に酸化物半導 体を用いると、絶縁層211から供給される水素によって、酸化物半導体の導電率を高め ることができる。 [0408]例えば、絶縁層220に水素を含む窒化シリコン膜を用い、共通電極112に酸化物半導 体を用いると、絶縁層220から供給される水素によって、酸化物半導体の導電率を高め ることができる。 [0409]トランジスタ201及びトランジスタ206は、絶縁層215で覆われており、絶縁層2 15上には、着色層131及び遮光層132が設けられている。着色層131は、少なく とも、画素の開口部69(副画素の開口部ともいえる)と重なる部分に位置する。画素( 副画素)が有する遮光領域67には、遮光層132が設けられている。遮光層132は、 トランジスタ206の少なくとも一部と重なる。着色層131及び遮光層132上には、 接着層142を介して、基板51が貼り合わされている。 [0410]スペーサ117は、基板51と基板61との距離が一定以上近づくことを防ぐ機能を有す る。図36(A)では、スペーサ117の底面が、基板61と接している例を示す。また 、図36(A)では、スペーサ117と重なる部分で、配向膜133aと配向膜133b が接する例を示す。 [0411]基板51及び基板61は、接着層141によって貼り合わされている。基板51、基板6 1、及び接着層141に囲まれた領域に、液晶層113が封止されている。 [0412]表示装置110を、透過型の液晶表示装置として機能させる場合、偏光板を、表示部62 を挟むように2つ配置する。図36(A)では、基板51側の偏光板130を図示してい る。基板61側に設けられた偏光板よりも外側に配置されたバックライトからの光45は 偏光板を介して入射する。このとき、画素電極111と共通電極112の間に与える電圧 によって液晶層113の配向を制御し、光の光学変調を制御することができる。すなわち 、偏光板130を介して射出される光の強度を制御することができる。また、入射光は着 色層131によって特定の波長領域以外の光が吸収されるため、射出される光は例えば赤 色、青色、または緑色を呈する光となる。 [0413]駆動回路部64は、トランジスタ201を有する。 【0414】 トランジスタ201は、ゲート221、絶縁層213、半導体層(チャネル領域231a 及び低抵抗領域231b)、導電層222a、及び導電層222bを有する。導電層22 2 a 及び導電層 2 2 2 b のうち、一方はソースとして機能し、他方はドレインとして機能 する。導電層222a及び導電層222bは、それぞれ、低抵抗領域231bと電気的に 接続される。 【0415】 接続部204では、配線65と導電層255が互いに接続し、導電層255と導電層25 3が互いに接続し、導電層253と導電層251が互いに接続している。導電層251と

(47)

20

10

30

接続体242は互いに接続している。つまり、接続部204は接続体242を介してFP C72と電気的に接続している。このような構成とすることで、FPC72から、配線6 5 に、信号及び電力を供給することができる。 [0416]配線65は、トランジスタ206が有する導電層222と同一の材料、同一の工程で形成 することができる。導電層255は、半導体層の低抵抗領域231bと同一の材料、同一 の工程で形成することができる。導電層253は、液晶素子40が有する画素電極111 と同一の材料、同一の工程で形成することができる。導電層251は、液晶素子40が有 する共通電極112と同一の材料、同一の工程で形成することができる。このように、接 続部204を構成する導電層を、表示部62や駆動回路部64に用いる導電層と同一の材 料、同一の工程で作製すると、工程数の増加を防ぐことができ好ましい。 [0417]図37に示すタッチパネル355は、図36(A)に示す表示装置110の構成に加えて 、以下の構成を有する。表示装置110と共通する構成については、説明を省略する。 [0418]タッチパネル355は、着色層131と、接着層142との間に、オーバーコート121 及びタッチセンサを有する。 [0419]着色層131及び遮光層132上には、オーバーコート121を設けることが好ましい。 オーバーコート121は、着色層131及び遮光層132等に含まれる不純物がタッチセ ンサに拡散することを抑制できる。 [0420]オーバーコート121上には、電極127、電極128、及び配線136が設けられてい る。電極127、電極128、及び配線136上に、絶縁層125が設けられている。絶 縁層125上に、電極124及び導電層126が設けられている。電極124は、絶縁層 125に設けられた開口を介して、電極127を挟むように設けられる2つの電極128 と電気的に接続している。導電層126は、絶縁層125に設けられた開口を介して、配 線136と電気的に接続されている。電極124及び導電層126上に、接着層142を 介して基板51が貼り合わされている。 【0421】 本発明の一態様では、液晶素子の電極、トランジスタ、着色層、タッチセンサ等を同一の 基板上に形成することができる。そのため、基板61側の構成要素の数を減らすことがで きる。 [0422] また、トランジスタとタッチセンサの間に着色層を配置することで、トランジスタとタッ チセンサの距離を離すことができる。これにより、トランジスタの駆動時のノイズがタッ チセンサに伝搬することを抑制できる。これによりタッチセンサを安定に動作させること ができる。なお、トランジスタとタッチセンサの間に、ノイズを遮蔽するためのシールド として機能する層を設けてもよい。例えば、定電位が供給される導電層を、配置してもよ ι١. 【0423】 入力装置が有する導電層のうち、開口部69と重なる導電層(電極127、128等)に は、可視光を透過する材料を用いる。

【0424】

なお、入力装置が有する導電層を遮光領域67にのみ配置してもよい。入力装置が有する 導電層を開口部69と重ねない構成とすることで、入力装置が有する導電層の材料の可視 光の透過性が限定されない。入力装置が有する導電層に、金属等の抵抗率の低い材料を用 いることができる。例えば、タッチセンサの配線及び電極として、メタルメッシュを用い ることが好ましい。これにより、タッチセンサの配線及び電極の抵抗を下げることができ る。また、大型の表示装置のタッチセンサとして好適である。なお、一般的に金属は反射 10

20

率が大きい材料であるが、酸化処理などを施すことにより暗色にすることができる。した がって、表示面側から視認した場合においても、外光の反射による視認性の低下を抑える ことができる。

【 0 4 2 5 】

また、当該配線及び当該電極を、金属層と反射率の小さい層(「暗色層」ともいう。)の 積層で形成してもよい。暗色層の一例としては、酸化銅を含む層、塩化銅または塩化テル ルを含む層などがある。また、暗色層を、Ag粒子、Agファイバー、Cu粒子等の金属 微粒子、カーボンナノチューブ(CNT)、グラフェン等のナノ炭素粒子、並びに、PE DOT、ポリアニリン、ポリピロールなどの導電性高分子などを用いて形成してもよい。 【0426】

導電層126は、配線65、導電層255、導電層253、導電層251、及び接続体2 42を介してFPC72と電気的に接続される。これにより、一つの基板側にのみFPC を配置しても、液晶素子40を駆動する信号とタッチセンサを駆動する信号の双方を供給 することができる。または、液晶素子40を駆動する信号を供給するFPCとタッチセン サを駆動する信号を供給するFPCとを同一面上に接続させることができる。一対の基板 のそれぞれにFPC等を接続する必要がなく、表示装置の構成をより簡略化できる。基板 51側と基板61側の双方にFPCを接続する場合に比べて、電子機器に組み込みやすく 、また、部品点数を削減できる。なお、表示装置には、1つまたは複数のFPCを接続さ

【0427】

バックライトからの光は、基板61、液晶素子40を透過した後、トランジスタと画素電 極111のコンタクト部に入射する。本発明の一態様では、トランジスタと画素電極11 1のコンタクト部が可視光を透過する構成であるため、当該コンタクト部を開口部69に 設けることができる。当該コンタクト部を透過した光は、着色層131、タッチセンサ、 基板51等を透過して、タッチパネル355の外部に射出される。

[0428]

本実施の形態の表示装置及びタッチパネルの各構成要素に用いることができる材料等の詳 細は、実施の形態1を参照できる。

【0429】

< 3 . 表示装置の構成例 3 >

図38~図41に、表示装置の一例をそれぞれ示す。図38は、表示装置110Aの断面 図であり、図39は、本発明の一態様の表示装置が有する副画素の上面図であり、図40 は、表示装置110Bの断面図であり、図41は、タッチパネル355Aの断面図である 。なお、表示装置110A、表示装置110B、及びタッチパネル355Aの斜視図は、 図4に示す表示装置100Aと同様であるため、ここでの説明は省略する。

【0430】

図38に示す表示装置110Aは、先に示す表示装置110と、画素電極111と共通電 極112の位置関係が異なる。

【0431】

図36(A)に示す表示装置110は、配向膜133aと共通電極112とが接する構成 である。一方、図38に示す表示装置110Aは、配向膜133aと画素電極111とが 接する構成である。

【0432】

図38に示すように、表示装置110Aでは、半導体層の低抵抗領域231bが、絶縁層 211及び絶縁層220の開口部の側面と接し、かつ、画素電極111と接続する。これ により、画素電極111を平坦に設けることができる。

【0433】

表示装置110Aにおいて、共通電極112は絶縁層211に埋め込まれている。共通電 極112の液晶層113側の面は、絶縁層211の液晶層113側の面と同一面を形成す ることができる。 20

10



【0434】

画素電極111は、絶縁層220に埋め込まれている。画素電極111の液晶層113側の面は、絶縁層220の液晶層113側の面と同一面を形成することができる。そして、 配向膜133aは平坦に設けられる。

【0435】

図38に示すように、画素電極111の液晶層113側の面と、絶縁層220の液晶層1 13側の面とが、同一面を形成することができると、画素の開口部69内で、配向膜13 3aと配向膜133bの間隔を均一にすることができる。つまり、画素電極1110の厚さ が、液晶層113の厚さに影響を与えない。液晶層113の厚さは、画素の開口部69内 で均一となる。これにより、表示装置110Aは、色再現性を高め、良好な表示を行うこ とができる。

【0436】

また、配向膜133aが平坦に設けられることで、画素電極111の端部においても、初 期配向を揃えやすくなる。隣接する2つの副画素間に、液晶層113の初期配向が揃いに くい領域が生じることを抑制できる。したがって、開口率を高めることができ、表示装置 の高精細化が容易となる。

【0437】

図39(A)、(B)に、本発明の一態様の表示装置が有する副画素の上面図を示す。図 39(A)は、副画素のうち、共通電極112から導電層222までの積層構造(例えば、図40参照)を、共通電極112側から見た上面図である。図39(A)には、副画素の開口部69を一点鎖線の枠で示す。図39(B)は、図39(A)の積層構造から共通 電極112を除いた上面図である。

20

30

40

10

【0438】

図40に、表示装置110Bの断面図を示す。図40に示す表示装置110Bは、先に示 す表示装置110の構成に加え、絶縁層211b及びゲート223を有する。

【0439】

本発明の一態様の表示装置では、チャネルの上下にゲートが設けられているトランジスタ を適用することができる。

[0440]

図 3 9 に示すコンタクト部Q1において、ゲート221及びゲート223は、電気的に接 続されている。

【0441】

図39に示すコンタクト部Q2において、半導体層の低抵抗領域231bが、画素電極1 11と接続している。半導体層に可視光を透過する材料を用いることで、コンタクト部Q 2を副画素の開口部69に設けることができる。これにより、副画素の開口率を高めるこ とができる。また、表示装置の消費電力を低減することができる。

【0442】

図39において、1つの導電層が、走査線228及びゲート223として機能するともい える。図39において、1つの導電層が、信号線229及び導電層222として機能する ともいえる。

【0443】

ゲート221、223には、それぞれ、金属材料及び酸化物導電体(OC)の一方を単層 で、または双方を積層して用いることができる。例えば、ゲート221及びゲート223 のうち、一方に、酸化物導電体を用い、他方に金属材料を用いてもよい。

[0444]

トランジスタ206は、半導体層として酸化物半導体層を用い、ゲート221及びゲート 223のうち、少なくとも一方に酸化物導電層を用いる構成とすることができる。このと き、酸化物半導体層と酸化物導電層を、酸化物半導体を用いて形成することが好ましい。 【0445】

ゲート223に可視光を遮る導電層を用いることで、バックライトの光がチャネル領域2

31 a に照射されることを抑制できる。このように、チャネル領域231 a を、可視光を 遮る導電層と重ねると、光によるトランジスタの特性変動を抑制できる。これにより、ト ランジスタの信頼性を高めることができる。 [0446]チャネル領域231aの基板51側に、遮光層132が設けられ、チャネル領域231a の基板61側に、可視光を遮るゲート223が設けられていることで、バックライトの光 及び外光が、チャネル領域231aに照射されることを抑制できる。 [0447]図39(A)及び図40では、1つの副画素の開口部69に、共通電極112の開口が1 つ設けられている例を示す。 [0448]< 4.表示装置の作製方法例> 図 4 1 に示すタッチパネル 3 5 5 A の作製方法の一例について、図 4 2 ~ 図 4 7 を用いて 説明する。なお、本作製方法例において、作製するトランジスタや液晶素子の構成を変え ることで、本実施の形態の他の表示装置及びタッチパネルも作製することができる。 [0449]作製基板上に機能素子を形成した後、機能素子を作製基板から分離して別の基板に転置す ることができる。この方法によれば、例えば、耐熱性の高い作製基板上で形成した機能素 子を、耐熱性の低い基板に転置することができる。このため、機能素子の作製温度が、耐 熱性の低い基板によって制限されない。また、作製基板に比べて軽い、薄い、または可撓 性が高い基板等に機能素子を転置することが可能であり、半導体装置、表示装置等の各種 装置の軽量化、薄型化、フレキシブル化を実現できる。 【0450】 具体的には、第1の基板上に分離層を形成し、分離層上に機能素子を形成し、第1の基板 と第2の基板とを、接着層を用いて貼り合わせた後、分離層を用いて第1の基板と第2の 基板を分離することで、第1の基板上で形成した機能素子を第2の基板に転置することが できる。 [0451]分離層に用いることができる材料は、例えば無機材料または有機材料等が挙げられる。 [0452] 無機材料としては、タングステン、モリブデン、チタン、タンタル、ニオブ、ニッケル、 コバルト、ジルコニウム、亜鉛、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリ ジウム、シリコンから選択された元素を含む金属、該元素を含む合金または該元素を含む 化合物等を挙げることができる。 【0453】 有機材料としては、ポリイミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリカー ボネート若しくはアクリル樹脂等を挙げることができる。 [0454]分離層は、単層構造または積層構造等を有していてもよい。例えば、タングステンを含む 層とタングステンの酸化物を含む層の積層構造を適用できる。また、金属酸化物層と樹脂 層の積層構造を適用できる。 【0455】 分離層の材料によって、分離界面は異なる。具体的には、第1の基板と分離層との界面、 分離層中、または分離層と分離層に接して設けられた被剥離層との界面で、分離が生じる [0456] 本実施の形態では、金属酸化物層と樹脂層の積層構造を分離層に用いて、金属酸化物層と 樹脂層の界面(分離層中ともいえる)で分離させる例を示す。

【0457】

まず、図42(A)に示すように、作製基板301上に金属酸化物層303を形成し、金

(51)

10

20

30

40

属酸化物層303上に、樹脂層305を形成する。

【0458】

作製基板301は、搬送が容易となる程度に剛性を有し、かつ作製工程にかかる温度に対して耐熱性を有する。作製基板301に用いることができる材料としては、例えば、ガラス、石英、セラミック、サファイア、樹脂、半導体、金属または合金などが挙げられる。 ガラスとしては、例えば、無アルカリガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス等が挙げられる。

【0459】

作製基板301の厚さは、例えば、0.5mm以上1mm以下であり、具体的には0.5 mmや0.7mmが挙げられる。

[0460]

金属酸化物層303には、各種金属の酸化物を用いることができる。金属酸化物としては、例えば、酸化チタン(TiO<sub>X</sub>)、酸化モリブデン、酸化アルミニウム、酸化タングステン、シリコンを含むインジウム錫酸化物(ITSO)、インジウム亜鉛酸化物、In-Ga-Zn酸化物等が挙げられる。

【0461】

そのほか、金属酸化物としては、酸化インジウム、チタンを含むインジウム酸化物、タン グステンを含むインジウム酸化物、インジウム錫酸化物(ITO)、チタンを含むITO 、タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛(ZnO)、ガリウムを含むZn O、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ガリウム、酸化タンタ ル、酸化マグネシウム、酸化ランタン、酸化セリウム、酸化ネオジム、酸化スズ、酸化ビ スマス、チタン酸塩、タンタル酸塩、ニオブ酸塩等が挙げられる。

[0462]

金属酸化物層303の形成方法に特に限定は無い。例えば、スパッタリング法、プラズマ CVD法、蒸着法、ゾルゲル法、電気泳動法、スプレー法等を用いて形成することができ る。

[0463]

金属層を成膜した後に、当該金属層に酸素を導入することで、金属酸化物層303を形成 することができる。このとき、金属層の表面のみ、または金属層全体を酸化させる。前者 の場合、金属層に酸素を導入することで、金属層と金属酸化物層303との積層構造が形 成される。分離層は、金属層、金属酸化物層303、及び樹脂層305の積層構造であっ てもよい。

【0464】

例えば、酸素を含む雰囲気下で金属層を加熱することで、金属層を酸化させることができる。酸素を含むガスを流しながら金属層を加熱することが好ましい。金属層を加熱する温度は、100 以上500 以下が好ましく、100 以上450 以下がより好ましく、100 以上350 以下がさらに好ましい。

【0465】

金属層は、トランジスタの作製における最高温度以下で加熱されることが好ましい。これ により、表示装置の作製における最高温度が高くなることを防止できる。トランジスタの 作製における最高温度以下とすることで、トランジスタの作製工程における製造装置など を流用することが可能となるため、追加の設備投資などを抑制することができる。したが って、生産コストが抑制された表示装置とすることができる。例えば、トランジスタの作 製温度が350 までである場合、加熱処理の温度は350 以下とすることが好ましい

[0466]

または、金属層の表面にラジカル処理を行うことで金属層を酸化させることができる。ラ ジカル処理では、酸素ラジカル及びヒドロキシラジカルのうち少なくとも一方を含む雰囲 気に、金属層の表面を曝すことが好ましい。例えば、酸素または水蒸気(H<sub>2</sub>O)のうち 10

20

一方または双方を含む雰囲気でプラズマ処理を行うことが好ましい。

【0467】

金属酸化物層303の表面または内部に、水素、酸素、水素ラジカル(H<sup>\*</sup>)、酸素ラジ カル(O<sup>\*</sup>)、ヒドロキシラジカル(OH<sup>\*</sup>)等を含ませることで、金属酸化物層303 と樹脂層305との分離に要する力を低減できる。このことからも、金属酸化物層303 の形成に、ラジカル処理もしくはプラズマ処理を行うことは好適である。

【0468】

金属層の表面にラジカル処理もしくはプラズマ処理を行うことで金属層を酸化させる場合 、金属層を高温で加熱する工程が不要となる。そのため、表示装置の作製における最高温 度が高くなることを防止できる。

【 0 4 6 9 】

または、酸素雰囲気下で、金属酸化物層303を形成することができる。例えば、酸素を 含むガスを流しながら、スパッタリング法を用いて金属酸化物膜を成膜することで、金属 酸化物層303を形成できる。この場合も、金属酸化物層303の表面にラジカル処理を 行うことが好ましい。ラジカル処理では、酸素ラジカル、水素ラジカル、及びヒドロキシ ラジカルのうち少なくとも1種を含む雰囲気に、金属酸化物層303の表面を曝すことが 好ましい。例えば、酸素、水素、または水蒸気(H2O)のうち一つまたは複数を含む雰 囲気でプラズマ処理を行うことが好ましい。

【0470】

ラジカル処理は、プラズマ発生装置またはオゾン発生装置を用いて行うことができる。 【0471】

例えば、酸素プラズマ処理、水素プラズマ処理、水プラズマ処理、オゾン処理等を行うこ とができる。酸素プラズマ処理は、酸素を含む雰囲気下でプラズマを生成して行うことが できる。水素プラズマ処理は、水素を含む雰囲気下でプラズマを生成して行うことができ る。水プラズマ処理は、水蒸気(H<sub>2</sub>O)を含む雰囲気下でプラズマを生成して行うこと ができる。特に水プラズマ処理を行うことで、金属酸化物層303の表面または内部に水 分を多く含ませることができ好ましい。

【0472】

酸素、水素、水(水蒸気)、及び不活性ガス(代表的にはアルゴン)のうち2種以上を含む雰囲気下でのプラズマ処理を行ってもよい。当該プラズマ処理としては、例えば、酸素と水素とを含む雰囲気下でのプラズマ処理、酸素と水とを含む雰囲気下でのプラズマ処理、水とアルゴンとを含む雰囲気下でのプラズマ処理、酸素とアルゴンとを含む雰囲気下でのプラズマ処理などが挙 げられる。プラズマ処理のガスの一つとして、アルゴンガスを用いることで金属層または 金属酸化物層303にダメージを与えながら、プラズマ処理を行うことが可能となるため 好適である。

【0473】

2種以上のプラズマ処理を大気に暴露することなく連続で行ってもよい。例えば、アルゴ ンプラズマ処理を行った後に、水プラズマ処理を行ってもよい。

【0474】

そのほか、酸素、水素、水等の導入方法としては、イオン注入法、イオンドーピング法、 プラズマイマージョンイオン注入法等を用いることができる。

【0475】

金属酸化物層303の厚さは、例えば、1nm以上200nm以下が好ましく、5nm以 上100nm以下がより好ましく、5nm以上50nm以下がより好ましい。なお、金属 層を用いて金属酸化物層303を形成する場合、最終的に形成される金属酸化物層303 の厚さは、成膜した金属層の厚さよりも厚くなることがある。

【0476】

金属酸化物層303には、酸化チタン、酸化タングステン等が好適である。酸化チタンを 用いると、酸化タングステンよりもコストを低減でき、好ましい。 10

(54) [0477]樹脂層305は、各種樹脂材料(樹脂前駆体を含む)を用いて形成することができる。 [0478]樹脂層305は、熱硬化性を有する材料を用いて形成することが好ましい。 [0479]樹脂層305は、感光性を有する材料を用いて形成してもよく、感光性を有さない材料( 非感光性の材料ともいう)を用いて形成してもよい。 [0480]感光性を有する材料を用いると、フォトリソグラフィ法により、所望の形状の樹脂層30 5を形成することができる。具体的には、樹脂層305となる膜を成膜した後、溶媒を除 去するための熱処理(プリベーク処理)を行い、その後フォトマスクを用いて露光を行う 。続いて、現像処理を施すことで、不要な部分を除去することができる。 [0481]また、樹脂層305となる層または樹脂層305上にレジストマスク、ハードマスク等の マスクを形成し、エッチングすることで、所望の形状の樹脂層305を形成することがで きる。この方法は、非感光性の材料を用いる場合に特に好適である。 [0482] 例えば、樹脂層305上に無機膜を形成し、無機膜上にレジストマスクを形成する。レジ ストマスクを用いて、無機膜をエッチングした後、無機膜をハードマスクに用いて、樹脂 層305をエッチングすることができる。 【0483】 ハードマスクとして用いることができる無機膜としては、各種無機絶縁膜や、導電層に用 いることができる金属膜及び合金膜などが挙げられる。 [0484]マスクを極めて薄い厚さで形成し、エッチングと同時にマスクを除去することができると 、マスクを除去する工程を削減でき、好ましい。 [0485]樹脂層305は、ポリイミド樹脂またはポリイミド樹脂前駆体を含む材料を用いて形成さ れることが好ましい。樹脂層305は、例えば、ポリイミド樹脂と溶媒を含む材料、また はポリアミック酸と溶媒を含む材料等を用いて形成できる。ポリイミドは、表示装置の平 坦化膜等に好適に用いられる材料であるため、成膜装置や材料を共有することができる。 そのため本発明の一態様の構成を実現するために新たな装置や材料を必要としない。 [0486] そのほか、樹脂層305の形成に用いることができる樹脂材料としては、例えば、アクリ ル樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、シロキサン樹脂、ベン ゾシクロブテン系樹脂、フェノール樹脂、及びこれら樹脂の前駆体等が挙げられる。 [0487] 樹脂層305は、スピンコータを用いて形成することが好ましい。スピンコート法を用い ることで、大判基板に薄い膜を均一に形成することができる。 [0488]

10

20

40

50

樹脂層305は、粘度が5cP以上500cP未満、好ましくは5cP以上100cP未 満、より好ましくは10cP以上50cP以下の溶液を用いて形成することが好ましい。 溶液の粘度が低いほど、塗布が容易となる。また、溶液の粘度が低いほど、気泡の混入を 抑制でき、良質な膜を形成できる。

【0489】

そのほか、樹脂層305の形成方法としては、ディップ、スプレー塗布、インクジェット 、ディスペンス、スクリーン印刷、オフセット印刷、ドクターナイフ、スリットコート、 ロールコート、カーテンコート、ナイフコート等が挙げられる。 [0490]

加熱処理は、例えば、加熱装置のチャンバーの内部に、酸素、窒素、及び希ガス(アルゴ

ンなど)のうちーつまたは複数を含むガスを流しながら行うことができる。または、加熱 処理は、大気雰囲気下で加熱装置のチャンバー、ホットプレート等を用いて行うことがで きる。

【0491】

大気雰囲気下や酸素を含むガスを流しながら加熱を行うと、樹脂層 3 0 5 が酸化により着 色し、可視光に対する透過性が低下することがある。

【0492】

そのため、窒素ガスを流しながら、加熱を行うことが好ましい。これにより、樹脂層305の可視光に対する透過性を高めることができる。

【0493】

加熱処理により、樹脂層305中の脱ガス成分(例えば、水素、水等)を低減することが できる。特に、樹脂層305上に形成する各層の作製温度以上の温度で加熱することが好 ましい。これにより、トランジスタの作製工程における、樹脂層305からの脱ガスを大 幅に抑制することができる。

【0494】

例えば、トランジスタの作製温度が350 までである場合、樹脂層305となる膜を3
50 以上450 以下で加熱することが好ましく、400 以下がより好ましく、37
5 以下がさらに好ましい。これにより、トランジスタの作製工程における、樹脂層30
5からの脱ガスを大幅に抑制することができる。

【0495】

加熱処理の温度は、トランジスタの作製における最高温度以下とすることが好ましい。ト ランジスタの作製における最高温度以下とすることで、トランジスタの作製工程における 製造装置などを流用することが可能となるため、追加の設備投資などを抑制することがで きる。したがって、生産コストが抑制された表示装置とすることができる。例えば、トラ ンジスタの作製温度が350 までである場合、加熱処理の温度は350 以下とするこ とが好ましい。

[0496]

トランジスタの作製における最高温度と、加熱処理の温度を等しくすると、加熱処理を行うことで表示装置の作製における最高温度が高くなることを防止でき、かつ樹脂層305の脱ガス成分を低減できるため、好ましい。

【0497】

処理時間を長くすることで、加熱温度が比較的低い場合であっても、加熱温度がより高い 条件の場合と同等の剥離性を実現できる場合がある。そのため、加熱装置の構成により加 熱温度を高められない場合には、処理時間を長くすることが好ましい。

【0498】

加熱処理の時間は、例えば、5分以上24時間以下が好ましく、30分以上12時間以下 がより好ましく、1時間以上6時間以下がさらに好ましい。なお、加熱処理の時間はこれ に限定されない。例えば、加熱処理を、RTA(Rapid Thermal Anne aling)法を用いて行う場合などは、5分未満としてもよい。

【0499】

加熱装置としては、電気炉や、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱輻射によっ て被処理物を加熱する装置等、様々な装置を用いることができる。例えば、GRTA(G as Rapid Thermal Anneal)装置、LRTA(Lamp Rap id Thermal Anneal)装置等のRTA装置を用いることができる。LR TA装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボン アークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光(電磁 波)の輻射により、被処理物を加熱する装置である。GRTA装置は、高温のガスを用い て加熱処理を行う装置である。RTA装置を用いることによって、処理時間を短縮するこ とができるので、量産する上で好ましい。また、加熱処理はインライン型の加熱装置を用 いて行ってもよい。 10

[0500]

加熱処理を行う前に、樹脂層305となる膜に含まれる溶媒を除去するための熱処理(プ リベーク処理ともいう)を行ってもよい。プリベーク処理の温度は用いる材料に応じて適 宜決定することができる。例えば、50以上180以下、80以上150以下、 または90以上120以下で行うことができる。または、加熱処理がプリベーク処理 を兼ねてもよく、加熱処理によって、樹脂層305となる膜に含まれる溶媒を除去しても よい。

【0501】

樹脂層305は、可撓性を有する。作製基板301は、樹脂層305よりも可撓性が低い

[0502]

樹脂層305の厚さは、0.01µm以上10µm未満であることが好ましく、0.1µ m以上5µm以下であることがより好ましく、0.5µm以上3µm以下であることがさ らに好ましい。樹脂層を薄く形成することで、低コストで表示装置を作製できる。また、 表示装置の軽量化及び薄型化が可能となる。また、表示装置の可撓性を高めることができ る。低粘度の溶液を用いることで、樹脂層305を薄く形成することが容易となる。ただ し、これに限定されず、樹脂層305の厚さは、10µm以上としてもよい。例えば、樹 脂層305の厚さを10µm以上200µm以下としてもよい。樹脂層305の厚さを1 0µm以上とすることで、表示装置の剛性を高めることができるため好適である。 【0503】 樹脂層305の熱膨張係数は、0.1ppm/以上50ppm/以下であることが好 ましく、0.1ppm/以上20ppm/以下であることがより好ましく、0.1p

pm/以上10ppm/以上20ppm/以下であることがさらに好ましい。樹脂層305の熱膨張係 数が低いほど、加熱により、トランジスタ等を構成する層にクラックが生じることや、ト ランジスタ等が破損することを抑制できる。

【0504】

次に、樹脂層305上に、共通電極112及び導電層251を形成する。なお、共通電極 112を形成する前に、樹脂層305上に絶縁層(窒化物絶縁層、酸化物絶縁層等)を形 成してもよい。

【 0 5 0 5 】

本発明の一態様では、トランジスタを形成する前に共通電極112を形成するため、平坦 な面上に共通電極112を形成することができる。

[0506]

次に、共通電極112及び導電層251を覆う絶縁層220を形成する。次に、絶縁層2 20上に、画素電極111及び導電層253を形成する。次に、画素電極111及び導電 層253を覆う絶縁層211aを形成する(図42(B))。

【0507】

次に、絶縁層211a上に、ゲート223を形成し、ゲート223を覆う絶縁層211b を形成する(図42(C))。

【0508】

次に、絶縁層211a及び絶縁層211bの一部をエッチングすることで、画素電極11 1に達する開口部と導電層253に達する開口部を形成する(図43(A))。ここでは 、絶縁層211aと絶縁層211bをまとめてエッチングする例を示すが、本発明の一態 様はこれに限られない。

[0509]

次に、絶縁層に設けられた開口部を覆うように、島状の半導体層231を形成する(図4 3(B))。

【0510】

次に、半導体層231を覆う絶縁層213\_0を形成し、絶縁層213\_0上に導電層2 21\_0を形成する(図44(A))。 10



(57)

[0511]

次に、絶縁層213\_0及び導電層221\_0を加工することで、島状の絶縁層213及 び島状のゲート221を形成する。そして、絶縁層213及びゲート221を覆う絶縁層 212を形成する(図44(B))。

[0512]

窒素または水素を含む絶縁層212を形成すること、さらには加熱処理を行うことで、半 導体層のうちゲート221及び絶縁層213と重ならない部分に窒素または水素を供給し 、低抵抗領域231bを形成することができる。

【0513】

または、島状の絶縁層213及び島状のゲート221を形成後かつ絶縁層212を形成す る前に、半導体層231に不純物を添加し、低抵抗領域231bを形成してもよい。また は、絶縁層212を形成した後に、半導体層231に不純物を添加し、低抵抗領域231 bを形成してもよい。後述する絶縁層214、215の少なくとも一方を形成した後に半 導体層231に不純物を添加してもよい。

【0514】

半導体層のうちゲート221及び絶縁層213と重なる部分は、重ならない部分に比べて 不純物の供給が妨げられるため、抵抗率の低下が抑制され、チャネル領域231aとして 機能することができる。

[0515]

次に、絶縁層214を形成する。絶縁層212及び絶縁層214の一部をエッチングする ことで、低抵抗領域231bに達する開口部と導電層255に達する開口部を形成する。 なお、複数の絶縁層は、それぞれ別の工程で加工してもよいし、2層以上をまとめて加工 してもよい。次に、絶縁層に設けられた開口部を覆うように、低抵抗領域231b上に導 電層を形成し、当該導電層を所望の形状に加工することで、導電層222及び配線65を 形成する(図45(A))。

[0516]

次に、図45(B)に示すように、絶縁層215を形成し、絶縁層215上に、着色層1 31及び遮光層132を形成する。

[0517]

絶縁層215は平坦化機能を有していてもよい。

【0518】

着色層131は、感光性の材料を用いて形成することで、フォトリソグラフィ法等により 島状に加工することができる。遮光層132は、金属または樹脂等を用いて形成すること ができる。

【0519】

次に、着色層131及び遮光層132を覆うオーバーコート121を形成する。そして、 オーバーコート121及び絶縁層215に、配線65に達する開口部を設ける。

【 0 5 2 0 】

次に、オーバーコート121上に、検知素子を形成する。具体的には、オーバーコート1 21上に、電極127、電極128、及び配線136を形成する。配線136は、オーバ ーコート121及び絶縁層215に設けられた開口部を覆うように形成され、配線65と 電気的に接続する。次に、電極127、電極128、及び配線136を覆う絶縁層125 を形成する。絶縁層125に電極128に達する開口部と配線136に達する開口部を設 ける。次に、絶縁層125上に、電極124及び導電層126を設ける。電極124は、 絶縁層125に設けられた開口部を覆うように形成され、電極128と電気的に接続する 。導電層126は、絶縁層125に設けられた開口部を覆うように形成され、配線136 と電気的に接続する。 【0521】

その後、作製基板301と基板51とを、接着層142を用いて貼り合わせる(図45( B))。 10

20

【0522】

次に、図46に示すように、金属酸化物層303と樹脂層305とを分離する。

【 0 5 2 3 】

本実施の形態では、光を照射することで、金属酸化物層303と樹脂層305とを分離す る。なお、加熱処理等により、分離を行ってもよい。

【0524】

光照射工程において、レーザ光を、作製基板301を介して金属酸化物層303と樹脂層 305との界面またはその近傍に照射することが好ましい。また、レーザ光は、金属酸化 物層303中に照射されてもよく、樹脂層305中に照射されてもよい。

[0525]

金属酸化物層303は、レーザ光を吸収する。樹脂層305は、レーザ光を吸収してもよい。

【0526】

作製基板301と金属酸化物層303の積層構造におけるレーザ光の吸収率は、50%以上100%以下が好ましく、75%以上100%以下がより好ましく、80%以上100 %以下がさらに好ましい。当該積層構造が、レーザ光の大半を吸収することで、金属酸化 物層303と樹脂層305との界面で確実に剥離することが可能となる。また、樹脂層3 05が光から受けるダメージを低減できる。

[0527]

レーザ光の照射により、金属酸化物層303と樹脂層305の密着性もしくは接着性が低 下する。レーザ光の照射により、樹脂層305が脆弱化されることがある。

【0528】

レーザ光としては、少なくともその一部が作製基板301を透過し、かつ金属酸化物層303に吸収される波長の光を選択して用いる。レーザ光は、可視光線から紫外線の波長領域の光であることが好ましい。例えば波長が180nm以上450nm以下の光、好ましくは200nm以上400nm以下の光、より好ましくは波長が250nm以上350nm以下の光を用いることができる。

【0529】

レーザ光は、金属酸化物層303のエネルギーギャップよりも高いエネルギーを有することが好ましい。例えば、酸化チタンのエネルギーギャップは、約3.2eVである。したがって、金属酸化物層303に酸化チタンを用いる場合、光は、3.2eVより高いエネルギーを有することが好ましい。

【0530】

特に、波長308nmのエキシマレーザを用いると、生産性に優れるため好ましい。エキ シマレーザは、LTPSにおけるレーザ結晶化にも用いるため、既存のLTPS製造ライ ンの装置を流用することができ、新たな設備投資を必要としないため好ましい。波長30 8nmの光のエネルギーは、約4.0eVである。つまり、金属酸化物層303に酸化チ タンを用いる場合、波長308nmのエキシマレーザは好適である。また、Nd:YAG レーザの第三高調波である波長355nmのUVレーザなどの固体UVレーザ(半導体U Vレーザともいう)を用いてもよい。固体レーザはガスを用いないため、エキシマレーザ に比べて、ランニングコストを低減でき、好ましい。また、ピコ秒レーザ等のパルスレー ザを用いてもよい。

[0531]

レーザ光として、線状のレーザ光を用いる場合には、作製基板301と光源とを相対的に 移動させることでレーザ光を走査し、剥離したい領域に亘ってレーザ光を照射する。 【0532】

ここで、分離時に、分離界面に水や水溶液など、水を含む液体を添加し、該液体が分離界 面に浸透するように分離を行うことで、分離を容易に行うことができる。また、分離時に 生じる静電気が、トランジスタなどの機能素子に悪影響を及ぼすこと(半導体素子が静電 気により破壊されるなど)を抑制できる。

【0533】

供給する液体としては、水(好ましくは純水)、中性、アルカリ性、もしくは酸性の水溶 液や、塩が溶けている水溶液が挙げられる。また、エタノール、アセトン等が挙げられる 。また、各種有機溶剤を用いてもよい。

【0534】

また、作製基板301と樹脂層305とを分離する前に、レーザ光または鋭利な刃物等を 用いて、分離の起点を形成することが好ましい。樹脂層305の一部にクラックを入れる (膜割れやひびを生じさせる)ことで、分離の起点を形成できる。例えば、レーザ光の照 射によって、樹脂層305の一部を溶解、蒸発、または熱的に破壊することができる。 【0535】

そして、形成した分離の起点から、物理的な力(人間の手や治具で引き剥がす処理や、基板に密着させたローラーを回転させることで分離する処理等)によって樹脂層305と作製基板301とを分離する。図46の下部に、樹脂層305から分離された金属酸化物層303と作製基板301を示す。

【0536】

次に、樹脂層305の一部または全部を除去してもよい。樹脂層305は、ウエットエッ チング装置、ドライエッチング装置、アッシング装置等を用いて除去することができる。 特に、酸素プラズマを用いたアッシングを行って樹脂層305を除去することが好適であ る。樹脂層305の厚さが薄いと、樹脂層305を除去する工程にかかる時間を短縮でき 好ましい。樹脂層305を除去することで、共通電極112及び導電層251を露出する ことができる(図47)。また、導電層251が露出するよう、樹脂層305の一部を除 去してもよい。なお、樹脂層305を配向膜133aとして用いてもよい。

【0537】

次に、共通電極112上に配向膜133aを形成する。

【0538】

その後、接着層141を用いて、配向膜133bが形成された基板61と、基板51と、 の間に、液晶層113を封止する。以上により、タッチパネル355A(図41)を作製 することができる。

【0539】

以上のように、本発明の一態様では、表示装置を構成するトランジスタ及び液晶素子等の 機能素子を、作製基板上で形成する。したがって、機能素子の形成工程にかかる熱に対す る制限がほとんど無い。高温プロセスにて作製した極めて信頼性の高い機能素子を、表示 装置を構成する基板上に歩留まりよく転置することができる。これにより、信頼性の高い 表示装置を実現できる。

【0540】

本発明の一態様では、トランジスタを形成する前に、液晶素子の電極を形成するため、液 晶素子の電極を平坦な面上に形成できる。したがって、セルギャップのばらつき及び液晶 の初期配向のばらつきを抑制することができる。これにより、開口率を高くすること、さ らには、表示装置の高精細化が可能となる。

【0541】

< 5.表示装置の構成例 4 >

図 4 8 (A)に、表示装置の一例をそれぞれ示す。図 4 8 (A)は、表示装置110Cの 断面図である。なお、表示装置110Cの斜視図は、図4に示す表示装置100Aと同様 であるため、ここでの説明は省略する。

【0542】

図 4 8 (A) に示す表示装置 1 1 0 C は、先に示す表示装置 1 1 0 B と、画素電極 1 1 1 と共通電極 1 1 2 の形状が異なる。

【0543】

画素電極111及び共通電極112の双方が、 歯状の上面形状、またはスリットが設け られた上面形状を有していてもよい。 10

[0544]図48(A)に示す表示装置110Cの表示部62は、上面から見て、画素電極111及 び共通電極112の双方が設けられていない部分を有する。 [0545]または、上面から見て、一方の電極のスリットの端部と、他方の電極のスリットの端部が 重なる形状であってもよい。この場合の断面図を図48(B)に示す。 【0546】 または、上面から見て、画素電極111及び共通電極112が互いに重なる部分を有して いてもよい。この場合の断面図を図48(C)に示す。 [0547]または、上面から見て、一方の電極の一方の端部は、他方の電極と重なり、他方の端部は 、他方の電極と重ならなくてもよい。この場合の断面図を図48(D)に示す。 [0548]または、図48(E)に示すように、画素電極111及び共通電極112は、同一平面上 に設けられていてもよい。 [0549]< 6 . 表示装置の構成例 5 > 図49は、タッチパネル355Bの断面図である。タッチパネル355Bの斜視図は、図 20に示すタッチパネル350Aと同様であるため、実施の形態1の説明を参照できる。 [0550]タッチパネル355Bは、別々に作製された表示装置と検知素子とを貼り合わせた構成で ある。 [0551] タッチパネル355Bは、入力装置375と、表示装置370とを有し、これらが重ねて 設けられている。 図49は、表示部62、駆動回路部64、FPC72aを含む領域、及びFPC72bを 含む領域等の断面図である。 [0553]基板51と基板61とは、接着層141によって貼り合わされている。基板61と基板1 62とは、接着層169によって貼り合わされている。ここで、基板51から基板61ま での各層が、表示装置370に相当する。また、基板162から電極124までの各層が 入力装置375に相当する。つまり、接着層169は、表示装置370と入力装置375 を貼り合わせているといえる。 [0554]図49に示す表示装置370の構成は、図38に示す表示装置110Aと同様の構成であ るため、詳細な説明は省略する。 [0555]基板51には、接着層167によって、偏光板165が貼り合わされている。偏光板16 5には、接着層163によって、バックライト161が貼り合わされている。 [0556] 基板162には、接着層168によって、偏光板166が貼り合わされている。偏光板1 66には、接着層164によって、保護基板160が貼り合わされている。 [0557]入力装置375と表示装置370の間に偏光板166を配置してもよい。その場合、図4 9 に示す保護基板160、接着層164、及び接着層168を設けなくてよい。つまり、 タッチパネル355Bの最表面に基板162が位置する構成とすることができる。 [0558] 基板162の基板61側には、電極127及び電極128が設けられている。電極127

及び電極128は同一平面上に形成されている。絶縁層125は、電極127及び電極1

(60)

20

10

30

28を覆うように設けられている。電極124は、絶縁層125に設けられた開口を介し て、電極127を挟むように設けられる2つの電極128と電気的に接続している。 [0559]入力装置375が有する導電層のうち、画素の開口部と重なる導電層(電極127、12 8等)には、可視光を透過する材料を用いる。 [0560] 電極127、128と同一の導電層を加工して得られた配線136が、電極124と同一 の導電層を加工して得られた導電層126と接続している。導電層126は、接続体24 2 b を介して F P C 7 2 b と電気的に接続される。 [0561]< 7.表示装置の構成例 6 > 図50に、タッチパネルの一例を示す。図50は、タッチパネル3550の断面図である [0562] タッチパネル355Cは、画像を表示する機能と、タッチセンサとしての機能と、を有す る、インセル型のタッチパネルである。 [0563] タッチパネル355Cは、表示素子を支持する基板のみに、検知素子を構成する電極等を 設けた構成である。このような構成は、別々に作製された表示装置と検知素子とを貼り合 わせる構成や、対向基板側に検知素子を作製する構成に比べて、タッチパネルを薄型化も しくは軽量化することができる、または、タッチパネルの部品点数を少なくすることがで きる。 [0564] 図 5 0 に示すタッチパネル 3 5 5 C は、先に示す表示装置 1 1 0 B の構成に加え、補助配 線119を有する。 [0565] 補助配線119は、共通電極112と電気的に接続されている。共通電極と電気的に接続 する補助配線を設けることで、共通電極の抵抗に起因する電圧降下を抑制することができ る。また、このとき、金属酸化物を含む導電層と、金属を含む導電層の積層構造とする場 合には、ハーフトーンマスクを用いたパターニング技術により形成すると、工程を簡略化 できるため好ましい。 [0566] タッチパネルの使用者から視認されないよう、補助配線119は、遮光層132等と重な る位置に設けられることが好ましい。 [0567] 図50では、隣り合う2つの副画素を含む断面図を示す。図50に示す2つの副画素はそ れぞれ異なる画素が有する副画素である。 [0568] 図50に示すタッチパネル355Cでは、左の副画素が有する共通電極112と、右の副 画素が有する共通電極112との間に形成される容量を利用して、被検知体の近接または 接触等を検知することができる。すなわちタッチパネル355Cにおいて、共通電極11 2は、液晶素子の共通電極と、検知素子の電極と、の両方を兼ねる。 【0569】 このように、本発明の一態様のタッチパネルでは、液晶素子を構成する電極が、検知素子 を構成する電極を兼ねるため、作製工程を簡略化でき、かつ作製コストを低減できる。ま た、タッチパネルの薄型化、軽量化を図ることができる。 [0570] 共通電極112は、補助配線119と電気的に接続されている。補助配線119を設ける

ことで、検知素子の電極の抵抗を低減させることができる。検知素子の電極の抵抗が低下 することで、検知素子の電極の時定数を小さくすることができる。検知素子の電極の時定 20

10

30

40

10

20

30

40

(62)

数が小さいほど、検出感度を高めることができ、さらには、検出の精度を高めることがで きる。 [0571]タッチパネル355Cは、一つのFPCにより、画素を駆動する信号と検知素子を駆動す る信号が供給される。そのため、電子機器に組み込みやすく、また、部品点数を削減する ことが可能となる。 [0572] タッチパネル355Cには、実施の形態1のタッチパネル350Eの動作方法の例など( 図29~図31参照)を適用することができる。 [0573]本実施の形態の表示装置は、トランジスタが可視光を透過する領域を有するため、画素の 開口率を高めることができる。これにより、表示装置の消費電力を低減させることができ る。また、表示装置の高精細化を実現できる。 [0574] 本実施の形態の表示装置では、液晶素子の電極が平坦に設けられる。表示装置における、 表示不良の抑制が可能となる。また、液晶の配向不良に起因する開口率の縮小を抑制でき る。 [0575]本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。 [0576] (実施の形態3) 本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置で行うことができる動作モードについて図 51を用いて説明する。 [0577] なお、以下では、通常のフレーム周波数(代表的には60日z以上240日z以下)で動 作する通常動作モード(Normal mode)と、低速のフレーム周波数で動作する アイドリング・ストップ(IDS)駆動モードと、を例示して説明する。 [0578]なお、IDS駆動モードとは、画像データの書き込み処理を実行した後、画像データの書 き換えを停止する駆動方法のことをいう。一旦画像データの書き込みをして、その後、次 の画像データの書き込みまでの間隔を延ばすことで、その間の画像データの書き込みに要 する分の消費電力を削減することができる。IDS駆動モードは、例えば、通常動作モー ドの1/100乃至1/10程度のフレーム周波数とすることができる。静止画は、連続 するフレーム間でビデオ信号が同じである。よって、IDS駆動モードは、静止画を表示 する場合に特に有効である。IDS駆動を用いて画像を表示させることで、消費電力が低 減されるとともに、画面のちらつき(フリッカー)が抑制され、眼精疲労も低減できる。 [0579] 図51(A)~図51(C)は、画素回路、及び、通常駆動モードとIDS駆動モードを 説明するタイミングチャートである。なお、図51(A)では、第1の表示素子501( ここでは反射型の液晶素子)と、第1の表示素子501に電気的に接続される画素回路5 06と、を示している。また、図51(A)に示す画素回路506では、信号線SLと、 ゲート線GLと、信号線SL及びゲート線GLに接続されたトランジスタM1と、トラン ジスタM1に接続される容量素子Csicとを示している。 【0580】 トランジスタM1は、データD1のリークパスと成り得る。よって、トランジスタM1の オフ電流は小さいほど好ましい。トランジスタM1としては、チャネルが形成される半導 体層に金属酸化物を有するトランジスタを用いることが好ましい。金属酸化物が増幅作用 、整流作用、及びスイッチング作用の少なくとも1つを有する場合、当該金属酸化物を、 金属酸化物半導体(metal oxide semiconductor)または酸化 物半導体(oxide semiconductor)、略してOSと呼ぶことができる

。以下、トランジスタの代表例として、チャネルが形成される半導体層に酸化物半導体を 用いたトランジスタ(「OSトランジスタ」ともいう。)を用いて説明する。OSトラン ジスタは、多結晶シリコンなどを用いたトランジスタよりも非導通状態時のリーク電流( オフ電流)が極めて低い特徴を有する。トランジスタM1にOSトランジスタを用いるこ とでノードND1に供給された電荷を長期間保持することができる。

【0581】

なお、図51(A)に示す回路図において、液晶素子LCはデータD<sub>1</sub>のリークパスとなる。したがって、適切にIDS駆動を行うには、液晶素子LCの抵抗率を1.0×10<sup>1</sup> <sup>4</sup> ・ cm以上とすることが好ましい。

[0582]

なお、上記OSトランジスタのチャネル領域には、例えば、In-Ga-Zn酸化物、I n-Zn酸化物などを好適に用いることができる。また、上記In-Ga-Zn酸化物と しては、代表的には、In:Ga:Zn=4:2:4.1[原子数比]近傍の組成を用い ることができる。

【0583】

図51(B)は、通常駆動モードでの信号線SL及びゲート線GLにそれぞれ与える信号 の波形を示すタイミングチャートである。通常駆動モードでは通常のフレーム周波数(例 えば60Hz)で動作する。図51(B)に期間T1からT3までを表す。各フレーム期 間でゲート線GLに走査信号を与え、信号線SLからデータD1をノードND1に書き込 む動作を行う。この動作は、期間T1からT3までで同じデータD1を書き込む場合、ま たは異なるデータを書き込む場合でも同じである。

【0584】

一方、図51(C)は、IDS駆動モードでの信号線SL及びゲート線GLに、それぞれ 与える信号の波形を示すタイミングチャートである。IDS駆動では低速のフレーム周波 数(例えば1Hz)で動作する。1フレーム期間を期間T<sub>1</sub>で表し、その中でデータの書 き込み期間を期間T<sub>W</sub>、データの保持期間を期間T<sub>RET</sub>で表す。IDS駆動モードは、 期間T<sub>W</sub>でゲート線GLに走査信号を与え、信号線SLのデータD<sub>1</sub>を書き込み、期間T RETでゲート線GLをローレベルの電圧に固定し、トランジスタM1を非導通状態とし て一旦書き込んだデータD<sub>1</sub>を保持させる動作を行う。なお、低速のフレーム周波数とし ては、例えば、0.1Hz以上60Hz未満とすればよい。

[0585]

本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。

【 0 5 8 6 】

(実施の形態4)

本実施の形態では、タッチセンサの駆動方法の例について、図面を参照して説明する。 【0587】

< センサの検知方法の例 >

図52(A)は、相互容量方式のタッチセンサの構成を示すブロック図である。図52( A)では、パルス電圧出力回路551、電流検出回路552を示している。なお図52( A)では、パルス電圧が与えられる電極521、電流の変化を検知する電極522をそれ ぞれ、X1乃至X6、Y1乃至Y6のそれぞれ6本の配線として示している。また図52 (A)は、電極521及び電極522が重畳することで形成される容量553を図示して いる。なお、電極521と電極522とはその機能を互いに置き換えてもよい。 【0588】

パルス電圧出力回路551は、X1乃至X6の配線に順にパルス電圧を印加するための回路である。X1乃至X6の配線にパルス電圧が印加されることで、容量553を形成する電極521と電極522の間に電界が生じる。この電極間に生じる電界が遮蔽等により容量553の相互容量に変化を生じさせることを利用して、被検知体の近接または接触を検出することができる。

【0589】

10

20



電流検出回路552は、容量553での相互容量の変化による、Y1乃至Y6の配線での 電流の変化を検出するための回路である。Y1乃至Y6の配線では、被検知体の近接また は接触がないと検出される電流値に変化はないが、検出する被検知体の近接または接触に より相互容量が減少する場合には電流値が減少する変化を検出する。なお電流の検出は、 積分回路等を用いて行えばよい。

【0590】

なお、パルス電圧出力回路551及び電流検出回路552の一方または両方を、図4等に 示す基板51上または基板61上に形成してもよい。例えば、表示部62や駆動回路部6 4などと同時に形成すると、工程を簡略化できることに加え、タッチセンサの駆動に用い る部品数を削減することができるため好ましい。また、パルス電圧出力回路551及び電 流検出回路552の一方または両方を、IC73に実装してもよい。

【0591】

特に、基板51に形成されるトランジスタとして、チャネルが形成される半導体層に多結 晶シリコンや単結晶シリコンなどの結晶性シリコンを用いると、パルス電圧出力回路55 1や電流検出回路552等の回路の駆動能力が向上し、タッチセンサの感度を向上させる ことができる。

【0592】

図52(B)には、図52(A)で示す相互容量方式のタッチセンサにおける入出力波形 のタイミングチャートを示す。図52(B)では、1フレーム期間で各行列での被検知体 の検出を行うものとする。また図52(B)では、被検知体を検出しない場合(非タッチ )と被検知体を検出する場合(タッチ)との2つの場合について示している。なおY1乃 至Y6の配線については、検出される電流値に対応する電圧値とした波形を示している。 【0593】

【0593】 X1-X6の配線には、順にパルス電圧が与えられ、該パルス電圧にしたがってY1乃至 Y6の配線での波形が変化する。被検知体の近接または接触がない場合には、X1乃至X 6の配線の電圧の変化に応じてY1乃至Y6の波形が一様に変化する。一方、被検知体が

Y6の配線での波形が変化する。被検知体の近接または接触がない場合には、X1乃至X 6の配線の電圧の変化に応じてY1乃至Y6の波形が一様に変化する。一方、被検知体が 近接または接触する箇所では、電流値が減少するため、これに対応する電圧値の波形も変 化する。

[0594]

このように、相互容量の変化を検出することにより、被検知体の近接または接触を検知す ることができる。

[0595]

<表示装置の駆動方法例>

図53(A)は、表示装置の構成例を示すブロック図である。図53(A)ではゲート駆動回路GD(走査線駆動回路)、ソース駆動回路SD(信号線駆動回路)、複数の画素pixを有する表示部を示している。なお図53(A)では、ゲート駆動回路GDに電気的に接続されるゲート線×\_1乃至×\_m(mは自然数)、ソース駆動回路SDに電気的に接続されるソース線y\_1乃至y\_n(nは自然数)に対応して、画素pixではそれぞれに(1,1)乃至(n,m)の符号を付している。

【0596】

図53(B)は、図53(A)で示す表示装置におけるゲート線及びソース線に与える信号のタイミングチャート図である。図53(B)では、1フレーム期間ごとにデータ信号を書き換える場合と、データ信号を書き換えない場合と、に分けて示している。なお図53(B)では、帰線期間等の期間を考慮していない。

【0597】

1フレーム期間ごとにデータ信号を書き換える場合、 x \_\_1 乃至 x \_\_mのゲート線には、 順に走査信号が与えられる。走査信号がHレベルの期間である水平走査期間1Hでは、各 列のソース線 y \_\_1 乃至 y \_\_n にデータ信号 D が与えられる。

【0598】

1フレーム期間ごとにデータ信号を書き換えない場合、ゲート線 × \_\_ 1乃至 × \_\_ mに与え

10

20

40

る走査信号を停止する。また水平走査期間1Hでは、各列のソース線 y \_ 1 乃至 y \_ n に 与えるデータ信号を停止する。

【0599】

1フレーム期間ごとにデータ信号を書き換えない駆動方法は、特に、画素pixが有する トランジスタとしてチャネルが形成される半導体層に酸化物半導体を適用する場合に有効 である。酸化物半導体が適用されたトランジスタはシリコン等の半導体が適用されたトラ ンジスタに比べて極めてオフ電流を小さくすることが可能である。そのため、1フレーム 期間ごとにデータ信号の書き換えを行わずに前の期間に書き込んだデータ信号を保持させ ることができ、例えば1秒以上、好ましくは5秒以上に亘って画素の階調を保持すること もできる。

【0600】

また、 画素 p i × が有するトランジスタとしてチャネルが形成される半導体層に多結晶シ リコンなどを適用する場合には、画素が有する保持容量の大きさをあらかじめ大きくして おくことが好ましい。保持容量が大きいほど、画素の階調を長時間に亘って保持すること ができる。保持容量の大きさは、保持容量に電気的に接続するトランジスタや表示素子の リーク電流に応じて設定すればよいが、例えば、1画素あたりの保持容量を5fF以上5 pF以下、好ましくは10fF以上5pF以下、より好ましくは20fF以上1pF以下 とすると、1フレーム期間ごとにデータ信号の書き換えを行わずに前の期間に書き込んだ データ信号を保持させることができ、例えば数フレームまたは数10フレームの期間に亘 って画素の階調を保持することが可能となる。

[0601]

<表示部とタッチセンサの駆動方法の例>

図54(A)乃至(D)は、一例として図52(A)、(B)で説明したタッチセンサと、図53(A)、(B)で説明した表示部を1sec.(1秒間)駆動する場合に、連続するフレーム期間の動作について説明する図である。なお図54(A)では、表示部の1フレーム期間を16.7ms(フレーム周波数:60Hz)、タッチセンサの1フレーム期間を16.7ms(フレーム周波数:60Hz)とした場合について示している。 【0602】

本発明の一態様の表示装置は、表示部の動作とタッチセンサの動作は互いに独立しており 、表示期間と平行してタッチ検知期間を設けることができる。そのため図54(A)に示 すように、表示部及びタッチセンサの1フレーム期間を共に16.7ms(フレーム周波 数:60Hz)と設定することができる。また、タッチセンサと表示部のフレーム周波数 を異ならせてもよい。例えば図54(B)に示すように、表示部の1フレーム期間を8. 3ms(フレーム周波数:120Hz)と設定し、タッチセンサの1フレーム期間を16. 7ms(フレーム周波数:60Hz)とすることもできる。また、図示しないが、表示 部のフレーム周波数を33.3ms(フレーム周波数:30Hz)としてもよい。

【 0 6 0 3 】

また表示部のフレーム周波数を切り替え可能な構成とし、動画像の表示の際にはフレーム 周波数を大きく(例えば60Hz以上または120Hz以上)し、静止画像の表示の際に はフレーム周波数を小さく(例えば60Hz以下、30Hz以下、または1Hz以下)す ることで、表示装置の消費電力を低減することができる。またタッチセンサのフレーム周 波数を切り替え可能な構成とし、待機時と、タッチを感知した時とでフレーム周波数を異 ならせてもよい。

【0604】

また本発明の一態様の表示装置は、表示部におけるデータ信号の書き換えを行わずに、前の期間に書き換えたデータ信号を保持することで、表示部の1フレーム期間を16.7m sよりも長い期間とすることができる。そのため、図54(C)に示すように、表示部の 1フレーム期間を1sec.(フレーム周波数:1Hz)と設定し、タッチセンサの1フ レーム期間を16.7ms(フレーム周波数:60Hz)とすることもできる。 【0605】

なお、表示部におけるデータ信号の書き換えを行わずに、前の期間に書き換えたデータ信号を保持する構成については、先に説明のIDS駆動モードを参照することができる。なお、IDS駆動モードについては、表示部におけるデータ信号の書き換えを特定の領域だけ行い、部分IDS駆動モードとは、表示部におけるデータ信号の書き換えを特定の領域だけ行い、それ以外の領域においては、前の期間に書き換えたデータ信号を保持する構成である。

(66)

【0606】

また、本実施の形態に開示するタッチセンサの駆動方法によれば、図54(C)に示す駆動を行う場合、継続してタッチセンサの駆動を行うことができる。そのため、図54(D)に示すようにタッチセンサにおける被検知体の近接または接触を検知したタイミングで、表示部のデータ信号を書き換えることもできる。

【0607】

ここで、タッチセンサのセンシング期間に表示部のデータ信号の書き換え動作を行うと、 データ信号の書き換え時に生じるノイズがタッチセンサに伝わることで、タッチセンサの 感度を低下させてしまう恐れがある。したがって、表示部のデータ信号の書き換え期間と 、タッチセンサのセンシング期間とをずらすように駆動することが好ましい。

【0608】

図55(A)では、表示部のデータ信号の書き換えと、タッチセンサのセンシングとを交 互に行う例を示している。また、図55(B)では、表示部のデータ信号の書き換え動作 を2回行うごとに、タッチセンサのセンシングを1回行う例を示している。なお、これに 限られず3回以上の書き換え動作を行うごとにタッチセンサのセンシングを1回行う構成 としてもよい。

【 0 6 0 9 】

また、画素pixに適用されるトランジスタに、チャネルが形成される半導体層に酸化物 半導体を用いる場合、オフ電流を極めて低減することが可能なため、データ信号の書き換 えの頻度を十分に低減することができる。具体的には、データ信号の書き換えを行った後 、次にデータ信号を書き換えるまでの間に、十分に長い休止期間を設けることが可能とな る。休止期間は、例えば0.5秒以上、1秒以上、または5秒以上とすることができる。 休止期間の上限は、トランジスタに接続される容量や表示素子等のリーク電流によって制 限されるが、例えば1分以下、10分以下、1時間以下、または1日以下などとすること ができる。

[0610]

図55(C)では、5秒間に1度の頻度で表示部のデータ信号の書き換えを行う例を示している。図55(C)では、表示部はデータ信号を書き換えたのち、次のデータ信号の書 き換え動作までの期間は、書き換え動作を停止する休止期間が設けられている。休止期間 では、タッチセンサがフレーム周波数iHz(iは表示装置のフレーム周波数以上、ここ では0.2Hz以上)で駆動することができる。また図55(C)に示すように、タッチ センサのセンシングを休止期間に行い、表示部のデータ信号の書き換え期間には行わない ようにすると、タッチセンサの感度を向上させることができ好ましい。また、図55(D) に示すように、表示部のデータ信号の書き換えとタッチセンサのセンシングを同時に行 うと、駆動のための信号を簡略化することができる。

【0611】

また、表示部のデータ信号の書き換え動作を行わない休止期間では、表示部へのデータ信 号の供給を停止するだけでなく、ゲート駆動回路GD及びソース駆動回路SDの一方また は双方の動作を停止してもよい。さらに、ゲート駆動回路GD及びソース駆動回路SDの 一方または双方への電力供給を停止してもよい。このようにすることで、ノイズをより低 減し、タッチセンサの感度をさらに良好なものとすることができる。また、表示装置の消 費電力をさらに低減することができる。

【0612】

本発明の一態様の表示装置は、2つの基板で表示部とタッチセンサが挟持された構成を有

20

する。よって、表示部とタッチセンサの距離を極めて近づけることができる。このとき、 表示部の駆動時のノイズがタッチセンサに伝搬しやすくなり、タッチセンサの感度が低下 してしまう恐れがある。本実施の形態で例示した駆動方法を適用することで、薄型化と高 い検出感度を両立した、タッチセンサを有する表示装置を実現できる。 [0613]本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。 [0614](実施の形態5) 本実施の形態では、本発明の一態様で開示されるトランジスタの半導体層に用いることが できる金属酸化物について説明する。なお、トランジスタの半導体層に金属酸化物を用い る場合、当該金属酸化物を酸化物半導体と読み替えてもよい。 [0615]酸化物半導体は、単結晶酸化物半導体と、非単結晶酸化物半導体と、に分けられる。非単 結晶酸化物半導体としては、CAAC-OS(c-axis-aligned crys talline oxide semiconductor)、多結晶酸化物半導体、n c-OS(nanocrystalline oxide semiconductor )、擬似非晶質酸化物半導体(a-like OS:amorphous-like o xide semiconductor)、及び非晶質酸化物半導体などがある。 [0616]また、本発明の一態様で開示されるトランジスタの半導体層には、CAC-OS(C1o ud-Aligned Composite oxide semiconductor )を用いてもよい。 [0617] なお、本発明の一態様で開示されるトランジスタの半導体層は、上述した非単結晶酸化物 半導体またはCAC-OSを好適に用いることができる。また、非単結晶酸化物半導体と しては、nc-OSまたはCAAC-OSを好適に用いることができる。 [0618] なお、本発明の一態様では、トランジスタの半導体層として、CAC-OSを用いると好 ましい。CAC-OSを用いることで、トランジスタに高い電気特性または高い信頼性を 付与することができる。 [0619]以下では、CAC - OSの詳細について説明する。 [0620]CAC-OSまたはCAC-metal oxideは、材料の一部では導電性の機能と 、材料の一部では絶縁性の機能とを有し、材料の全体では半導体としての機能を有する。 なお、CAC‐OSまたはCAC‐metal oxideを、トランジスタのチャネル 形成領域に用いる場合、導電性の機能は、キャリアとなる電子(またはホール)を流す機 能であり、絶縁性の機能は、キャリアとなる電子を流さない機能である。導電性の機能と 、絶縁性の機能とを、それぞれ相補的に作用させることで、スイッチングさせる機能(〇 n / Off させる機能)をCAC - OSまたはCAC - metal oxideに付与す ることができる。CAC-OSまたはCAC-metal oxideにおいて、それぞ れの機能を分離させることで、双方の機能を最大限に高めることができる。 [0621]また、CAC-OSまたはCAC-metal oxideは、導電性領域、及び絶縁性 領域を有する。導電性領域は、上述の導電性の機能を有し、絶縁性領域は、上述の絶縁性 の機能を有する。また、材料中において、導電性領域と、絶縁性領域とは、ナノ粒子レベ ルで分離している場合がある。また、導電性領域と、絶縁性領域とは、それぞれ材料中に 偏在する場合がある。また、導電性領域は、周辺がぼけてクラウド状に連結して観察され る場合がある。

[0622]

30

10

20

また、CAC-OSまたはCAC-metal oxideにおいて、導電性領域と、絶 縁性領域とは、それぞれ0.5nm以上10nm以下、好ましくは0.5nm以上3nm 以下のサイズで材料中に分散している場合がある。

【 0 6 2 3 】

また、CAC-OSまたはCAC-metal oxideは、異なるバンドギャップを 有する成分により構成される。例えば、CAC-OSまたはCAC-metal oxi deは、絶縁性領域に起因するワイドギャップを有する成分と、導電性領域に起因するナ ローギャップを有する成分と、により構成される。当該構成の場合、キャリアを流す際に 、ナローギャップを有する成分において、主にキャリアが流れる。また、ナローギャップ を有する成分が、ワイドギャップを有する成分に相補的に作用し、ナローギャップを有す る成分に連動してワイドギャップを有する成分にもキャリアが流れる。このため、上記C AC-OSまたはCAC-metal oxideをトランジスタのチャネル形成領域に 用いる場合、トランジスタのオン状態において高い電流駆動力、つまり大きなオン電流、 及び高い電界効果移動度を得ることができる。

【0624】

すなわち、CAC-OSまたはCAC-metal oxideは、マトリックス複合材 (matrix composite)または金属マトリックス複合材(metal m atrix composite)と呼称することもできる。

【0625】

CAC-OSは、例えば、金属酸化物を構成する元素が、0.5 nm以上10 nm以下、 好ましくは、1 nm以上2 nm以下またはその近傍のサイズで偏在した材料の一構成であ る。なお、以下では、金属酸化物において、一つあるいはそれ以上の金属元素が偏在し、 該金属元素を有する領域が、0.5 nm以上10 nm以下、好ましくは、1 nm以上2 n m以下またはその近傍のサイズで混合した状態をモザイク状またはパッチ状ともいう。 【0626】

なお、金属酸化物は、少なくともインジウムを含むことが好ましい。特にインジウム及び 亜鉛を含むことが好ましい。また、それらに加えて、アルミニウム、ガリウム、イットリ ウム、銅、バナジウム、ベリリウム、ホウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマ ニウム、ジルコニウム、モリブデン、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タン タル、タングステン、またはマグネシウムなどから選ばれた一種または複数種が含まれて いてもよい。

【 0 6 2 7 】

例えば、In-Ga-Zn酸化物におけるCAC-OS(CAC-OSの中でもIn-G a-Zn酸化物を、特にCAC-IGZOと呼称してもよい。)とは、インジウム酸化物 (以下、InO<sub>X1</sub>(X1は0よりも大きい実数)とする。)、またはインジウム亜鉛酸 化物(以下、In<sub>X2</sub>Zn<sub>Y2</sub>O<sub>Z2</sub>(X2、Y2、及びZ2は0よりも大きい実数)と する。)と、ガリウム酸化物(以下、GaO<sub>X3</sub>(X3は0よりも大きい実数)とする。 )、またはガリウム亜鉛酸化物(以下、Ga<sub>X4</sub>Zn<sub>Y4</sub>O<sub>Z4</sub>(X4、Y4、及びZ4 は0よりも大きい実数)とする。)などと、に材料が分離することでモザイク状となり、 モザイク状のInO<sub>X1</sub>、またはIn<sub>X2</sub>Zn<sub>Y2</sub>O<sub>Z2</sub>が、膜中に均一に分布した構成 (以下、クラウド状ともいう。)である。

【0628】

つまり、CAC-OSは、GaO<sub>X3</sub>が主成分である領域と、In<sub>X2</sub> Ζn<sub>Υ2</sub> О<sub>Ζ2</sub>、 またはInO<sub>X1</sub>が主成分である領域とが、混合している構成を有する複合金属酸化物で ある。なお、本明細書において、例えば、第1の領域の元素Mに対するInの原子数比が 、第2の領域の元素Mに対するInの原子数比よりも大きいことを、第1の領域は、第2 の領域と比較して、Inの濃度が高いとする。

【 0 6 2 9 】

なお、 IGZOは通称であり、 In、 Ga、 Zn、 及びOによる1つの化合物をいう場合 がある。代表例として、 In GaO3 (ZnO)m1 (m1は自然数)、または In (1

+ x 0 ) G a <sub>(1-x0)</sub> O <sub>3</sub> (Z n O ) <sub>m0</sub> (-1 x0 1、m0は任意数)で表される結晶性の化合物が挙げられる。

【 0 6 3 0 】

上記結晶性の化合物は、単結晶構造、多結晶構造、またはCAAC(c-axis al igned crystal)構造を有する。なお、CAAC構造とは、複数のIGZO のナノ結晶がc軸配向を有し、かつa-b面においては配向せずに連結した結晶構造であ る。

【0631】

一方、CAC-OSは、金属酸化物の材料構成に関する。CAC-OSとは、In、Ga 、Zn、及びOを含む材料構成において、一部にGaを主成分とするナノ粒子状に観察さ れる領域と、一部にInを主成分とするナノ粒子状に観察される領域とが、それぞれモザ イク状にランダムに分散している構成をいう。従って、CAC-OSにおいて、結晶構造 は副次的な要素である。

【0632】

なお、 C A C - O S は、組成の異なる二種類以上の膜の積層構造は含まないものとする。 例えば、 I n を主成分とする膜と、 G a を主成分とする膜との 2 層からなる構造は、含ま ない。

【 0 6 3 3 】

なお、 G a O <sub>X 3</sub> が主成分である領域と、 I n <sub>X 2</sub> Z n <sub>Y 2</sub> O <sub>Z 2</sub>、または I n O <sub>X 1</sub> が 主成分である領域とは、明確な境界が観察できない場合がある。

【0634】

なお、ガリウムの代わりに、アルミニウム、イットリウム、銅、バナジウム、ベリリウム 、ホウ素、シリコン、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン 、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、またはマグネ シウムなどから選ばれた一種、または複数種が含まれている場合、CAC-OSは、一部 に該金属元素を主成分とするナノ粒子状に観察される領域と、一部にInを主成分とする ナノ粒子状に観察される領域とが、それぞれモザイク状にランダムに分散している構成を いう。

[0635]

CAC-OSは、例えば基板を意図的に加熱しない条件で、スパッタリング法により形成 することができる。また、CAC-OSをスパッタリング法で形成する場合、成膜ガスと して、不活性ガス(代表的にはアルゴン)、酸素ガス、及び窒素ガスの中から選ばれたい ずれか一つまたは複数を用いればよい。また、成膜時の成膜ガスの総流量に対する酸素ガ スの流量比は低いほど好ましく、例えば酸素ガスの流量比を0%以上30%未満、好まし くは0%以上10%以下とすることが好ましい。

【0636】

CAC-OSは、X線回折(XRD:X-ray diffraction)測定法のひ とつであるOut-of-plane法による /2 スキャンを用いて測定したときに 、明確なピークが観察されないという特徴を有する。すなわち、X線回折から、測定領域 のa-b面方向、及びc軸方向の配向は見られないことが分かる。

【0637】

またCAC-OSは、プローブ径が1nmの電子線(ナノビーム電子線ともいう。)を照 射することで得られる電子線回折パターンにおいて、リング状に輝度の高い領域と、該リ ング領域に複数の輝点が観測される。従って、電子線回折パターンから、CAC-OSの 結晶構造が、平面方向、及び断面方向において、配向性を有さないnc(nano-cr ystal)構造を有することがわかる。

【0638】

また例えば、In-Ga-Ζn酸化物におけるCAC-OSでは、エネルギー分散型X線 分光法(EDX:Energy Dispersive X-ray spectros copy)を用いて取得したEDXマッピングにより、GaO<sub>X3</sub>が主成分である領域と 10

ュータネットワークに接続する機能、無線通信機能を用いて様々なデータの送信または受 信を行う機能、記録媒体に記録されているプログラムまたはデータを読み出して表示部に

10

20

30

40

50

(70)

表示する機能、等を有することができる。なお、図56(A)~(C)に示す携帯情報端 末が有する機能はこれらに限定されず、その他の機能を有していてもよい。 [0648]図56(A)~(C)に示す携帯情報端末は、移動電話、電子メール、文章閲覧及び作成 、音楽再生、インターネット通信、コンピュータゲームなどの種々のアプリケーションを 実行することができる。また、図56(A)~(C)に示す携帯情報端末は、通信規格さ れた近距離無線通信を実行することが可能である。例えば、図56(C)に示す腕時計型 の携帯情報端末820は、無線通信可能なヘッドセットと相互通信することによって、ハ ンズフリーで通話することもできる。 [0649]図 5 6 (A) に示す携帯情報端末 8 0 0 は、筐体 8 1 1、表示部 8 1 2、操作ボタン 8 1 3、外部接続ポート814、スピーカ815、マイク816等を有する。携帯情報端末8 00の表示部812は平面を有する。 [0650] 図56(B)に示す携帯情報端末810は、筐体811、表示部812、操作ボタン81 3、外部接続ポート814、スピーカ815、マイク816、カメラ817等を有する。 携帯情報端末810の表示部812は曲面を有する。 [0651] 図56(C)に、腕時計型の携帯情報端末820を示す。携帯情報端末820は、筐体8 11、表示部812、スピーカ815、操作キー818(電源スイッチまたは操作スイッ チを含む)等を有する。携帯情報端末820の表示部812の外形は円形状である。携帯 情報端末の表示部812は、平面を有する。 [0652] 本発明の一態様の表示装置を、表示部812に用いることができる。これにより、開口率 が高い表示部を有する携帯情報端末を作製することができる。 [0653] 本実施の形態の携帯情報端末は、表示部812にタッチセンサを備える。電話を掛ける、 或いは文字を入力するなどのあらゆる操作は、指やスタイラスなどで表示部812に触れ ることで行うことができる。 [0654]また、操作ボタン 8 1 3 の操作により、電源の O N 、 O F F 動作や、表示部 8 1 2 に表示 される画像の種類の切り替えを行うことができる。例えば、メール作成画面から、メイン メニュー画面に切り替えることができる。 [0655] また、携帯情報端末の内部に、ジャイロセンサまたは加速度センサ等の検出装置を設ける ことで、携帯情報端末の向き(縦か横か)を判断して、表示部812の画面表示の向きを 自動的に切り替えることができる。また、画面表示の向きの切り替えは、表示部812に 触れること、操作ボタン813の操作、またはマイク816を用いた音声入力等により行 うこともできる。 [0656] 図 5 7 (A) に示すテレビジョン装置 7 1 0 0 は、筐体 7 1 0 1 に表示部 7 1 0 2 が組み 込まれている。表示部7102では、映像を表示することが可能である。本発明の一態様 の表示装置を表示部7102に用いることができる。これにより、開口率が高い表示部を 有するテレビジョン装置を作製することができる。また、ここでは、スタンド7103に より筐体7101を支持した構成を示している。 [0657]テレビジョン装置7100の操作は、筐体7101が備える操作スイッチや、別体のリモ コン操作機7111により行うことができる。リモコン操作機7111が備える操作キー により、チャンネルや音量の操作を行うことができ、表示部7102に表示される映像を 操作することができる。また、リモコン操作機7111に、当該リモコン操作機7111

10

20

30

40

から出力する情報を表示する表示部を設ける構成としてもよい。 [0658] なお、テレビジョン装置7100は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機に より一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線又は無線によ る通信ネットワークに接続することにより、一方向(送信者から受信者)又は双方向(送 信者と受信者間、あるいは受信者間同士など)の情報通信を行うことも可能である。 【0659】 図 5 7 ( B ) に示すコンピュータ 7 2 0 0 は、本体 7 2 0 1 、筐体 7 2 0 2 、表示部 7 2 03、キーボード7204、外部接続ポート7205、ポインティングデバイス7206 等を含む。なお、コンピュータは、本発明の一態様の表示装置をその表示部7203に用 いることにより作製される。これにより、開口率が高い表示部を有するコンピュータを作 製することができる。 [0660]図 5 7 (C) に示すカメラ 7 3 0 0 は、筐体 7 3 0 1 、表示部 7 3 0 2 、操作ボタン 7 3 03、シャッターボタン7304等を有する。またカメラ7300には、着脱可能なレン ズ7306が取り付けられている。 [0661] 本発明の一態様の表示装置を、表示部7302に用いることができる。これにより、開口 率が高い表示部を有するカメラを作製することができる。 [0662]ここではカメラ7300を、レンズ7306を筐体7301から取り外して交換すること が可能な構成としたが、レンズ7306と筐体7301とが一体となっていてもよい。 [0663] カメラ7300は、シャッターボタン7304を押すことにより、静止画または動画を撮 像することができる。また、表示部7302はタッチパネルとしての機能を有し、表示部 7302をタッチすることにより撮像することも可能である。 [0664]なお、カメラ7300は、ストロボ装置や、ビューファインダーなどを別途装着すること ができる。または、これらが筐体7301に組み込まれていてもよい。 [0665]本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。 【符号の説明】 [0666] 10A 表示装置 表示装置 10B 1 1 基板 12 基板 13 バックライトユニット トランジスタ 14 15 液晶素子 15 A 表示装置 15B 表示装置 15C 表示装置 16 接着層 20A 表示装置 20B 表示装置 2 1 画素電極 22 液晶層 23 共通電極

25 導電層

10

20

30

40
2	6		絶	縁	層							
2	7		導	電	層							
2	8		導	電	層							
2	9		接	続	体							
3	1		タ	ッ	チ	セ	ン	サ	ユ	=	ッ	۲
3	2		絶	縁	層							
3	3		導	電	層							
3	4		容	量	素	子						
3	5	А		表	示	装	置					
3	5	В		表	示	装	置					
3	5	С		表	示	装	置					
4	0		液	瞐	素	子						
4	5		光									
4	5	а		光								
4	5	b		光								
5	1		基	板								
5	6		導	電	層							
5	6	а		導	電	層						
5	6	b		導	電	層						
5	7		補	助	配	線						
5	8		導	電	層							
6	0		画	素								
6	0	а		副	画	素						
6	0	b		副	画	素						
6	0	с		副	画	素						
6	1		基	板								
6	2		表	示	部							
6	3		接	続	部							
6	4		駆	動	□	路	部					
6	5		配	線								
6	6		非	表	示	領	域					
6	7		遮	光	領	域						
6	8		表	示	領	域						
6	9		開	П	部							
7	2		F	Ρ	С							
7	2	а		F	Ρ	С						
7	2	b		F	Ρ	С						
7	3		Ι	С								
7	3	а		Ι	С							
7	3	b		Ι	С							
8	1		走	査	線							
8	2		信	号	線							
1	0	0	А		表	示	装	置				
1	0	0	В		表	示	装	置				
1	0	0	С		表	示	装	置				
1	0	0	D		表	示	装	置				
1	0	0	Е		表	示	装	置				
1	0	0	F		表	示	装	置				
1	1	0		表	示	装	置	_				
1	1	0	А		表	示	装	置				

JP 7460314 B2 2024.4.2

1	1	0	В	表示装置
1	1	0	С	表示装置
1	1	1		画素電極
1	1	2		共通電極
1	1	2	а	共通電極
1	1	2	b	共通電極
1	1	3		液晶層
1	1	7		スペーサ
1	1	9		補助配線
1	2	1		オーバーコート
1	2	2		絶縁層
1	2	3		絶縁層
1	2	4		電極
1	2	5		絶縁層
1	2	6		- 導電層 - ディン
1	2	/		電極
1	2	8		電極
1	3	0		偏光极
1	3	1		有巴層
1	3	2	_	遮 尤 溜 ` · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	3	2	a L	<sup>远</sup> 元 僧
1	3 7	2	D	<sup>远</sup> 元 僧 曰 白 唶
1	3 2	3 2	d h	<u> </u>
1	с 2	د د	D	10 归族
1 1	2	7		回 标 和 纪
י 1	2	י 2		記録
י 1	ך ג	9		補助配線
1	4	1		協助記録
1	4	2		接着層
2	0	1		トランジスタ
2	0	4		接続部
2	0	6		トランジスタ
2	0	7		接続部
2	1	1		絶縁層
2	1	1	а	絶縁層
2	1	1	b	絶縁層
2	1	2		絶縁層
2	1	3		絶縁層
2	1	4		絶縁層
2	1	5		絶縁層
2	1	6		絶縁層
2	2	0		絶縁層
2	2	1		ゲート
2	2	2		導電層
2	2	2	а	導電層
2	2	2	b	導電層
2	2	2	с	導電層
2	2	3		ゲート

2	2	7	導電層

(74)

(75)

2	2	8		走査線
2	2	9		信号線
2	3	1		半導体層
2	3	1	а	チャネル領域
2	3	1	b	低抵抗領域
2	4	2		接続体
2	4	2	b	接続体
2	4	3		接続体
2	4	4		容量線
2	5	1		導電層
2	5	3		導電層
2	5	5		導電層
2	8	4		導電層
2	8	5		導電層
2	8	6		導電層
9	0	0		画素
9	0	0	s	遮光領域
9	0	0	t	透過領域
9	0	1		駆動回路部
9	0	2		配線
9	0	4		配線
9	1	1		トランジスタ
9	1	4		トランジスタ
9	1	5		容量素子
9	1	6		容量部
9	1	8	В	表示領域
9	1	8	G	表示領域
9	1	8	R	表示領域
9	1	8	w	表示領域
9	3	0	L	C 液晶素子
9	3	2	В	M 遮光膜
9	3	2	С	F 着色膜

## 【図面】

【図1】

(A) <u>20A</u>



(B) <u>20B</u>



【図2】

(A)



(B)



(C) <u>35C</u>

	33	14	Ą	31	Д	
	 	desea	3000000000	aadaaa	00000000	12
						-10
600000				7175776767		26
$\square$					HI.	-22
				•		-11
29 25	23	45	b	15 2	1	—45a

20

10

30

(77)



【図4】



20

10





【図6】



30

【図7】





【図9】



【図10】





30

20

【図11】



【図12】



10

20

【図13】



【図14】











## 【図17】

(A)

(B)



## 【図18】





(B)

20

10

30







(B)

【図21】





20

30



【図23】





10

20





【図26】





30



【図28】



10

20



(E)





(B)



【図30】

3511\_5

3511\_6 -

(D)

(E)

471

472



 書き込み期間
 検知期間

 1フレーム期間

 書き込み期間

 検知期間

 1フレーム期間

30



【図32】





(A) <u>20A</u>

45b 45a

(B) <u>20B</u>

		14 <u>4</u>	$\Delta$	Ą	
	388 <b>7</b> 2			898899898	12
			1		
	<u> </u>	///////	<i>a.m</i>		11
29 25	23	45b	15	21	— 45a



-26

(A)

(B)





(C) <u>35C</u>

33 14 31 12 29 25 23 45b 15 21 45a 



¥

B



20

10

【図37】

Å



【図38】



30

40



【図39】





【図41】



【図42】

3



20

10

30

40

ŝ

64

V

251









【図45】

3



【図46】

₹



【図47】



【図48】

(88)



【図49】



【図50】









5 Z J







20

10

【図53】



(B)









## 【図57】





フロントページの続き

	日本国(JP)		
(56)参考文献		1 - 0 5 3 2 6 1	(JP,A)
(58)調査した分野	特開201 (Int.Cl.,DB	0-156963 名)	(JP,A)
	G 0 2 F	1 / 1 3 6 8	
	G 0 2 F	1 / 1 3 3 3	
	G 0 2 F	1 / 1 3 4 3	